

AC/DC 耐電圧・絶縁・アース導通(GB)
安全試験器
GPT-10000 シリーズ

ユーザマニュアル



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

GW INSTEK

保証

GPT-10000 シリーズ
AC/DC 耐電圧・絶縁抵抗・アース導通 安全試験器

GPT-10000 シリーズは、正常な使用状態で発生する故障について、お買上げの日より2年間に発生した故障については無償で修理を致します。ただしLCDディスプレイの保証は1年となります。

ただし、保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3. 取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買上げ明細書類のご提示がない場合。

お買上げ時の明細書(納品書、領収書など)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。

また、校正作業につきましては有償にて受け賜ります。

この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

本マニュアルについて

ご使用に際しては、必ず本マニュアルを最後までお読みいただき、正しくご使用ください。また、いつでも見られるよう保存してください。

本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしました。が、万一不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、ご購入元または当社までご連絡ください。

本説明書では日本未発売の機種が含まれます。機種については弊社ホームページをご覧ください。

本マニュアルは

GPT-12000 シリーズ:V1.11

GPT-15000 シリーズ:V1.05

のファームウェアバージョンに適用されます。

2023年8月

このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。当社はすべての権利を保持します。当社の文書による事前承諾なしに、このマニュアルを複製、転載、翻訳することはできません。

このマニュアルに記載された情報は印刷時点のもので、製品の仕様、機器、および保守手順は、いつでも予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。

Good Will Instrument Co., Ltd.

No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236,
Taiwan.

目次

安全上の注意	1
はじめに	4
GPT-10000 シリーズの概要	5
フロントパネル一覧	10
リアパネル一覧	14
セットアップ	17
操作方法	24
メニュー構成	26
テストリードの接続	31
単独 (MANU[AL]) 試験	34
特別 単独 (MANU[AL]) 試験モード (000)	93
スリープ機能	95
自動 (AUTO) 試験	98
システム設定	122
外部接点制御	171
外部接点制御の概要	172
デジタル制御	178
インタフェースについて	179
コマンド構成	184
コマンドリスト	186
エラーメッセージ	245
よくある質問	246
付録	248
ヒューズ交換	248
試験エラー	249
バーコードリーダーについて	252
工場出荷時設定	253
GPT-10000 シリーズの仕様	255
GPT-15001/15002/15003 の外形寸法図	262
GPT-15004 の外形寸法図	263
GPT-12001/12002/12003 の外形寸法図	264
GPT-12004 の外形寸法図	265
Declaration of Conformity	266
索引	267

安全上の注意

この章は、本器の操作時、保管時に注意しなければならない、重要な安全上の注意事項を説明しています。操作を始める前に以下の注意をよくお読みになり、安全を確保し、最良の状態でご使用ください。

安全マーク

以下の安全マークは、本マニュアルまたは本器上に記載されています。



警告

警告:ただちに人体に危害が及ぶ、または生命の危険につながる恐れのある状況、操作を説明していません。



注意

注意:本器または他の機器(被測定物)が損傷する恐れのある状況、操作を説明しています。



危険:高電圧になっています。



注意:マニュアルをご参照ください。



保護導体端子



フレームまたは筐体の端子



アース(接地)端子



廃棄電気/電子機器(WEEE)指令の要件に適合します。

安全上の注意

一般的な 注意事項



注意

- 本器の上に重いものを置かないでください。
- 機器が損傷する恐れがありますので、本器に衝撃を加えたり、乱暴に取り扱わないでください。
- 本器に静電気を与えないでください。
- 端子配線には、安全に考慮したコネクタ付ケーブルのみを使用してください。裸線を端子に接続しないでください。
- 冷却用の通気口は塞がないでください。
- 本器を分解、改造しないでください。当社のサービス技術者および認定された者以外、本器を分解することは禁止されています。

(測定カテゴリ) EN 61010-1:2010 は、測定カテゴリと要件を以下のように規定しています。GPT-10000 は、カテゴリ II、III、IV には該当しません。

- 測定カテゴリ IV: 低電圧下での測定が対象です。
- 測定カテゴリ III: 建物設備での測定が対象です。
- 測定カテゴリ II: 低電圧に直接接続される回路での測定が対象です。

電源



警告

- AC 入力電圧レンジ:
100V - 240VAC \pm 10%
- 周波数: 50Hz/60Hz
- 感電防止のため、AC 電源ケーブルのグランド端子を必ず大地アースに接続してください。

GPT-10000 の クリーニング

- クリーニング前に電源ケーブルを外してください。
 - 中性洗剤と水の混合液を浸した柔らかい布地を使用してください。液体はスプレーせず、機器に液体が入らないようにしてください。
 - ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど、危険な成分を含んだ化学物質は使用しないでください。
-

動作環境

- 設置場所: 屋内で、直射日光が当たらず、ホコリがなく、非導電性の汚染度(以下を参照)のもとでご使用ください。
- 相対湿度: 70%以下(結露のないこと)
- 高度: 2000m 未満
- 温度: 0°C ~ +40°C

(汚染度) EN 61010-1:2010 は、汚染度を以下のように規定しています。GPT-10000 は、汚染度 2 に該当します。

汚染とは、「絶縁耐力、表面抵抗を低下させる異物、固体、液体、ガス(イオン化ガス)の添加」を意味します。

- 汚染度 1: どのような汚染も発生しないか、または乾燥状態で非導電性の汚染だけが発生する。この汚染は、どのような影響も及ぼさない。
- 汚染度 2: 非導電性の汚染は発生するが、たまたま結露によって一時的に導電性が引き起こされることが予想される。
- 汚染度 3: 導電性の汚染が発生する。または予想される結露のために導電性となる、乾燥した非導電性の汚染が発生する。このような状態では通常、直射日光、降雨、風圧から機器を保護する。しかし、温度、湿度は制御しない。

保管環境

- 場所: 室内
- 動作時: -10°C ~ +70°C
- 相対湿度: 85%以下(結露のないこと)

廃棄



廃棄電気/電子機器(WEEE)指令の要件に適合しません。EU 圏では本器を家庭ゴミとして廃棄できません。WEEE 指令に従って廃棄してください。EU 圏以外では、市域に定められたルールに従って廃棄してください。

はじめに

この章では、本器の主な機能、フロント／リアパネルについて簡単に説明します。本器の概要をご理解の上、「セットアップ」の章の安全に関する注意事項をお読みください。

GPT-10000 シリーズの概要	5
シリーズ一覧	5
モデル一覧	6
特長	6
付属品とオプション	8
梱包内容	9
フロントパネル一覧	10
リアパネル一覧	14
セットアップ	17
チルトスタンド	17
AC ケーブルの接続と主電源 ON	18
GP-IB/LAN(オプション)のインストール	19
作業環境について	20
作業上の注意事項	21
基本的な安全確認	23

GPT-10000 シリーズの概要

シリーズ一覧

GPT-10000 シリーズは、AC/DC 耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験、導通試験が可能な安全試験器です。

GPT-10000 シリーズには 2 つのカテゴリがあります。

2 つのカテゴリは、同じテスト機能を共有していますが、仕様が異なります。、ACW の出力容量が GPT-12xxx は 200VA、GPT-15xxx は 500VA と異なります。以下で説明するモデル名の 2 桁目を「X」と呼び、両方のカテゴリを共通に使用します。

GPT-1X001 は AC 耐電圧と導通の試験器です。

GPT-1X002 は AC/DC 耐電圧と導通の試験器です。

GPT-1X003 は AC/DC 耐電圧、絶縁抵抗、導通の試験器です。

GPT-1X004 は全ての機能に加え、アース導通(GB)試験も可能です。

詳細については、次のラインナップの概要を参照してください。

GPT-10000 シリーズは、100 個の単独(MANU)試験が保存できます。さらに、10 個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。これにより、IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS などの安全規格に対応できます。また、IEC(EN)61010-2-034: 絶縁抵抗の計測機器及び耐電圧試験機器の要求事項に対応しています。

注意: このユーザマニュアルでは、AC 耐電圧を ACW、DC 耐電圧を DCW、絶縁抵抗を IR、アース導通を GB、導通を CONT と表記して説明します。

モデル一覧

モデル名	電力	ACW	DCW	IR	GB	CONT
GPT-12001	200VA	✓				✓
GPT-12002		✓	✓			✓
GPT-12003		✓	✓	✓		✓
GPT-12004		✓	✓	✓	✓	✓
GPT-15001	500VA	✓*				✓
GPT-15002		✓*	✓			✓
GPT-15003		✓*	✓	✓		✓
GPT-15004		✓*	✓	✓	✓	✓

*Short Current > 200mA

一覧には日本未発売の機種が含まれています

特長

性能

- ACW(AC 耐電圧) : 0.05kV~5kVAC
- DCW(DC 耐電圧) : 0.05kV~6kVDC
- IR(絶縁抵抗) : 50V~1200V(50V ステップ)*
- GB(アース導通) : 3A~32A
- CONT(導通) : 100mA

特長

- RAMP(上昇時間)設定
- RAMP(下降時間)設定
- 安全放電機能
- 100 個の試験条件(単独:MANUAL モード)
- 100 個の自動試験(自動:AUTO モード)
- 過熱、過電圧、過電流保護
- PASS, FAIL, TEST, 高電圧, レディのインジケータ
- PWM 出力(90%の効率、優れた信頼性)
- インターロック(設定可能)
- リアパネル出力

- インタフェース
- リモート端子(試験の実行/停止)
 - 通信制御用の RS-232C/USB インタフェース
 - 通信制御用の GP-IB インタフェース(オプション)
 - 通信制御用の LAN インタフェース(オプション)
 - Signal I/O 端子(PASS/FAIL/TEST 状態信号と実行/停止の制御/インターロック)

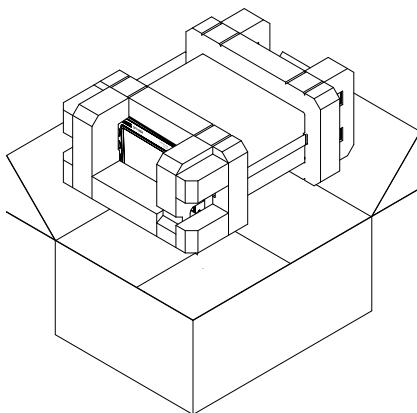
付属品とオプション

付属品	パーツ番号	概要
	GHT-115x1	テストリード 赤: 高圧出力用 白(黒カバー): RETURN 用 白(赤カバー): CONT 用
	地域により異なります GTL-215x1	電源ケーブル GB テストリード (GPT-1X004 のみ)
	GHT-119x1	リモートケーブル
	—	インターロックキー
オプション	パーツ番号	概要
	GHT-205	高電圧テストプローブ
	GHT-113	高電圧テストピストル
	GTL-232	RS-232C ケーブル
	GTL-248	GP-IB ケーブル
	GTL-246	USB ケーブル(A-B タイプ)
	GRA-440	ラックマウントアダプター
オプション	パーツ番号	概要
	OPT01-GP-PT10K	GP-IB モジュール
	OPT02-LAN-PT10K	LAN モジュール

梱包内容

GPT-10000 シリーズをご使用前に梱包内容をご確認ください。

梱包状態



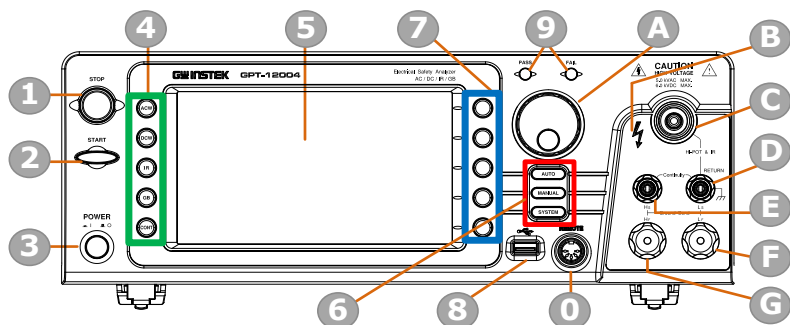
梱包内容 (1台)

- GPT-10000 本体
- ユーザマニュアル (CD)
- 出荷証明書
- 電源ケーブル×1 (地域に適したもの)
- GHT-115 テストリード×1
- GTL-215 GB テストリード×1 (GPT-1X004 のみ)
- GHT-119 リモートケーブル×1
- インターロックキー



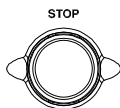
当社への発送に備え、梱包箱、緩衝材、ビニール袋など一式を保管しておいてください。

フロントパネル一覽



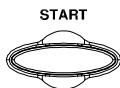
記号	概要
1	STOP ボタン
2	START ボタン
3	電源スイッチ
4	試験機能キー(緑エリア)
5	ディスプレイ
6	モードキー(AUTO、MANUAL、SYSTEM)(赤エリア)
7	ソフトキー(青エリア)
8	USB タイプ A ホストポート
9	PASS/FAIL インジケータ
0	リモート端子
A	ロータリノブ
B	高電圧インジケータ
C	高電圧出力端子
D	リターン端子/ Ground Bond Ls(GPT-1X004)
E	Continuity 端子/ Ground Bond Hs(GPT-1X004)
F	Ground Bond LF(GPT-1X004)
G	Ground Bond HF(GPT-1X004)

STOP ボタン



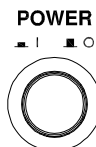
STOP ボタンを押すと、試験を停止／キャンセルします。また、このボタンを押すと本器は READY の状態になり、試験が始められる状態になります。

START ボタン



START ボタンを押すと、試験を開始します。START ボタンは、本器が READY の状態で使用できます。START ボタンを押すと、本器は TEST の状態になります。

POWER スイッチ



電源が入ります。本器は、最後に電源を切った状態の設定で起動します。

試験機能キー

ACW(AC 耐電圧)、DCW(DC 耐電圧)、IR(絶縁抵抗)、GB(アース導通)、CONT(導通)の機能が表示されています。いずれかのボタンを押すことで、その機能設定になります。

ディスプレイ

7 型カラーTFT ディスプレイ。分解能は 800×480。

AUTO ボタン



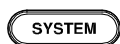
AUTO ボタンを押すと、自動(AUTO)試験モードになります。

MANUAL ボタン



MANUAL ボタンを押すと、単独(MANU)試験モードになります。

SYSTEM ボタン

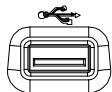


SYSTEM ボタンを押すと、システムモードになります。

ソフトキー

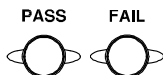
ソフトキーは、メインディスプレイに表示されるメニューキーに対応します。

USB
ホストポート



データ保存用の USB メモリ (FAT32 フォーマット、32GB まで) や、バーコードスキャナー (USB 仮想 COM ポート互換) を取り付けることができます。

PASS/FAIL
インジケータ



単独 (MANU) 試験または自動 (AUTO) 試験の結果 (PASS/FAIL) がインジケータによって表示されます。

REMOTE 端子



REMOTE 端子は、リモートコントローラとの接続で使用します。

ロータリノブ



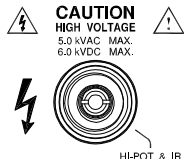
パラメータの値を変更します。

HIGH VOLTAGE
インジケータ



本器から試験電圧が出力されている場合に、HIGH VOLTAGE (高電圧) のインジケータが点灯します。試験が完了するか、または停止した場合にのみ、インジケータは消えます。

HIGH VOLTAGE
(高電圧)
出力端子



CAUTION
HIGH VOLTAGE
5.0 KVAC MAX.
6.0 KVDC MAX.

ACW (AC 耐電圧)、DCW (DC 耐電圧)、IR (絶縁抵抗) の試験において、試験電圧が出力されます。端子は、安全のために凹型になっています。RETURN 端子とペアで使用します。

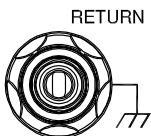


警告

非常に危険です。

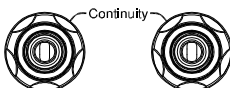
試験中は、HIGH VOLTAGE 端子には決して触れないでください。

RETURN 端子



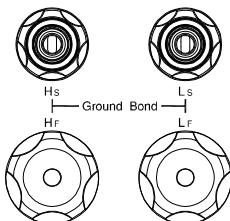
RETURN 端子は、ACW(AC 耐電圧)、DCW(DC 耐電圧)、IR(絶縁抵抗)、CONT(導通)試験で使用します。

Continuity 端子 すべてのモデル



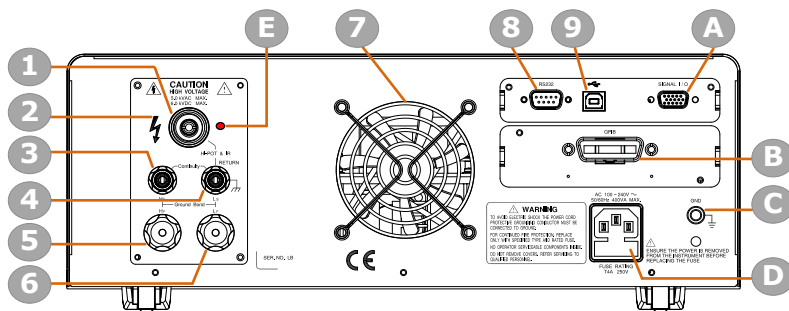
出力端子(赤)と RETURN 端子(黒)は、CONT(導通)試験で使用します。

Ground Bond 端子 GPT-1X004



Hs、Ls、Hf、Lfの端子は、GB(アース導通)試験で使用します。

リアパネル一覽



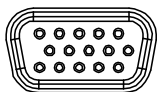
記号

概要

- | | |
|---|---|
| 1 | HIGH VOLTAGE 出力端子 |
| 2 | HIGH VOLTAGE マーク |
| 3 | Continuity 端子／Ground Bond Hs(GPT-1X004) |
| 4 | RETURN 端子／Ground Bond Ls(GPT-1X004) |
| 5 | Ground Bond HF(GPT-1X004) |
| 6 | Ground Bond LF(GPT-1X004) |
| 7 | 冷却ファン |
| 8 | RS-232C ポート |
| 9 | USB type-B ポート(通信用) |
| A | SIGNAL I/O ポート |
| B | GP-IB ポート/LAN ポート (オプション) |
| C | フレーム GND |
| D | AC 主電源(電源ケーブルソケット) |
| E | HIGH VOLTAGE パイロットランプ |

SIGNAL I/O
ポート

SIGNAL I / O



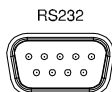
SIGNAL I/O ポートは、本器の状態 (PASS、FAIL、TEST) と入力 (START/STOP 信号) をモニタします。インターロックキーでも使用します。

USB type-B
ポート



USB type-B ポートは、リモート制御で使用します。

RS-232C インタ
フェースポート



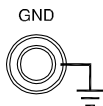
RS-232C ポートは、リモート制御で使用します。

冷却用ファン/
排気口



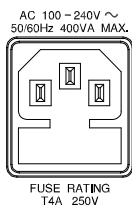
ファンの排気口です。排気の妨げにならないよう、十分に空間を確保してください。ファンの排気口は塞がないでください。

GND



GND(グラウンド)端子は大地アースに接続します。

AC 主電源入力



AC 主電源入力用の電源ケーブルソケット: 100~240VAC±10%。

ヒューズホルダには、AC 主電源用のヒューズが入っています。ヒューズの交換については、248 ページを参照してください。

GP-IB ポート
(オプション)



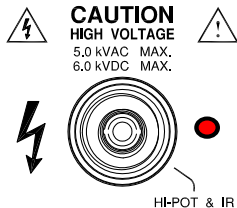
リモート制御の GP-IB インタフェース (オプション)

LAN ポート
(オプション)



リモート制御の LAN インタフェース (オプション)

HIGH VOLTAGE (高電圧) 出力端子



ACW(AC 耐電圧)、DCW(DC 耐電圧)、IR(絶縁抵抗)の試験において、試験電圧が出力されます。端子は、安全のために凹型になっています。RETURN 端子とペアで使用します。



警告

非常に危険です。

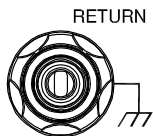
試験中は、HIGH VOLTAGE 端子には決して触れないでください。

HIGHT VOLTAGE パイロットランプ



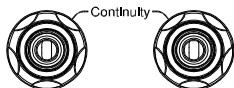
出力端子がアクティブになると、高電圧パイロットランプが赤く点灯します。テストが終了または停止した後にのみランプが消灯します。

RETURN 端子



RETURN 端子は、ACW(AC 耐電圧)、DCW(DC 耐電圧)、IR(絶縁抵抗)、CONT(導通)試験で使用します。

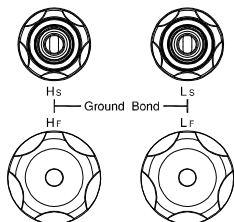
Continuity 端子 すべてのモデル



出力端子(赤)と RETURN 端子(黒)は、CONT(導通)試験で使用します。

Ground Bond 端子

GPT-1X004

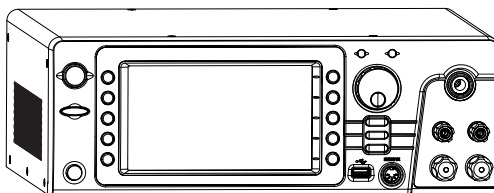


Hs、Ls、Hf、Lf の端子は、GB(アース導通)試験で使用します。

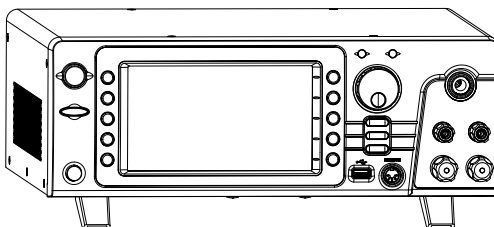
セットアップ

チルトスタンド

水平での使用 本器を、平らな表面に水平に置きます。



チルトスタンドの使用 本器の底面にある2つのスタンドを起こすと、少し傾いた状態で使用できます。

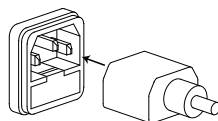


AC ケーブルの接続と主電源 ON

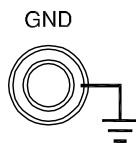
概要 GPT-10000 シリーズは、100~240V、50/60Hz の電圧で動作します。

手順

1. 電源ケーブルを、リアパネルの AC ソケットに差し込みます。



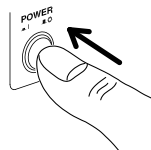
2. 電源ケーブルにアースグランドがない場合は、必ずグランド端子を大地アースに接続します。



警告

電源ケーブルが大地アースに接続されていることを確認してください。接続されていないと、人体、本器に危険が及びます。

3. POWER ボタンを押します。



4. 電源が入ると、以下のように MANU[AL] (単独) または AUTO (自動) のテストモードで前回のパラメータが表示されます。



GP-IB/LAN(オプション)のインストール

概要 オプションの GP-IB または LAN は、お客様が装着できます、次の手順にしたがってオプションカードをインストールしてください。

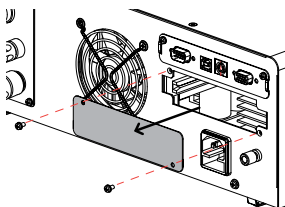


警告

オプションカードをインストールする前、必ず本器の電源を切り、AC ケーブルを外してください。

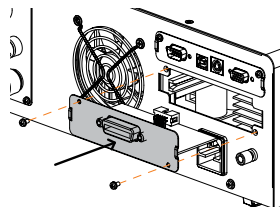
手順

1. リアパネルのカバープレートのネジを外します。

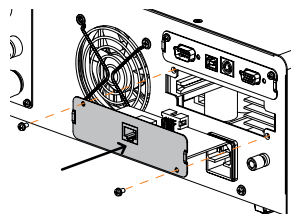


2. カバープレートを外した後のリアパネルの開口部に、オプションカードを入れます。カードを最後までゆっくりと差し込み、ネジでとめます。

GP-IB カード



LAN カード



作業環境について

概要 本器は、非常に高い電圧を出力する試験器です。以下に、安全にご使用いただくための注意事項と手順を説明します。



本器は、5kVAC または 6kVDC を超える電圧を出力します。本器の使用においては、ここに記す注意事項、警告、手順に必ずしたがってください。また、国・各都道府県において取扱い・作業者に対する教育や制限が付く場合がありますので、十分注意してください。

1. この取扱説明書を十分理解してから本器を操作してください。
2. 作業する場所は、十分に作業スペースを確保する必要があります。特に、本器の使用中は必ず十分な作業スペースを確保してください。本器には、適切な警告標識をはっきりと明示させてください。
3. 作業者は、いかなる電導性の素材、貴金属、バッチ、腕時計なども外す必要があります。
4. 作業者は、高電圧保護用の絶縁手袋を着用する必要があります。
5. 本器の GND 端子は、大地アースに確実に接地してください。
6. 本器は、磁場を発生します。影響を受けるものは、近づけないでください。

作業上の注意事項

概要 本器は、非常に高い電圧を出力する試験器です。ここでは、安全に作業していただくために守るべき注意事項と操作手順を説明します。



本器は、5kVAC または 6kVDC の高電圧を出力します。本器の使用においては、ここに記す注意事項、警告、手順に必ずしたがってください。

1. 試験実行中は、本器、入出力リード線、各端子、その他の接続された機器には触れないでください。
2. 本器は、すばやく ON/OFF したり、繰返し ON/OFF したりしないでください。電源を OFF にした場合、再度電源を ON にする場合はしばらく時間をとってからにしてください。こうすることで、保護回路が正しく初期化されます。

緊急時以外は、試験実行中に電源を OFF にしないでください。
3. 機器に付属しているテストリード線のみをご使用ください。不適切な太さのリード線の使用は、作業者と機器の両方にとって非常に危険です。アース導通 (GB) 試験では、センシングリード線 (Sense Leads) を HF, LF 端子に接続しないでください。
4. 高電圧 (HIGH VOLTAGE) 端子とグラウンド (GND) はショート (短絡) させないでください。高電圧が筐体 (シャーシ) に印加されます。
5. 本器の GND 端子は、大地アースに確実に接地してください。

6. 試験開始時、HIGH VOLTAGE/Hf/Hs 端子のテストリードは正確に、かつ確実に配線してください。それ以外のときは、テストリード線は外してください。
7. 試験を中断する場合は、停止 (STOP) ボタンを押してください。
8. 試験実行中、または本器の電源を ON の状態でその場を離れないでください。その場を離れる場合は、必ず電源を OFF にしてください。
9. 本器をリモート制御する場合は、以下の項目に注意してください。
 - 試験電圧を不注意に出力させないでください。
 - 試験中は、不注意に本器に触れないでください。本器をリモート制御している場合、本器と DUT は十分な距離をとってください。
10. DUT の放電時間を十分にとってください。

DCW または IR の試験では、DUT、テストリード、プローブには高電圧が帯電します。本器には放電回路があり、各試験の後に DUT を放電します。DUT の放電に要する時間は、DUT、試験電圧によって異なります。

放電が完了するまでは、本器から DUT を外さないでください。

基本的な安全確認

概要

本器は高電圧を出力するため、安全に操作するためには毎日のチェックが必要です。

1. すべてのテストリードが破損していないこと、ひびや割れがないことを確認してください。
2. 本器が大地アースに接続されていることを確認してください。
3. 低電圧、低電流で本器をテストします。

テストパラメータを低電圧、低電流に設定し、HIGH VOLTAGE と RETURN の端子をショート（短絡）したときに FAIL と判定されることを確認します。



警告

高電圧、大電流の設定の状態では HIGH VOLTAGE と RETURN の端子をショートさせないでください。本器が損傷する恐れがあります。

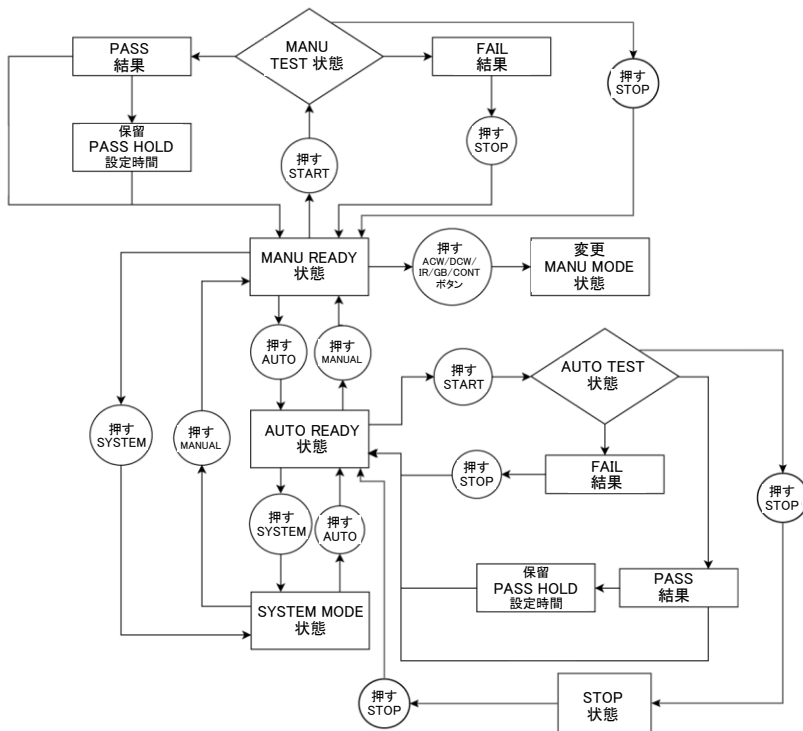
操作方法

メニュー構成	26
メニュー構成の概要	27
テストリードの接続	31
ACW、DCW、IR 試験の接続	31
GB(アース導通)試験の接続	32
CONT(導通)試験の接続	33
単独(MANU[AL])試験	34
試験機能の設定	36
単独(MANU[AL])試験番号の選択/呼出	37
単独(MANU[AL])試験ファイル名の作成	38
上限/下限の基準値設定	39
試験時間の設定	41
上昇時間(Ramp Up)の設定	43
下降時間(Ramp Down)の設定	45
試験電圧または試験電流の設定	47
試験周波数の設定	49
オフセット(Reference)の設定	50
初期電圧の設定	51
保留時間(WAIT TIME)の設定	53
ARC(アーク検出)機能の設定	55
MAX HOLD(最大測定値保持機能)の設定	58
PASS HOLD(PASS 表示保持)の設定	59
IR(絶縁抵抗)モードの設定	61
GND OFFSET(グランドオフセット)の設定	62
GB Contact の設定	64
テストリードのゼロ調整	66
グランドモード(GROUND MODE)の設定	69
コンタクトチェック(CONTACT CHK)の設定	75
画面のハードコピー	81
単独(MANU[AL])試験の実行	83
単独(MANU[AL])試験の PASS/FAIL	88
特別 単独(MANU[AL])試験モード(000)	93

スweep機能	95
自動(AUTO)試験	98
自動(AUTO)試験の選択と呼出	99
自動(AUTO)試験のファイル名の作成	100
自動(AUTO)試験へのステップの追加	101
自動(AUTO)試験の連続実行	102
自動(AUTO)試験ページの編集	104
自動(AUTO)試験の実行	111
自動(AUTO)試験の結果	116

メニュー構成

この章では、GPT-10000 シリーズの動作状態、モード構造の概要を説明します。本器には、2つのメイン試験モード(単独(MANU[AL])、自動(AUTO))、1つのシステムモード(SYSTEM)、5つの動作状態(準備完了(READY)、試験中(TEST)、合格(PASS)、不合格(FAIL)、停止(STOP))があります。



メニュー構成の概要

単独
(MANU[AL])
モード

単独(MANU)モードは、単独(MANU)試験を作成、実行します。各単独(MANU)試験のパラメータは、単独(MANU)モードでのみ編集できます。

単独(MANU)
モード

ACW		0. 100 kV	↑
MANU: 000			
MANU_NAME			↓
HI SET:	20.22 mA		←
LOW SET:	1.015 mA		→
TEST TIME:	016.0 s	READY	
RAMP TIME:	003.6 s		
ARC FUNC:	ON		
ARC SET:	1.001 mA		PAGE 1 / 3

自動(AUTO)
モード

自動(AUTO)モードでは、最大 10 個の MANU ステップをシーケンスで実行する自動(AUTO)試験を実行します。また、いくつかの自動(AUTO)試験をグループにして内部接続し、拡張自動(AUTO)試験として実行することもできます。

自動(AUTO)
モード

MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	READY	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		↑
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		↓
026	IR	0.050kV	49.99GΩ	001.0MΩ	P.C/F.C		←
							→

SYSTEM
モード

システムモードでは、表示、ブザー、インターフェース、制御方式、システムの時刻、データの初期化、インフォメーション、統計、USB の設定を行います。この設定はシステム全体に及び、MANUAL、AUTO の両方の試験に適用されます。

SYSTEM
モード

DISPLAY SET:	Year: 2019	↑ ↓ ← → ENTER
BUZZER:	Month: 04	
INTERFACE:	Date: 02	
CONTROL:	Hours: 19	
SYSTEM TIME:	Minutes: 08	
DATA INIT:	Seconds: 52	
INFORMATION:		
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		

READY
(準備完了)状態
(黄色)

本器が MANU または AUTO 試験の READY 状態は、試験準備完了を示しています。START ボタンを押すと試験が実行され、本器は TEST の状態になります。AUTO ボタンを押すと、MANU - READY の状態から AUTO - READY の状態に変化します。MANUAL のボタンを押すと、AUTO - READY から MANU - READY の状態に変化します。

単独(MANU)
試験における
READY の状態

ACW	0. 100 kV mA READY	↑ ↓ ← → PAGE 1 / 3
MANU: 001		
MANU_NAME		
HI SET: 1,000 mA		
LOW SET: 000 uA		
TEST TIME: 000.3 s		
RAMP TIME: 000.1 s		
ARC FUNC: OFF		
ARC SET: 1,000 mA		

自動(AUTO)
試験における
READY の状態

AUTO-001	AUTO_NAME	READY	
MANU	TEST	V/I	HI SETTING
STEP	MODE	SETTING	LOW SETTING
001	DCW	0.100kV	1.000mA
			000 uA
			P.C/F.H
002	ACW	0.100kV	1.000mA
			000 uA
			P.H/F.C
005	IR	0.050kV	066.8MΩ
			000.1MΩ
			P.C/F.S
010	ACW	0.200kV	2.000mA
			000 uA
			P.C/F.C
006	DCW	0.500kV	1.500mA
			000 uA
			P.H/F.S
			SKIP
			DEL.
			STEP
			HOLD

テストリードの接続

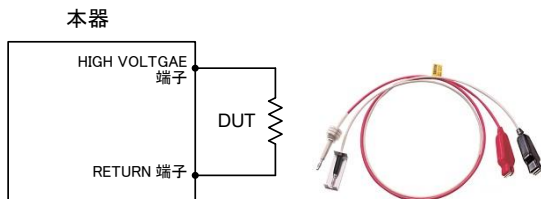
AC/DC 耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通試験、導通試験における、本器と DUT(被測定物)との接続方法を説明します。

ACW、DCW、IR 試験の接続

概要

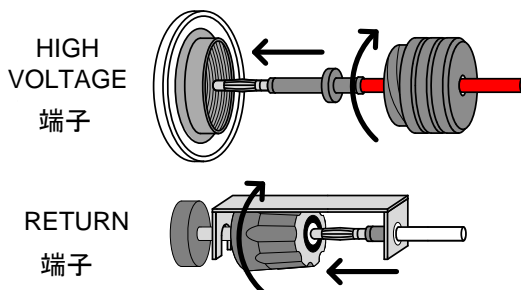
ACW、DCW、IR の試験では、HIGH VOLTAGE 端子、RETURN 端子、GHT-115 テストリードを使用します。

ACW、DCW、IR 試験の接続



手順

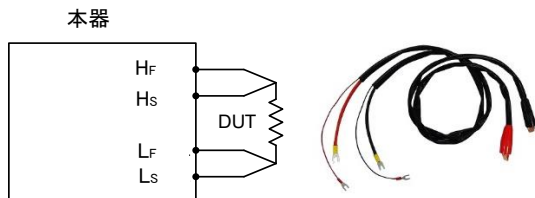
1. 本器の電源を OFF にします。
2. HIGH VOLTAGE 端子に高電圧テストリード(赤)を差し込み、ねじ込んでしっかりと固定します。
3. RETURN 端子にリターンテストリード(白)を接続し、抜け防止用金具を含め、下図のように確実に接続します。



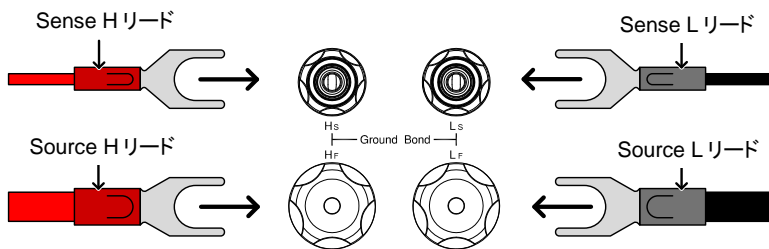
GB(アース導通)試験の接続

概要 GB 試験では、Hs, Ls 端子、Hf, Lf 端子、GTL-215 テストリードを使用します。

GB 試験の接続



- 手順
1. 本器の電源を OFF にします。
 2. Hs 端子に Sense H リード線を接続します。
 3. Ls 端子に Sense L リード線を接続します。
 4. Hf 端子に Source H リード線を接続します。
 5. Lf 端子に Source L リード線を接続します。

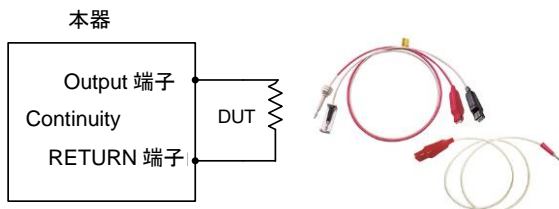


CONT(導通)試験の接続

概要

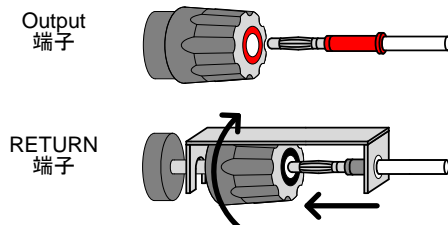
CONT(導通)試験では、ContinuityのOUTPUT端子、RETURN端子、GTL-115テストリードを使用します。

CONT試験の接続



手順

1. 本器の電源を OFF にします。
2. OUTPUT 端子に OUTPUT テストリード(白、赤プラグ)を接続します。
3. RETURN 端子にリターンテストリード(白)を接続し、抜け防止用金具を含め、下図のように確実に接続します。



単独 (MANU[AL]) 試験

この章では、ACW、DCW、IR、GB、CONT の単独 (MANU) 試験の設定、編集、実行方法について説明します。この章で説明する単独 (MANU) 試験の設定は、選択された単独 (MANU) 試験にのみ適用され、他の単独 (MANU) 試験には影響しません。

各単独 (MANU) 試験は 100 個まで保存／呼び出しできます。メモリから呼出した単独 (MANU) 試験は、自動 (AUTO) 試験 (98 ページを参照) を作成する場合のテスト手順として使用できます。

試験機能の設定	36
単独 (MANU[AL]) 試験番号の選択／呼出	37
単独 (MANU[AL]) 試験ファイル名の作成	38
上限／下限の基準値設定	39
試験時間の設定	41
上昇時間 (Ramp Up) の設定	43
下降時間 (Ramp Down) の設定	45
試験電圧または試験電流の設定	47
試験周波数の設定	49
オフセット (Reference) の設定	50
初期電圧の設定	51
保留時間 (WAIT TIME) の設定	53
ARC (アーク検出) 機能の設定	55
MAX HOLD (最大測定値保持機能) の設定	58
PASS HOLD (PASS 表示保持) の設定	59
IR (絶縁抵抗) モードの設定	61
GND OFFSET (グランドオフセット) の設定	62
GB Contact の設定	64
テストリードのゼロ調整	66
グランドモード (GROUND MODE) の設定	69

コンタクトチェック(CONTACT CHK)の設定	75
ACW/DCW テストフィルタ設定	77
IR テストフィルタ設定	78
画面のハードコピー	81
単独(MANU[AL])試験の実行	83
単独(MANU[AL])試験のPASS/FAIL.....	88
特別 単独(MANU[AL])試験モード(000)	93
スweep機能	95

試験機能の設定

概要 試験機能には、ACW(AC 耐電圧)、DCW(DC 耐電圧)、IR(絶縁抵抗)、GB(アース導通)、CONT(導通)の5種類があります。

手順 1. 本器が AUTO または SYSTEM のモードになっている場合は、MANUAL キーを押して単独(MANU)モードにします。

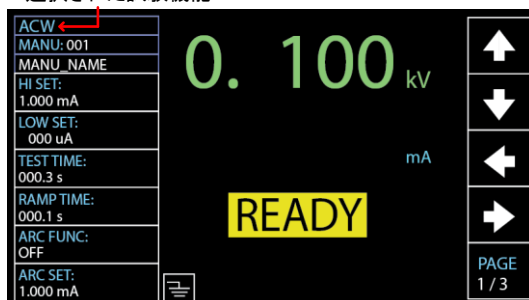


2. フロントパネルの ACW、DCW、IR、GB、CONT を押して試験テスト機能を選択します。



3. 選択された試験機能のキーが点灯し、ディスプレイ左上に試験機能が表示されます。

選択された試験機能



単独 (MANU[AL]) 試験番号の選択／呼出

概要 ACW、DCW、IR、GB、CONT の試験は、MANU モードでのみ作成、編集できます。単独 (MANU) 試験番号は 001～100 で保存でき、番号で単独 (MANU) 試験を呼出して編集し、組み合わせて自動 (AUTO) 試験を作成することができます。単独 (MANU) 試験の番号 000 は特別モードです。特別モードの詳細については、93 ページを参照してください。

手順 1. AUTO または SYSTEM のモードになっている場合は、MANUAL キーを押して MANU モードに切り替えます。



2. ロータリノブを回して MANU 番号を選択します。



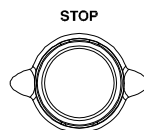
MANU 番号 001～100
(MANU# 000 は特別モード)

MANU 番号カーソル



注意

MANU 番号は、ディスプレイに READY が表示されている場合のみ選択または呼出しができます。FAIL が表示されている場合は、STOP キーを押してから選択または呼出しの手順を実行します。



単独 (MANU[AL]) 試験ファイル名の作成

概要

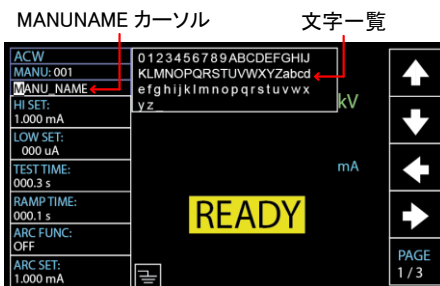
単独 (MANU) 試験のファイル名は、最大 10 文字まで設定できます (初期設定名: MANU_NAME)。使用可能な文字を以下に示します。

使用可能な文字のリスト

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	_															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

手順

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを MANU_NAME (初期設定名) に移動します。文字の一覧が表示されます。



2. ロータリノブを回して文字を選択します。



3. 左右の矢印ソフトキーでカーソルを次の文字に移動します。



4. カーソルを次の設定に移動すると、単独 (MANU) 試験のファイル名が設定されます。

上限／下限の基準値設定

概要 下限 (LOW) と上限 (HI) の基準値を設定します。測定値が下限 (LOW SET) より低いと、試験は FAIL と判定されます。測定値が上限 (HI SET) を超える場合でも、試験は FAIL と判定されます。測定値が下限 (LOW SET) と上限 (HI SET) の範囲内で PASS と判定とされます。下限 (LOW SET) 値は、上限 (HI SET) 値より大きい値で設定できません。

手順

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを HI SET に移動します。



HI SET カーソル



2. ロータリノブを回して上限値 (HI) を設定します。



ACW (HI)	001uA~42.00mA (GPT-12xxx) 001uA~110.0mA (GPT-15xxx)
DCW (HI)	001uA~11.00mA (GPT-12xxx) 001uA~21.00mA (GPT-15xxx)
IR (HI)	000.2MΩ~50.00GΩ, OFF
GB (HI)	000.1mΩ~650.0mΩ
CONT (HI)	00.01Ω~80.00Ω

3. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを LOW SET に移動します。



4. ロータリノブを回して下限値 (LOW SET) を設定します。



ACW (LOW)	000uA~41.99mA (GPT-12xxx) 000uA~109.9mA (GPT-15xxx)
DCW (LOW)	000uA~10.99mA (GPT-12xxx) 001uA~20.99mA (GPT-15xxx)
IR (LOW)	000.1MΩ~49.99GΩ
GB (LOW)	000.0mΩ~649.9mΩ
CONT (LOW)	00.00Ω~79.99Ω



注意

*測定値の分解能は、上限 (HI SET) 値の設定によって異なります。

LOW SET 設定は HI SET 設定を超えることができません。

GPT-12XXX シリーズでは、ACW で 200VA、DCW で 50W まで設定可能です。

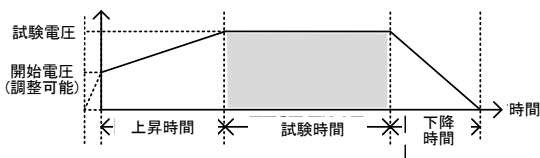
GPT-15XXX シリーズは ACW で最大 500VA、DCW で最大 100W まで設定可能

試験時間の設定

概要

この設定では、試験時間を設定します。試験時間とは、試験電圧または試験電流が DUT に印加される時間を意味します。この時間には、RAMP UP (上昇時間) または RAMP DOWN (下降時間) は含まれません (注意: GB 試験、CONT 試験には、RAMP UP または RAMP DOWN の機能はありません)。試験時間は、ACW、DCW、IR、GB、CONT では 0.3~999.9 秒で設定できます。分解能は、すべてのモードで 0.1 秒です。また、ACW または DCW の試験機能では、試験時間をオフにすることができます。

各試験には RAMP UP (上昇) と RAMP DOWN (下降) の時間があります (GB、CONT を除く)。詳細については、43 ページ、45 ページをご参照ください。



手順

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを TEST TIME に移動します。



TEST TIME カーソル



2. ロータリノブを回して試験時間 (TEST TIME) を設定します。



ACW	OFF, 000.3s~999.9s
DCW	OFF, 000.3s~999.9s
IR	000.3s~999.9s
GB	000.3s~999.9s
CONT	000.3s~999.9s



注意

ACW では、試験電流が 30mA より大きい場合、RAMP UP (上昇) 時間 + 試験時間は 240 秒以上に設定できません。このような電流レベルでは、試験時間またはそれ以上の時間、本器を休止させる必要があります。

試験時間のオフ

ACW または DCW の試験では、試験時間をオフにできます。つまり、FAIL の判定になるまで試験を続けることができます。

通常の TEST TIME 設定と同様、ロータリノブを回して TEST TIME の値を OFF にすることで試験時間をオフにできます。



TEST TIME OFF

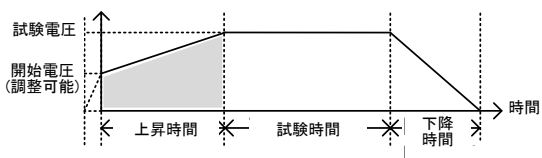


上昇時間(Ramp Up)の設定

概要

上昇(Ramp Up)時間は、設定された試験電圧に達するまでの時間です。上昇時間は、000.1～999.9秒の範囲で設定できます。上昇時間は、ACW、DCW、IR試験で適用されます。

出力電圧 タイミングチャート (抵抗負荷)



手順

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを RAMP TIME に移動します。



RAMP TIME カーソル



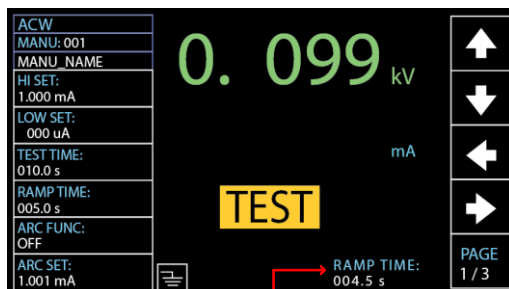
2. ロータリノブを回して上昇時間 (RAMP TIME)を設定します。



ACW	000.1s～999.9s
DCW	000.1s～999.9s
IR	000.1s～999.9s

ランプ時間
(RAMP TIME)
経過インジケータ

RAMP TIME を設定し、START ボタンを押して試験を開始すると、ディスプレイ右下に経過時間が表示されます。設定時間まで表示され、それに続いて試験時間が表示されます(スクリーンショットを参照)。

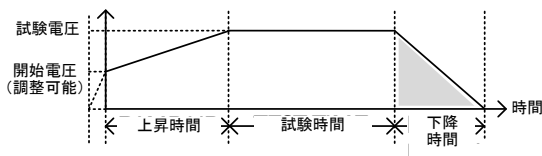


ランプ時間 (RAMP TIME) 経過インジケータ

下降時間(Ramp Down)の設定

概要

下降時間(RAMP DOWN)は、DUT が試験電圧を放電するための時間です。下降時間は、000.0～999.9 秒の範囲で設定できます。下降時間は、ACW、DCW、IR 試験で適用されます。



手順

1. PAGE ソフトキーを押して 2/3 ページにすると、ACW、DCW のための RAMP DOWN 設定が表示されます。

PAGE
2 / 3

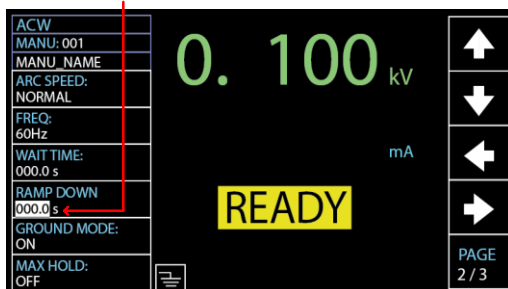
IR 試験では、2/2 ページに RAMP DOWN 設定が表示されます。

PAGE
2 / 2

2. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを RAMP DOWN に移動します。



RAMP DOWN カーソル



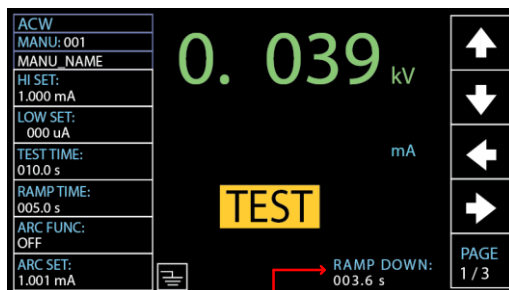
3. ロータリノブを回して下降時間 (RAMP DOWN) を設定します。



ACW	000.0s~999.9s
DCW	000.0s~999.9s
IR	000.0s~999.9s

下降時間
(RAMP DOWN)
経過インジケータ

設定された試験時間が経過すると、ディスプレイ右下に RAMP DOWN のインジケータが表示され、設定された時間までの下降の経過時間が表示されます(下図を参照)。



ランプ時間(RAMP DOWN)経過インジケータ

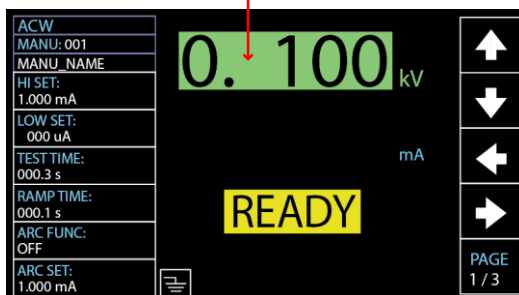
試験電圧または試験電流の設定

概要 試験電圧は、ACW で 0.050kV～5.1kV、DCW で 0.050kV～6.1kV、IR で 0.050kV～1.2kV (50V ステップ) の範囲で設定できます。GB 試験では、試験電流は 3A～33A で設定できます。CONT 試験では、試験電流は固定で、100mA です。

手順 1. 上下の矢印ソフトキーを押し、選択する試験機能により、カーソルを電圧または電流の設定に移動します。



試験電圧／電流のカーソル領域



2. ロータリノブを回して試験電圧または試験電流を設定します。



ACW	0.050kV～5.1kV ¹
DCW	0.050kV～6.1kV ²
IR	0.05kV～1.2kV (50V steps)
GB	03.00A～33.00A
CONT	100mA ³

¹ 50V/10mA の設定電圧に達するには、最低でも 0.3 秒かかります。

² 50V/2mA の設定電圧に達するには、最低でも 0.3 秒かかります。

³ CONT の試験電流は、固定で 100mA です。



注意

電流設定の場合、GPT-12xxx では、ACW(AC 耐電圧)で設定可能な最大出力電力は 200VA、DCW(DC 耐電圧)では最大 50W になります。

GPT-15xxx は、ACW で最大 500VA、DCW で 100W まで設定できます。

アース導通電圧(GBV)は、 $(HI SET 値 \times 試験電流)$ で計算できます。

試験周波数の設定

概要 試験周波数は、AC 入力の周波数に関係なく、50Hz または 60Hz に設定できます。試験周波数の設定は、ACW、GB の試験にのみ適用されます。



注意

試験周波数の設定は、ACW または GB の試験にのみ適用されます。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して 2/3 ページにすると、ACW のための FREQ 設定が表示されます。

PAGE
2 / 3

GB 試験では、1/2 ページに FREQ 設定が表示されます。

PAGE
1 / 2

2. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを FREQ に移動します。



FREQ 設定カーソル






3. ロータリノブを回して試験周波数を設定します。





ACW、GB 50Hz、60Hz

オフセット(Reference)の設定

概要 REF VALUE は、オフセットとして機能します。REF VALUE(オフセット)の設定値は、測定電流 (ACW、DCW の場合)または測定抵抗(IR、GB、CONT の場合)から引き算されます。

- 手順**
1. PAGE ソフトキーを押して 3/3 ページにすると、ACW、DCW では REF VALUE 設定が表示されます。 
 - IR、GB では、2/2 ページに REF VALUE 設定が表示されます。 
 - CONT では、1/1 ページに REF VALUE 設定が表示されます。 

2. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを REF VALUE に移動します。  

REF VALUE 設定カーソル



3. ロータリノブを回して REF 値を設定します。



ACW	000uA~41.99mA (GPT-12xxx) *HI SET+REF 値 \leq 42.00mA 000uA~ 109.9mA (GPT-15xxx) *HI SET+REF value \leq 110.0mA
DCW	000uA~ 10.99mA (GPT-12xxx) *HI SET + REF value \leq 11.00mA 000uA~ 20.99mA (GPT-15xxx) *HI SET+REF value \leq 21.00mA
IR	000.0M Ω ~50.00G Ω
GB	000.0m Ω ~650.0m Ω *ISET \times (HI SET+REF 値) は 7.2V 未満
CONT	00.00 Ω ~80.00 Ω * ISET (100mA) \times (HI SET+REF 値) は 8V 未満



注意

IR 試験では、本器のオフセット値は GND OFFSET 機能経由で自動的に決まります。詳細については、62 ページを参照してください。

GB、CONT 試験では、本器のオフセット値は ZERO CHECK 機能経由で自動的に決まります。詳細については、66 ページを参照してください。

初期電圧の設定

概要

原則として、ACW、DCW 共に、試験電圧は TEST TIME (試験時間) 前の RAMP TIME (上昇時間) の設定にしたがって、徐々に、直線的に、設定された電圧に向かって 0V から上昇します。

しかし、特定の条件では開始試験電圧に対して特定の割合を設定することができます。このように、INIT VOLTAGE (初期電圧) を設定することで、さまざまなアプリケーションに対応できます。

INIT VOLTAGE 設定で試験電圧のパーセント(%)値を設定することで、開始電圧を設定できます。



注意

INIT VOLTAGE の設定は、ACW、DCW の試験でのみ有効になります。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して 3/3 ページにすると、ACW、DCW では INIT VOLTAGE 設定が表示されます。

PAGE
3 / 3

2. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを INIT VOLTAGE に移動します。



INIT VOLTAGE 設定カーソル

3. ロータリノブを回して初期電圧 (INIT VOLTAGE) のパーセント(%)を設定します。



INIT VOLTAGE 000%~099%

保留時間(WAIT TIME)の設定

概要

保留時間 (Wait Time) は、FAIL 判定が表示されるまでの保留時間です。初期設定では、FAIL 判定は試験開始から 0.3 秒経過後に始まります。しかし、Ramp Up (上昇) 時間を 0.5 秒に、試験時間を 1.0 秒に設定し、保留時間を 1.0 秒に設定すると、試験開始から 0.5 秒経過後に FAIL 判定を始めます。このように、保留時間は、Ramp Up 時間、試験時間よりも優先されて FAIL 判定表示されます。

WAIT TIME は、ACW、DCW、IR 試験でのみ適用されます。

手順

1. PAGE ソフトキーを押します。
ACW、DCW の試験 では、2/3 ページに WAIT TIME 設定が表示されます。

PAGE
2 / 3

IR 試験では、1/2 ページに WAIT TIME 設定が表示されます。

PAGE
1 / 2

上下の矢印ソフトキーを使用してカーソルを WAIT TIME に移動します。



WAIT TIME 設定カーソル



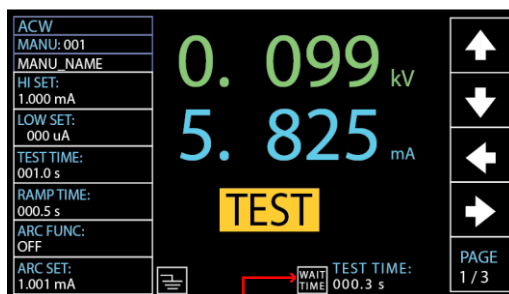
3. ロータリノブを回して保留時間 (WAIT TIME)を設定します。



ACW 000.0s~999.9s
 DCW 000.0s~999.9s
 IR 000.0s~999.9s

WAIT TIME
 インジケータ

保留時間が設定されると、テスト実行中に WAIT TIME のインジケータが表示されます。



WAIT TIME インジケータ



注意

保留時間中に、試験電圧が設定電圧の 1.1 倍を超えた場合、過電圧として、直ちに試験を停止します。

保留時間中、試験電流が以下の最大電流を超えた場合、過電流として、直ちに試験を停止します。

	GPT-12xxx	GPT-15xxx
ACW	40mA	100mA
DCW	10mA	20mA

ARC(アーク検出)機能の設定

概要

ARC(アーク検出)機能は、フラッシュオーバーとも呼ばれ、通常は検出されない高速の過渡電圧、過渡電流を検出します。アークは通常、絶縁耐圧が弱いところ、電極ギャップ、あるいは ACW、DCW 試験における一時的な電流または電圧のスパイクの原因となる絶縁問題の結果として現れます。

ARC 機能には、OFF(アーク検出動作 OFF)、ON & CONT(アーク検出動作 ON、検出しても試験継続)、ON & STOP(アーク検出 ON、検出時には試験停止)の3種類の設定があります。

ON & CONT(検出して継続)は、ARC の電流設定値を超えると検出しますが、試験を継続します。ON & STOP(検出して停止)は、アークを検出すると試験を停止します。

ARC 機能の設定は、ACW、DCW の試験でのみ有効になります。

手順

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを ARC FUNC に移動します。



ARC FUNC 設定カーソル



2. ロータリノブを回して ARC 機能を設定します。



ARC 機能: OFF, ON & CONT, ON & STOP

3. ARC MODE が ON & CONT、または ON & STOP に設定されると、ARC 電流レベルが設定できます。下矢印ソフトキーを押してカーソルを ARC SET に移動します。



ARC SET 設定カーソル



4. ロータリノブを回して ARC SET のレベルを設定します。



ACW	1.000mA~80.00mA (GPT-12xxx) 1.000mA~200.0mA (GPT-15xxx)
DCW	1.000mA~20.00mA (GPT-12xxx) 1.000mA~40.00mA (GPT-15xxx)

5. ARC MODE が ON & CONT、または ON & STOP に設定されると、ARC 速度、すなわち ARC として検出するためのスレッシュホールド幅が設定できます。PAGE ソフト・キーを押して 2/3 ページにすると、ACW、DCW のための ARC SPEED 設定が表示されます。



6. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを ARC SPEED に移動します。



ARC SPEED 設定カーソル



7. ロータリノブを回して ARC SPEED のレベルを設定します。



ARC SPEED	FAST	検出されるアークの幅が狭い場合のスレッシュヨルド
	NORMAL	検出されるアークの幅が一般的な場合のスレッシュヨルド
	SLOW	検出されるアークの幅が広い場合のスレッシュヨルド

MAX HOLD (最大測定値保持機能) の設定

概要

MAX HOLD (最大測定値保持機能) は、ACW、DCW 試験では試験中の最大電流値を保持します。IR、GB 試験では、最大抵抗値を保持します。

、IR 試験で試験時間を 120 秒にし、MAX HOLD を有効にすると、30 秒間で測定された最大抵抗値は、それより大きな値が現れるまで表示され、保持されます。それより大きな抵抗値が現れない場合、30 秒間で測定された最大値は 120 秒間の試験時間が終わるまで保持されます。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して 2/3 ページにすると、ACW、DCW のための MAX HOLD 設定が表示されます。



IR、GB では、2/2 ページに MAX HOLD 設定が表示されます。



2. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを MAX HOLD に移動します。



MAX HOLD 設定カーソル



3. ロータリノブを回して MAX HOLD を設定します。



MAX HOLD OFF、ON

PASS HOLD (PASS 表示保持) の設定

概要 PASS HOLD 設定は、ディスプレイに PASS 判定が表示される時間を設定します。PASS HOLD を設定すると、設定時間が経過するまで PASS の判定が保持されます。



注意

PASS HOLD の設定は、MANU (単独) 試験にのみ適用されます。AUTO (自動) 試験では無視されます。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して 3/3 ページにすると、ACW のための PASS HOLD 設定が表示されます。

DCW では、2/3 ページに表示されません。

IR、GB では、2/2 ページに PASS HOLD 設定が表示されます。

CONT では、1/1 ページに PASS HOLD 設定が表示されます。

2. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを PASS HOLD に移動します。



PASS HOLD 設定カーソル



3. ロータリノブを回して PASS HOLD の値を設定します。



PASS HOLD 000.0s~999.9s, ON



・PASS HOLD の設定時間中は STOP ボタンを押すことができ、PASS HOLD の設定は停止します。すなわち、必要に応じて、いつでも PASS HOLD の設定を中止することができます。

・ON が選択されている場合、PASS HOLD の期間は、STOP キーがさらに押されるまで継続されます。ただし、ブザーは、0.5 秒間だけ鳴ります。

IR (絶縁抵抗) モードの設定

概要

IR モードの設定には、STOP ON FAIL (FAIL で停止)、STOP ON PASS (PASS で停止)、TIMER (タイマ) があり、IR 試験のみで適用されます。

IR モードを STOP ON FAIL に設定すると、FAIL になった場合、試験時間の長さに関係なく、試験時間の最初 0.3 秒の間 FAIL が表示されます。

IR モードを STOP ON PASS に設定すると、PASS になった場合、試験時間の長さに関係なく、試験時間の最初 0.3 秒の間 PASS が表示されます。

IR モードを TIMER に設定すると、試験時間で試験を実行してから PASS または FAIL を表示します。



注意

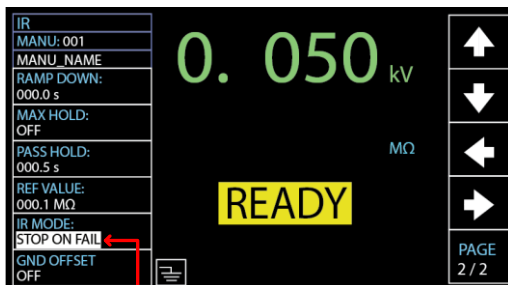
DUT が短絡などの異常な状態では、TIMER が設定されていても、SHORT 警告の FAIL 判定は、設定されたテスト時間に関係なくすぐに表示されません。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して 2/2 ページにすると、IR のための IR MODE 設定が表示されます。

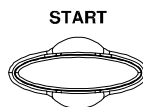
PAGE
2 / 2

2. 上下の矢印ソフトキーを使用してカーソルを IR MODE に移動します。



IR MODE 設定カーソル

3. START ボタンを押して GND OFFSET を実行します。GND OFFSET が完了すると、下図のように、本器の抵抗は REF VALUE に加算されます。



本器の抵抗値

GB Contact の設定

概要 原則として、GB(アース導通)試験には Ramp Up (上昇)時間がないため、試験時間から直接開始されます。ラインなどで自動的に流れてくる DUT に対して次々に GB 試験を行う場合、また治具の接続のための時間が必要な場合、GB CONTACT を設定することで、必要に応じて独自の時間設定を適用させることができます。

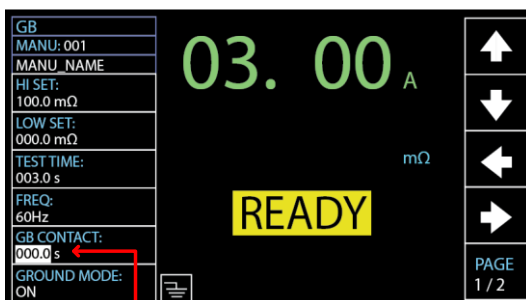


注意

GB CONTACT 設定は、GB 試験のみで適用されます。

手順

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを GB CONTACT に移動します。



GB CONTACT 設定カーソル

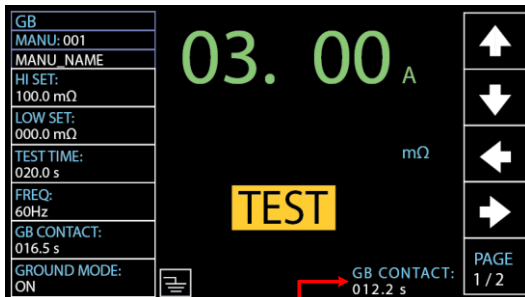
2. ロータリノブを回して GB CONTACT の値を設定します。



GB CONTACT 000.0 s~999.9s

GB CONTACT
経過時間

GB CONTACT を含む、すべてのパラメータを設定したら、START ボタンを押して GB 試験を開始します。ディスプレイ右下に、試験時間の後の GB CONTACT 経過時間が表示されます。下図を参照してください。



GB CONTACT 期間インジケータ

テストリードのゼロ調整

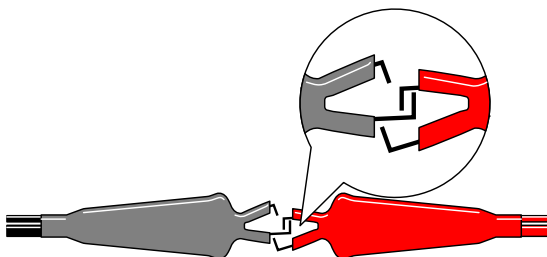
概要 ゼロ調整機能は、GB、CONT 試験におけるテストリードの抵抗を求めます。ZERO CHECK を実行すると、測定されたテストリードの抵抗値は自動的に基準値として設定されます。



注意

ZERO CHECK 設定は、GB、CONT 試験のみに適用されます。

手順 1. 図に示すように、正負のワニ口クリップを短絡します。



2. PAGE ソフトキーを押して 2/2 ページにすると、GB のための ZERO CHECK 設定が表示されます。

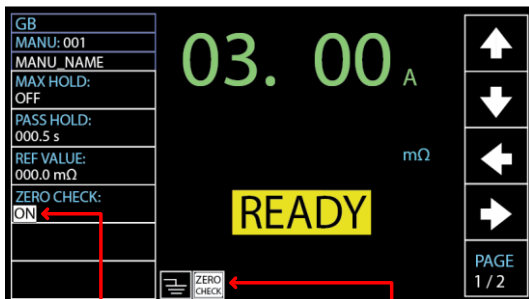
PAGE
2/2

CONT 試験では、1/1 ページに ZERO CHECK 設定が表示されます。

PAGE
1/1

3. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを ZERO CHECK に移動します。ON に設定すると、ZERO CHECK のインジケータが表示されます。

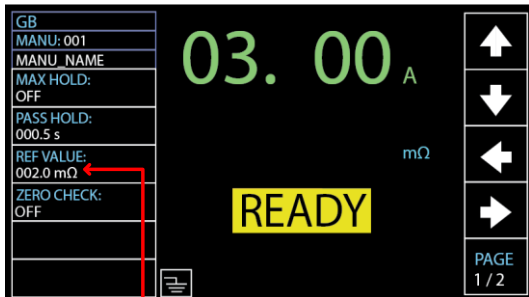
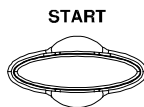




ZERO CHECK 設定カーソル

ZERO CHECK インジケータ

4. START ボタンを押して ZERO CHECK を実行します。ZERO CHECK 完了後の測定抵抗値は、下図のように REF VALUE の欄に加わります。



テストリードの抵抗値



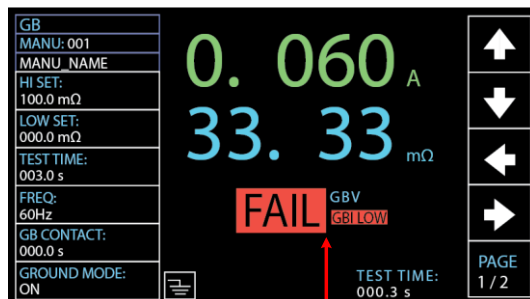
注意

GB 試験を行う前に、短絡されたテストリードを DUT に接続し直すことを忘れないようにご注意ください。

FAIL – GBI LOW

Ground Bond HF/LF 端子が接続されていないか締め付けが不十分な場合、FAIL -GBI LOW ステータスが表示されます。

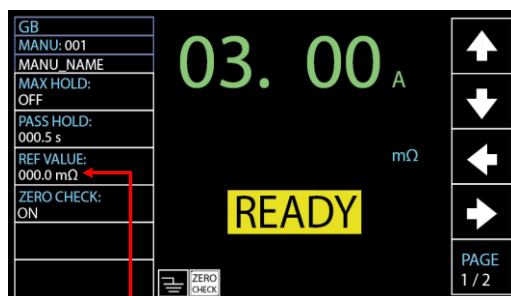
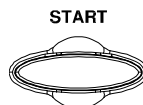
Ground Bond HF/LF 端子の接続を再度確認してください。



FAIL – GBI LOW の状態

REF VALUE = 0

+STOP ボタンを押すと、テストリードの抵抗値は正しく REF VALUE に入らず、下図のように 000.0mΩ が表示されます。Ground Bond HF/LF 端子の接続を再度確認し、START ボタンを押すと ZERO CHECK が実行されます。



REF VALUE = 0

グラウンドモード(GROUND MODE)の設定

概要

GROUND MODE を ON に設定すると、本器は RETURN 端子を大地アースに接地します。このモードはシャーシ、フィクスチャまたは動作環境によって大地アースをとる DUT に適しています。このモードでは、大地アースに対する HIGH VOLTAGE 端子の電位を測定します。このため、大地アースにリークする成分、ノイズ等も測定されます。正確さという点では潜在的に問題はありますが、もっとも安全な試験モードです。

GROUND MODE を OFF に設定すると、RETURN 端子は大地アースに対して非接地状態になります。このモードは、DUT が非接地（フローティング）であり、大地アースに直接接続されない DUT のためのモードです。試験回路の DUT 側の、大地アースにリークする成分、ノイズ等が軽減されることがあるため、GROUND MODE が ON の場合に比べて正確さが期待できます。



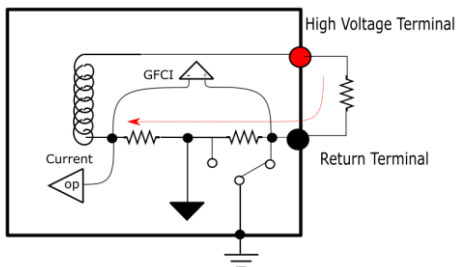
GROUND MODE が OFF の場合、DUT、フィクスチャ、接続された機器は接地しないでください。接地すると、試験中、内部回路に短絡経路が形成され危険です。

ACW、DCW 試験において、DUT を含む試験セットアップが接地されているか、接地されていないか不明な場合は、必ず GROUND MODE を ON に設定してください。

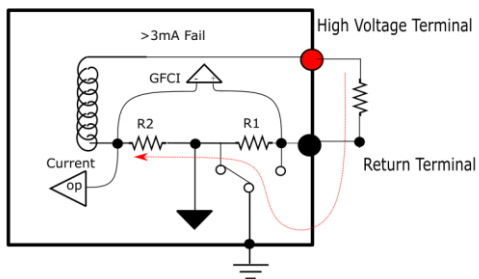
GROUND MODE を OFF にするのは、DUT が電氣的に非接地（フローティング）の状態が確認できる場合のみです。

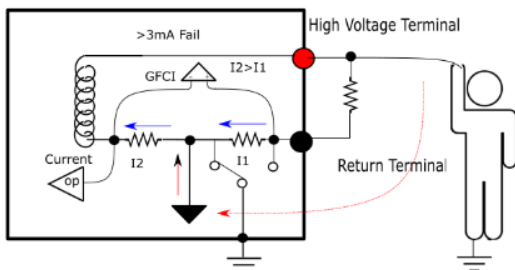
ACW テスト
DCW テスト

ACW/DCW、GROUND MODE = ON、
DUT : 接地

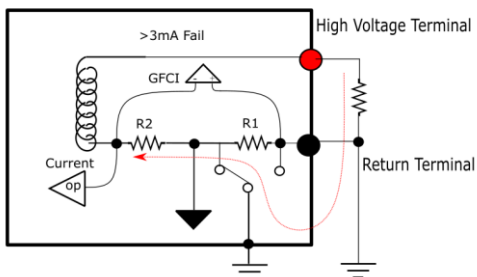


ACW/DCW、GROUND MODE = OFF、
DUT : 非接地





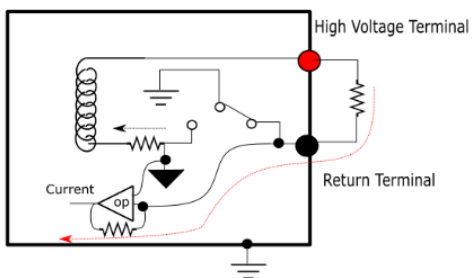
GROUND MODE が OFF の場合、万が一、使用者が DUT に触れ、I1 と I2 の電流を比較した結果、電流値が 3mA を超えると、GFCI (グラウンドフェイルチェック割り込み) 機能がアクティブになり、ただちに出力が停止します。



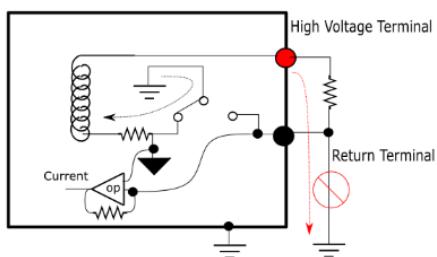
DUT が接地されている場合も、R1 に電流が流れず、3mA を超えると同様に GFCI が発生します。

IR テスト

IR、GROUND MODE = ON、
DUT : 接地



IR、GROUND MODE = OFF、
DUT : 非接地

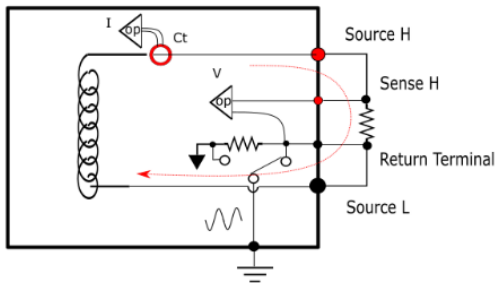


注意

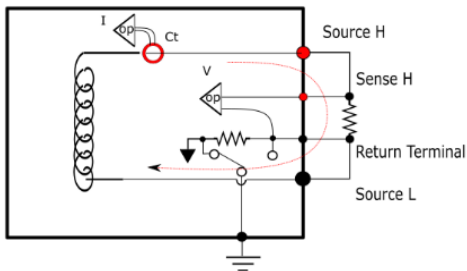
GROUND MODE が OFF の時、DUT が接地されていると、正確に電流を測定できず、抵抗値は実際よりも大きい値になります。
結果に信頼性はありません。
DUT は接地しないでください。

GB テスト

GB、GROUND MODE = ON、
DUT: 接地

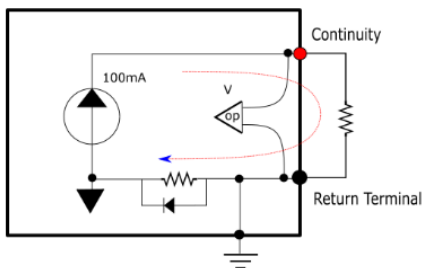


GB、GROUND MODE = OFF、
DUT: 非接地



Cont テスト

Cont.、GROUND MODE = ON、
DUT: 接地





注意

Cont. 導通テストに関しては、DUT の接地が必須であるため、GROUND MODE は常に ON です。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して 2/3 ページにすると、ACW、DCW のための GROUND MODE 設定が表示されず。
IR、GB では、1/2 ページに GROUND MODE 設定が表示されます。

2. 上下の矢印ソフトキーを使用してカーソルを GROUND MODE に移動します。



GROUND MODE カーソル

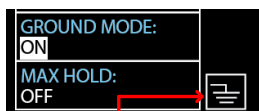


3. ロータリノブを回して GROUND MODE を設定します。

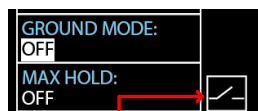


GROUND MODE OFF、ON

4. ディスプレイに表示される GROUND MODE アイコンも切り替わります。



GROUND MODE : ON



GROUND MODE : OFF



注意

IR 試験で GROUND モードを ON として試験時間設定を 0.5s より小さくした場合、下図のように TEST TIMR<0.5s と表示され、試験時間を 0.5s 以上に再設定しないと IR 試験を開始できません。41 ページを参照し、試験時間を 0.5s 以上に設定してください。



コンタクトチェック (CONTACT CHK) の設定

概要

CONTACT CHK 機能は、50V/400Hz の出力を用いて、ACW、DCW、および IR テストの前に、テストリードと DUT の間にオープンまたはショートが発生しているかどうかを判断する機能です。この機能を有効にする前に、基準値と関連するしきい値を定義する必要があります。詳細については、167 ページを参照してください。



注意

CONTACT CHK 設定は、ACW、DCW、および IR モードにのみ適用されます。

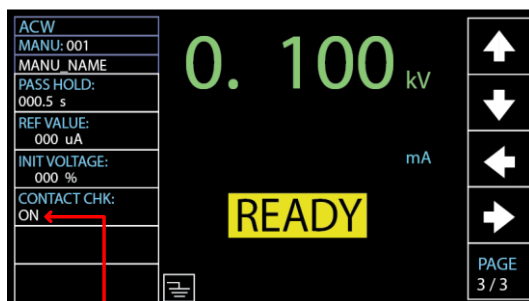
手順

1. DUT とのテストリードを適切に接続した後、最初に基準値と関連するしきい値を定義する方法について 167 ページを参照してください。

2. PAGE ソフトキーを押して、3/3 ページに移動します。ACW、DCW、および IR テストの CONTACT CHK 設定が表示されます。

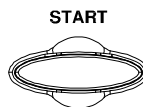
PAGE
3 / 3

3. 上/下の矢印ソフトキーを押して、カーソルを CONTACT CHK に移動します。ロータリノブを回して CONTACT CHK をオンにします。



コンタクトチェック: ON

4. START ボタンを押した後、本器は MANU テストを実行する前にコンタクトチェックを実行します。測定された電流が、基準値のユーザー定義の割合より低い場合は、「OPEN」ステータスが画面に表示されます。測定された電流が、基準値のユーザー定義の割合より高い場合は、「SHORT」ステータスが表示されます。

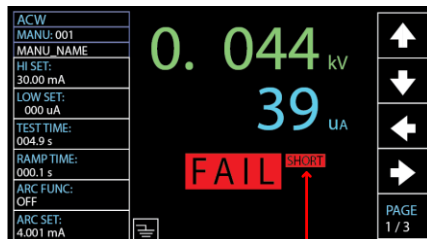


OPEN
ステータス



本器と DUT の接続がオープンの場合

SHORT
ステータス



本器と DUT の接続がショートの場合



注意

CONTACT CHK がオンになっている場合、基準値が 30uA 未満に定義されている場合、CONTACTCHK は無効になります。基準値の詳細については、167 ページを参照してください。

ACW/DCW テストフィルタ設定

概要

フィルタ機能は ACW/DCW/IR テストで利用できません。ACW 及び DCW ではフィルタ機能をオンすると歪んだピーク波形に対して判定を行わないように 100ms ごとの瞬時値を利用して測定を行います。



注意

フィルタ機能は GB テストでは利用できません。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して、3/3 ページに移動します。ACW/DCW テストのフィルタ設定が表示されます。

PAGE
3 / 3

2. 上/下の矢印ソフトキーを押して、カーソルを FILTER setting に移動します。



3. ロータリノブを回してフィルタ設定を変更します。

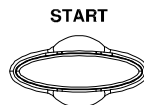


FILTER OFF, ON



FILTER設定 ON

4. スタートボタンを押すと設定が確定します。



IR テストフィルタ設定

概要

IR テストのフィルタ機能は容量性負荷に対して利用します。



注意

フィルタ機能は GB テストでは利用できません。

手順

1. PAGE ソフトキーを押して、3/3 ページに移動します。IR テストのフィルタ設定が表示されます。

PAGE
3 / 3

2. 上/下の矢印ソフトキーを押して、カーソルを FILTER setting に移動します。



3. ロータリノブを回してフィルタ設定を変更します。



FILTER OFF, LEVEL 1 ~ 10

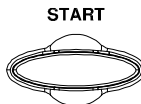
LEVEL 1 1 秒ごとの平均化を行います。

LEVEL 10 10 秒ごとの平均化を行います。

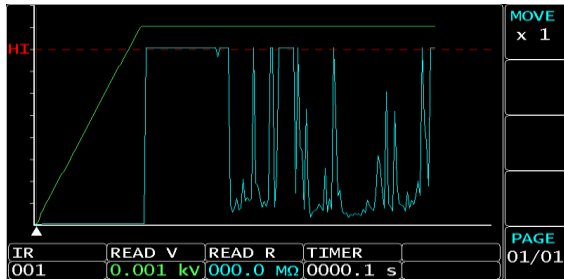


FILTER 設定 LEVEL 10

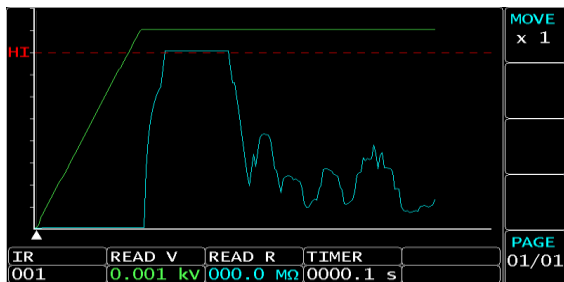
4. スタートボタンを押すと設定が確定します。フィルタの効果は次の通りです。



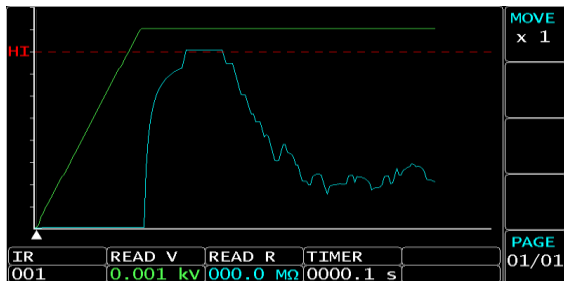
OFF



LEVEL 1
1 秒平均化



LEVEL 2
2 秒平均化



画面のハードコピー

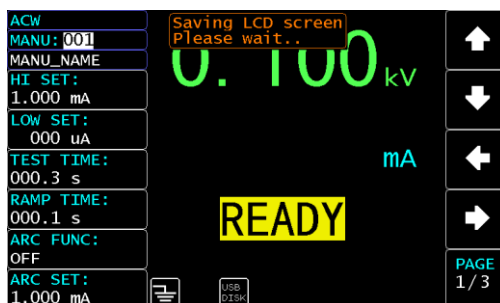
概要

USB メモリをフロントパネルの USB ポートに接続すると、ハードコピー機能を実行し、表示されている画面をキャプチャすることができます。

USB メモリに保存されたファイルは、bmp 形式で、ファイル名は GPT1X000 / SCREEN ディレクトリ内の LCDGET01.bmp～LCDGET99.bmp となります。

手順

1. SYSTEM キーを 2 秒以上押し続けると、ハードコピー中のメッセージが上部に表示されます。

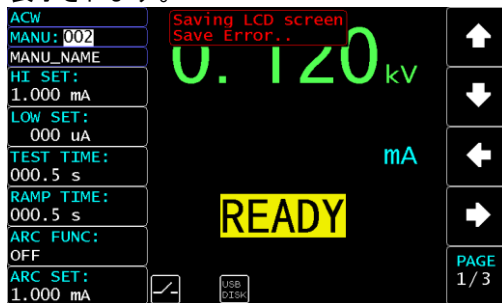


テスト実行中の場合、ハードコピー機能は使用できません。完了後に利用してください。

USB メモリは 32Gbyte 以下の FAT32 形式でフォーマットされたものが対応となります。

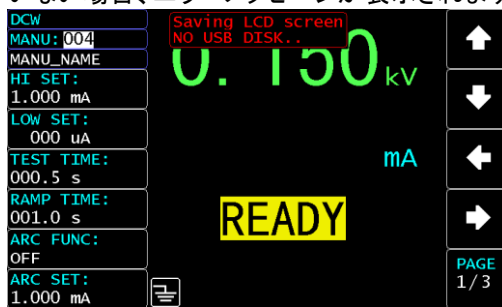
ファイル名の上限

ハードコピーの際、ファイル名の上限 LCDGET99.bmp に達すると、エラーメッセージが表示されます。



No USB Disk

ハードコピーの際、USBメモリが本器に接続されていない場合、エラーメッセージが表示されます。



単独 (MANU[AL]) 試験の実行

概要 試験は READY が表示されている場合のみ実行できます。



以下の条件では、試験は開始できません。

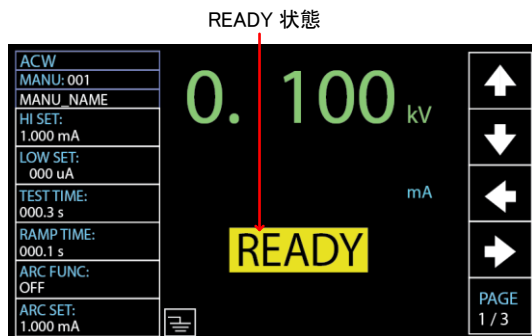
- 保護機能が働いた場合 — 保護機能が働くと、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージについては、245 ページを参照してください。
 - インターロック (INTERLOCK) 機能が ON で、SIGNAL I/O ポートにインターロックキーがない場合 (133 ページ参照)。
 - 外部リモートで STOP 信号を受信した場合。
 - Double Action が ON の場合、STOP ボタンを押してから 0.5 秒以内に START ボタンを押さないと試験は開始しません。
-



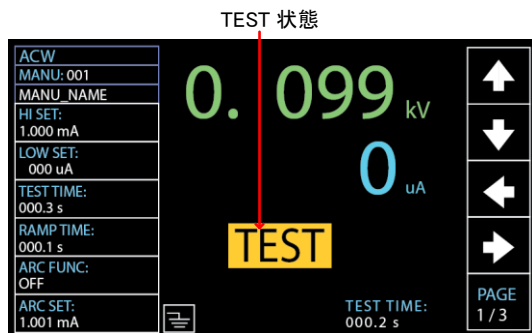
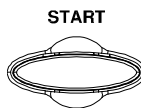
特別単独 (MANU) 試験モードを除き、試験中は出力電圧を変更できません。詳細については、93 ページを参照してください。

手順

1. 試験するモードで READY の状態に 28 ページ
なっていることを確認します。

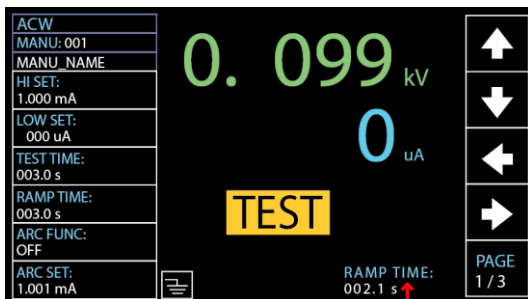


2. READY の状態になっていることを確認し、START ボタンを押します。単独 (MANU) 試験が開始し、TEST の状態になります。



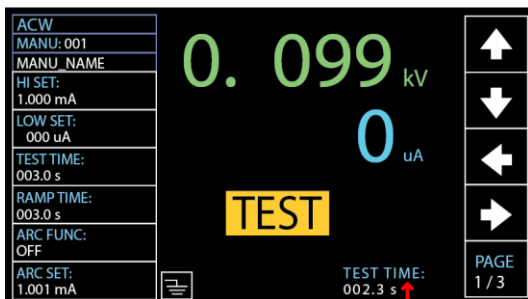
3. 試験が開始すると、上昇 (RAMP UP)、試験、下降 (RAMP DOWN) の経過時間が表示されます。試験は、完了するか、停止されるまで続きます。

上昇時間
(RAMP UP)



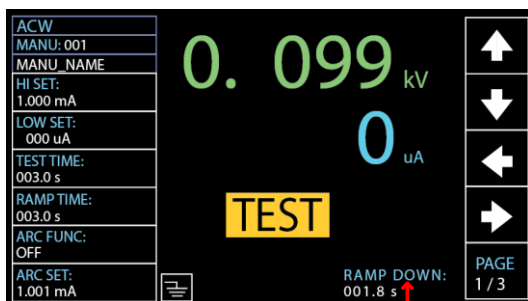
RAMP UP 経過時間

試験時間
(TEST TIME)



TEST TIME 経過時間

下降時間
(RAMP DOWN)

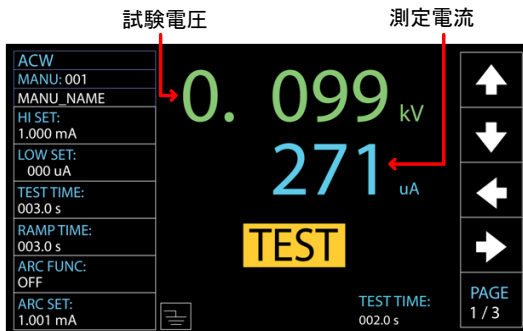


RAMP DOWN 経過時間

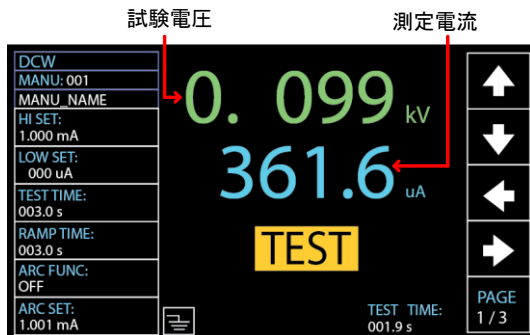


下降時間(RAMP DOWN)は、有効になっている場合にのみ表示されます。詳細については、45 ページを参照してください。

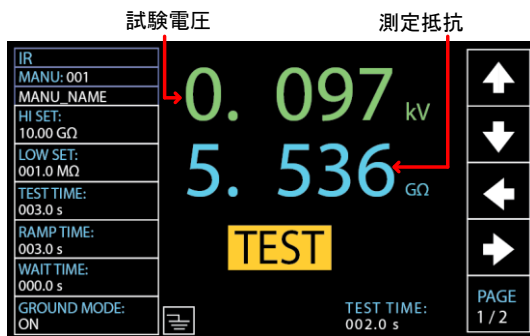
ACW の例



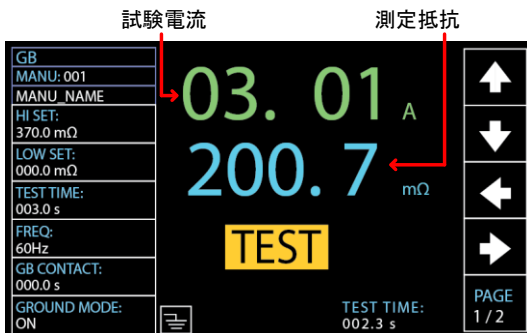
DCW の例



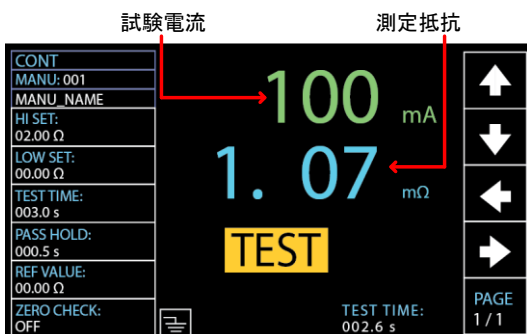
IR の例



GB の例

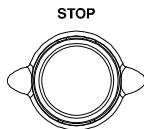


CONT の例



試験の停止

1. 試験実行中、STOP ボタンを押せばいつでも試験を停止できます。試験はただちに停止します。STOP ボタンを押すと、合否判定はされずに READY 状態に戻ります。



注意

試験実行中は、いかなる端子、テストリード、その他の接続に触れないでください。

単独 (MANU[AL]) 試験の PASS/FAIL

概要 試験が停止されずに、または保護回路が働かずに試験が完了すると、試験結果 (PASS または FAIL) が表示されます。



注意

以下の場合に PASS と判定されます。

- 試験中に、上限 (HI SET)、下限 (LO SET) の基準値を超えない場合。

以下の場合に FAIL と判定されます。

- 試験中に、上限 (HI SET) または下限 (LO SET) の基準値を超えた場合。
- 試験中に保護回路が働いた場合。エラーメッセージの詳細については、245 ページを参照してください。

PASS 判定

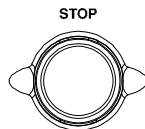
1. PASS と判定されると、ディスプレイに PASS が表示され、ブザーが鳴り、PASS のインジケータが緑に点灯します。

PASS



2. PASS と判定されると、本器はただちに READY (準備完了) の状態に戻ります。ただし、PASS HOLD の設定が有効になっている場合は、PASS HOLD の設定時間が経過するまでは PASS 判定の状態が続きます。詳細については、59 ページを参照してください。

また、PASS HOLD の設定時間中に STOP ボタンを押すと、ただちに READY 状態に戻ることができます。



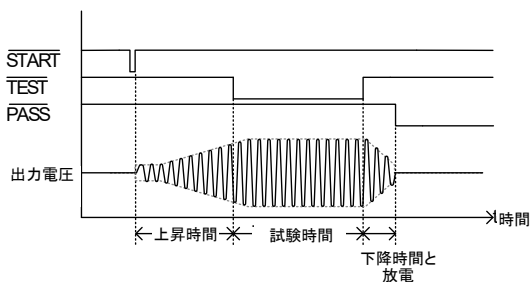
注意

ブザーが鳴っている間、START ボタンは機能しません。

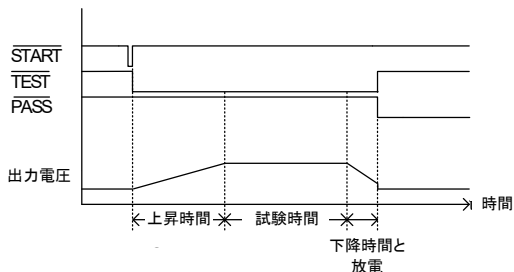
PASS のタイミ ングチャート

ACW、DCW、IR、GB、CONT 試験における、START 状態、TEST 状態、PASS 判定のタイミ
ングチャートを以下に記します。

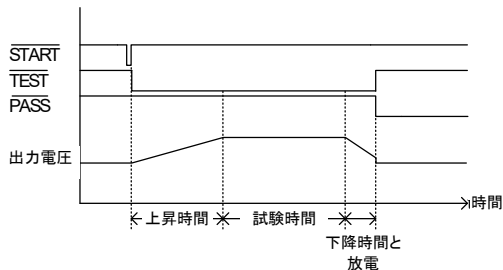
ACW の PASS タイミ ング



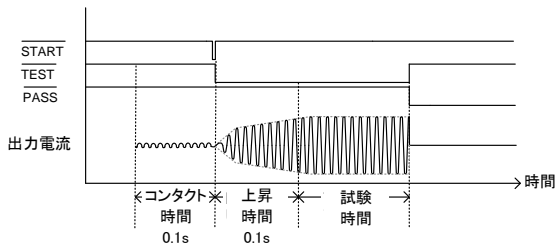
DCW の PASS タイミ ング



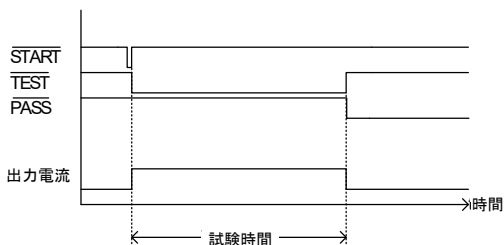
IR の
PASS タイミング



GB の
PASS タイミング

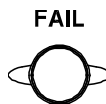


CONT の
PASS タイミング

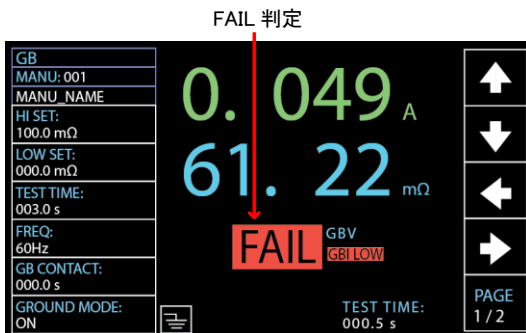


FAIL 判定

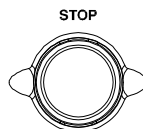
1. FAIL と判定されると、ディスプレイに FAIL が表示され、ブザーが鳴り、FAIL のインジケータが赤に点灯します。



FAIL と判定されると、端子の電源はただちに OFF になります。



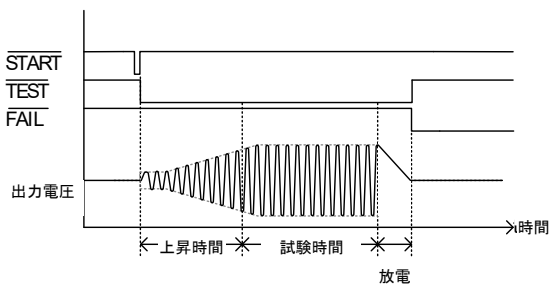
2. STOP ボタンが押されるまで、FAIL はディスプレイに表示されます。STOP ボタンを押すと、本器は READY の状態に戻ります。



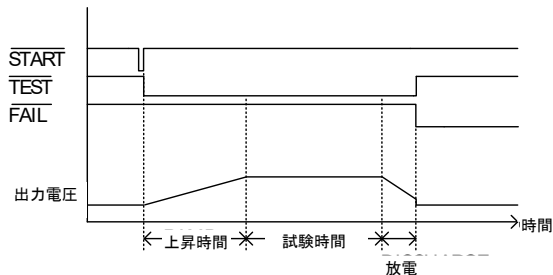
FAIL の
タイミングチャート

ACW、DCW、IR、GB、CONT 試験における、START 状態、TEST 状態、FAIL 判定のタイミングチャートを以下に記します。

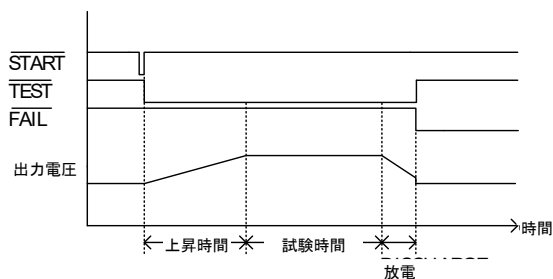
ACW の
FAIL タイミング



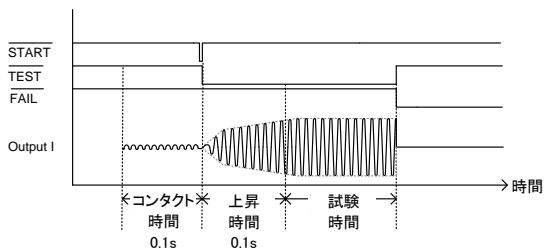
DCW の
FAIL タイミング



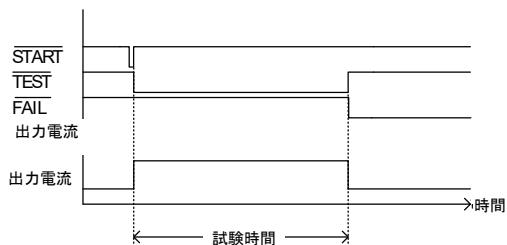
IR の
FAIL タイミング



GB の
FAIL タイミング



CONT の
FAIL タイミング



特別 単独 (MANU[AL]) 試験モード (000)

特別試験モード の概要

MANU 番号で 000 を選択すると、特別試験モードが有効になります。特別試験モードでは、試験中、電圧がリアルタイムに変更できます (ACW、DCW のみ)。通常の操作と違い、READY 状態でも試験機能を変更できます。

特別試験モードでは、ACW、DCW、IR、GB、CONT の試験機能の設定が個別に保存できます。すなわち、ACW、DCW、IR、GB、CONT のそれぞれの設定が、MANU 番号 000 で同時に保存できます。

手順

1. MANU 番号 000 を選択すると、特別 37 ページ
試験モードになります。

2. フロントパネルのソフトキーを押すと、
前回のその試験機能の設定が呼び
出せます。

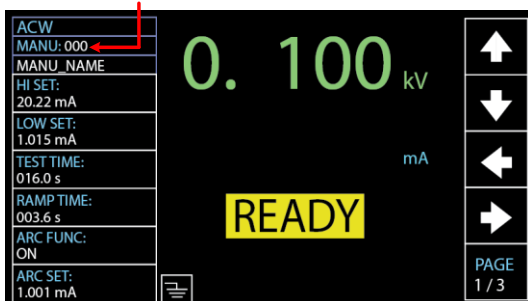
、現在 DCW のモードの場合、ここで
ACW のソフトキーを押すと、特別単
独モードで前回保存した ACW の設
定が呼び出せます。



3. すべてのパラメータを設定し、保存します。 37～69 ページ

注意:それぞれの試験機能(ACW、DCW、IR、GB、CONT)の設定が保存できます。特別単独(MANU)試験モードにおけるACWの例を以下に示します。

特別 MANU 番号 000



試験の実行

1. 特別試験モード(000)では、試験は通常の単独(MANU)試験モードと同様に開始、停止します。詳細については、83 ページを参照してください。
2. ACW、DCW のモードでは、必要に応じ、試験中にロータリノブを回すことでリアルタイムに電圧を変更できます。



ACW 0.050kV～5kV
DCW 0.050kV～6kV

試験結果

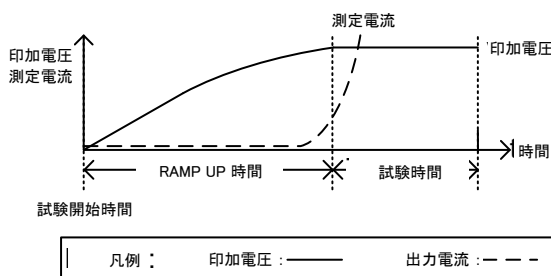
試験結果は、通常の単独(MANU)試験と同様です。詳細については、「単独(MANU[AL])試験の PASS/FAIL」の項を参照してください。 88 ページ

スイープ機能

スイープ機能 概要

本器にはスイープ機能が搭載されており、ACW/DCW/IR/GB/CONT の各試験を単独 (MANU)試験モード あるいは 特別単独(MANU)試験モードで実行した場合に、電圧/電流/抵抗の時間変化をグラフ表示させることができ、測定値を読み取ることができます。

下図は DCW 試験の際に表示されるグラフの例です。ユーザーが設定した DC 電圧まで出力電圧が上昇し、HI SET 設定値に達して試験がストップするか、設定された試験時間が経過するまでが表示されます。



グラフ表示される項目は、実行する試験によって変化します。

実施する試験 グラフ表示される項目

ACW	印加電圧と電流測定値 (V, I)
-----	-------------------

DCW	印加電圧と電流測定値 (V, I)
-----	-------------------

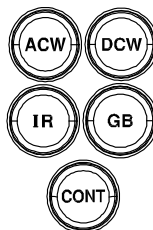
IR	印加電圧と抵抗測定値 (V, R)
----	-------------------

GB	印加電流と抵抗測定値 (I, R)
----	-------------------

CONT	印加電流と抵抗測定値 (I, R)
------	-------------------

スイープ機能の
グラフ表示の
方法

1. 試験が終わった後で、実施した試験のボタンを押してください。
、DCW 試験を実施した場合には、DCW ボタンを押します。ボタンを押すと、試験結果のグラフが表示されます。



グラフ表示される項目

実施した試験	緑色の線	青色の線
ACW	印加電圧	電流測定値
DCW	印加電圧	電流測定値
IR	印加電圧	抵抗測定値
GB	印加電流	抵抗測定値
CONT	印加電流	抵抗測定値

DCW 試験の
スイープ機能の
グラフ表示例



カーソル位置の測定値

2. ロータリノブで、赤色表示されている時間軸のカーソルを動かすと、カーソル位置における時間と緑線と青線の測定値が、橙色で表示されている領域に表示されます。また、実施した試験内容と試験番号もここに表示されます。
赤色の点線で表示される縦軸の「HI」の値は、実施した試験の「HI SET」の値を表しています。



表示ページの
切り替え

3. 650 ステップを超える場合には、結果グラフは 1 ページでは入り切りません。(1 ステップ当たりの時間は 0.1s です。)
この場合、PAGE ソフトキーを押すことで、表示させるページを切り替えることができます。

PAGE
01/02
PAGE
02/02

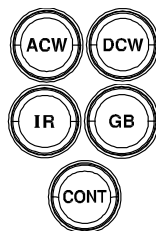
カーソルの
早送り

4. MOVE ソフトキーを押してからカーソルを動かすと、カーソルの移動量が 10 倍になります。測定ポイント数が多い場合に有用です。
もう一度 MOVE ソフトキーを押すことで、通常の移動量に戻ります、

MOVE
x 1
MOVE
x 10

グラフ表示の
終了

スイープ機能のグラフ表示を終わらせるには、実施した試験のボタンを再度押してください。
ボタンを押すことで、単独(MANU)試験の表示に戻ります、



自動(AUTO)試験

この章では、自動(AUTO)試験の設定、編集、実行方法について説明します。自動(AUTO)試験では、最大 10 種類の単独(MANU)試験を組合せ、1 つの自動(AUTO)試験として順番に実行できます。AUTO 試験の作成では、保存された単独(MANU)試験の手順が使用できます。また、5 種類までの自動(AUTO)試験を 1 つのグループとしてまとめ、拡張 AUTO 試験として実行できます。

自動(AUTO)試験の選択と呼出	99
自動(AUTO)試験のファイル名の作成	100
自動(AUTO)試験へのステップの追加	101
自動(AUTO)試験の連続実行	102
自動(AUTO)試験ページの編集	104
自動(AUTO)試験の実行	111
自動(AUTO)試験の結果	116

本器を操作する前に、17 ページの「セットアップ」の章の安全に関する項をお読みください。

自動(AUTO)試験の選択と呼出

概要 自動(AUTO)試験を作成、実行するには、まず自動(AUTO)モードにする必要があります。

最大 100 種類の自動(AUTO)試験が保存、呼出できます。

手順

1. 本器が単独(MANU[AL])またはシステム(SYSTEM)のモードになっている場合は、フロントパネルの AUTO キーを押します。これで自動(AUTO)モードになります。



AUTO

2. ロータリノブを回して AUTO 番号を選択します。

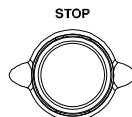


AUTO # 001~100

AUTO 番号カーソル		READY 状態				
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	H/I SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	
AUTO-001					READY	↑
						↓
						←
						→

 注意

AUTO 番号は、READY の状態でないと選択できません。PASS または FAIL の状態の場合は、STOP ボタンを押して READY の状態にしてください。



MANU STEP 番号カーソル(002)

AUTO-001	AUTO_NAME					READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
							SKIP
							DEL.
							STEP HOLD

4. この手順を繰り返すことで、さらに単独 (MANU) 試験を自動 (AUTO) 試験に追加できます。

自動 (AUTO) 試験の連続実行

概要

先にも説明したように、最大 10 個の単独 (MANU) 試験を 1 つのグループにして自動 (AUTO) 試験を行えます。自動 (AUTO) 試験では、単独 (MANU) 番号 1 から 100 までの各番号を指定できます。さらに、別々の自動 (AUTO) 試験をつなぎ合わせた連続自動 (AUTO) 試験を実行することもできます。

手順

1. まず、101 ページの「自動 (AUTO) 試験へのステップの追加」の手順を実行します。以下に、5 つの単独 (MANU) 試験を、AUTO-001 というグループに追加した例を示します。

AUTO-001	AUTO_NAME					READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.H		
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.H/F.C		
005	IR	0.050kV	066.8MΩ	000.1MΩ	P.C/F.S		
010	ACW	0.200kV	2.000mA	000 uA	P.C/F.C		
006	DCW	0.500kV	1.500mA	000 uA	P.H/F.S		
							SKIP
							DEL.
							STEP HOLD

2. 下矢印キーを押してカーソルを次の MANU STEP フィールドに移動し、ロータリノブを回して CON (Continue) を選択します。



AUTO-001		AUTO_NAME				READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.H	SKIP	
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.H/F.C		
005	IR	0.050kV	066.8MΩ	000.1MΩ	P.C/F.S		
010	ACW	0.200kV	2.000mA	000 uA	P.C/F.C		
006	DCW	0.500kV	1.500mA	000 uA	P.H/F.S		
CON							
						DEL.	
						STEP HOLD	

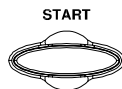
MANU STEP で CON を選択する

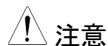
3. 手順 1 を繰り返して別の AUTO-002 というグループを作成します (以下を参照)。

3 つの単独 (MANU) 試験をつなげた AUTO-002

AUTO-002		AUTO_NAME				READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.H	SKIP	
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.H/F.C		
026	IR	0.150kV	069.8MΩ	000.6MΩ	P.C/F.S		
						DEL.	
						STEP HOLD	

4. ここまでの試験の後、AUTO-001 の試験ページに戻り、START ボタンを押して自動 (AUTO) 試験を実行します。AUTO-001 の試験が終わると、AUTO-002 の試験が続きます。このように、自動 (AUTO) 試験が連続して実行されます。





注意

- 自動(AUTO)試験を連続実行する場合、自動(AUTO)試験は5つまでつなげることができます。最初の4つのグループは、CONが入るために9つまでの単独(MANU)試験を含めることができ、最後の5つ目のグループは10までの単独(MANU)試験を含めることができます。したがって、自動(AUTO)試験をつないで連続して実行できる最大の単独(MANU)試験数は46になります。
- 自動(AUTO)試験を連続実行させる場合、実行させる自動(AUTO)試験の番号は連続である必要があります。連続実行をAUTO-005から始める場合、次に実行されるのはAUTO-006で、その次はAUTO-007です。このような形で、最大5グループまでの連続実行ができます。

自動(AUTO)試験ページの編集

概要

自動(AUTO)試験ページには、追加された単独(MANU)試験(最大10ステップ)が順番に並び、それぞれの試験の設定(試験モード、試験電圧/電流設定、HI/LOW設定、STEP HOLDのアクション)が表示されます。各試験は、スキップ、削除、STEP HOLDの編集が行えます。

MANU STEP のスキップ

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを該当するMANU STEPに移動します。



該当する MANU STEP のカーソル

AUTO-001		AUTO_NAME				READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
							SKIP
							DEL.
							STEP HOLD

2. SKIP ソフトキーを押します。

SKIP

3. 該当する MANU STEP の設定はグレー表示されます。

グレー表示された MANU STEP

AUTO-001		AUTO_NAME				READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
							SKIP
							DEL.
							STEP HOLD



次に自動(AUTO)試験を実行すると、グレー表示されたステップはスキップされます。

MANU STEP
の削除

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを該当する MANU STEP に移動します。



該当する MANU STEP のカーソル

AUTO-001		AUTO_NAME				READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
							SKIP
							DEL.
							STEP HOLD

2. DEL.ソフトキーを押します。

DEL.

3. 該当する MANU STEP は削除されます。

該当する MANU STEP は削除される

AUTO-001		AUTO_NAME				READY	↑
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	↓	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C		
							SKIP
							DEL.
							STEP HOLD

STEP HOLD の
編集

1. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを該当する MANU STEP に移動します。



該当する MANU STEP のカーソル

AUTO-001		AUTO_NAME				READY
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↑
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↓
						SKIP
						DEL.
						STEP HOLD

- STEP HOLD ソフトキーを押してカーソルを STEP HOLD の設定フィールドに移動します。

STEP HOLD

STEP HOLD カーソル

AUTO-001		AUTO_NAME				READY
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↑
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↓
						SKIP
						DEL.
						STEP HOLD

- ロータリノブを回して以下にリストした STEP HOLD のオプションから選択します。




P.H/F.H



(Pass Hold/Fail Hold)

PASS と判定されたステップは、次のステップで START ボタンが押されるまで一時停止します。FAIL と判定されたステップは、次のステップで START ボタンが押されるまで一時停止します。

- P.H/F.S (Pass Hold/Fail Stop)
PASSと判定されたステップは、次のステップで START ボタンが押されるまで一時停止します。FAILと判定されると、自動(AUTO)試験はただちに停止します。
- P.H/F.C (Pass Hold/Fail Continue)
PASSと判定されたステップは、次のステップで START ボタンが押されるまで一時停止します。FAILと判定されても、自動(AUTO)試験は自動的に継続されます。
- P.C/F.H (Pass Continue/Fail Hold)
PASSと判定されると、自動(AUTO)試験は自動的に継続されます。FAILと判定されたステップは、次のステップで START ボタンが押されるまで一時停止します。
- P.C/F.S (Pass Continue/Fail Stop)
PASSと判定されると、自動(AUTO)試験は自動的に継続されます。FAILと判定されると、自動(AUTO)試験はただちに停止します。
- P.C/F.C (Pass Continue/Fail Continue)
PASSと判定されると、自動(AUTO)試験は自動的に継続されます。FAILと判定されても、自動(AUTO)試験は自動的に継続されます。
- 0.1~ 999.9s PASSまたは FAIL の判定に関係なく、次の試験まで、設定された時間(0.1~999.9s)停止します。
- P.C/F.C  上記の P.C /F.C 設定と同じように機能します。ただし、この設定は PREVOLTAGE 機能に基づいて動作します。PREVOLTAGE の詳細については、109 ページを参照してください。

P.C/F.S.  上記の P.C /F.S 設定と同じように機能します。ただし、この設定は PREVOLTAGE 機能に基づいて動作します。PREVOLTAGE の詳細については、109 ページを参照してください。

PREVOLTAGE

PREVOLTAGE は、AUTO テスト内のオプション (P.C/F.C 、P.C/F.S ) で設定された MANU ステップが、電圧がゼロにならず、連続的に実行される機能です。以下の条件を参照してください。

1. P.C /F.C および P.C / F.S オプションの PREVOLTAGE は、ACW、DCW、および IR テストモードにのみ適用されます。また、連続 MANU ステップの同じモードのみが PREVOLTAGE テストを構成できます。たとえば、ステップ 1 が IR モードの場合、ステップ 2 も IR モードです。
2. AUTO テスト内の複数の MANU ステップに INIT VOLTAGE (初期電圧) 機能を適用すると、最初の MANU ステップのみが実行されません。
3. コンタクトステータスは、各 MANU ステップ間で同一である必要があります。AUTO テスト内のいくつかの MANU ステップで CONTACT CHK がオンの場合、最初の MANU ステップのみが実行されます。
4. 次の MANU ステップの設定電圧は、前の MANU ステップ以上である必要があります。そうでない場合、次の MANU ステップの設定電圧はゼロから開始されます。
5. 周波数設定は、AUTO テスト内の各 MANU ステップ間で同一である必要があります。

6. AUTO テスト内の複数の MANU ステップに RAMPDOWN 機能を適用すると、最後の MANU ステップのみが実行されます。
7. AUTO テスト内の MANU ステップに CON(継続)機能を適用すると、PREVOLTAGE に基づくテストのために次の AUTO テストページと相互接続することができます。

ただし、次の AUTO テストで最初の MANU ステップが CON を選択した場合、PREVOLTAGE 設定は無効になります。

8. AUTO テストで MANU ステップが SKIP に設定されている場合、PREVOLTAGE 設定は次の MANU ステップでは実行されません。たとえば、MANU ステップ 2 が SKIP に設定されている場合、AUTO テストは PREVOLTAGE の下で MANU ステップ 1 から始まり、PREVOLTAGE 設定なしで MANU ステップ 3 が続きます。

自動(AUTO)試験の実行

概要 試験は READY が表示されている場合のみ実行できます。



注意

以下の条件では、自動(AUTO)試験は開始できません。

- いずれかの保護モードが働いている場合。
- インターロック(INTERLOCK)機能が ON で、SIGNAL I/O ポートにインターロックキーがない場合(177 ページ参照)。
- 外部リモートで STOP 信号を受信した場合。

Double Action が ON の場合、STOP ボタンを押してから 0.5 秒以内に START ボタンを押さないと試験は開始しません。



警告

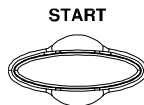
試験実行中は、いかなる端子、テストリード、その他の接続に触れないでください。

手順 1. 自動(AUTO)試験前に、READY の 99 ページ状態になっていることを確認します。

READY 状態インジケータ

AUTO-001	AUTO_NAME					READY
MANU TEST	V/I	HI	LOW	STEP		
STEP	MODE	SETTING	SETTING	SETTING	STEP	HOLD
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P,C/F,H	
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P,H/F,C	
005	IR	0.050kV	066.8MΩ	000.1MΩ	P,C/F,S	
010	ACW	0.200kV	2.000mA	000 uA	P,C/F,C	SKIP
006	DCW	0.500kV	1.500mA	000 uA	P,H/F,S	
						DEL.
						STEP
						HOLD

- READY の状態になっていることを確認し、START ボタンを押します。自動 (AUTO) 試験が自動的に開始し、ディスプレイには各単独 (MANU) 試験が順番に表示されます。



- 試験が開始すると、上昇 (RAMP UP)、試験、下降 (RAMP DOWN) の経過時間が表示されます。各試験は、最後の試験が完了するか、試験が停止するまで、順番に実行されます。



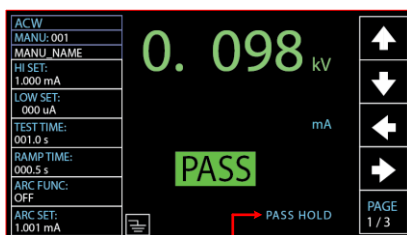
注意

下降時間 (RAMP DOWN) は、有効になっている場合にのみ表示されます。詳細については、45 ページを参照してください。

PASS & FAIL HOLD
(PASS/FAIL による一時停止)

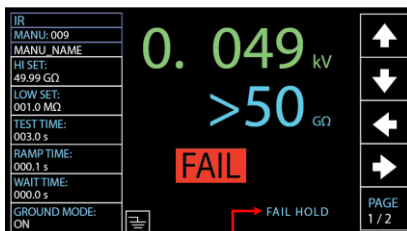
- MANU STEP で P.H (Pass Hold) または F.H (Fail Hold) を設定すると、その MANU STEP で PASS または FAIL になった場合に一時停止します。詳細については、107 ページを参照してください。

PASS
HOLD
インジケータ



PASS HOLD インジケータ

FAIL
HOLD
インジケータ

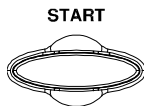


FAIL HOLD インジケータ

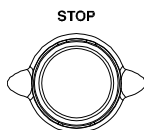
2. ディスプレイには PASS または FAIL のインジケータが点灯します。また、ブザーが鳴ります。



3. ディスプレイに HOLD が表示された後、START ボタンを押せば次の MANU STEP から再開します。



4. ディスプレイに HOLD が表示されている場合、STOP ボタンを押せばすべての自動(AUTO)試験は停止します。



注意

HOLD の状態では、START、STOP のボタンのみが機能し、その他のボタンは機能しません。

**FAIL STOP
(FAIL で停止)**

1. MANU STEP で F.S(Fail Stop)に設定した場合、その MANU STEP で FAIL と判定されるとすべての自動(AUTO)試験をただちに停止します。詳細については、108 ページを参照してください。

**FAIL
STOP
設定**

AUTO-001	AUTO NAME				READY	
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↑
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↓
026	IR	0.150kV	069.8MΩ	000.6MΩ	P.C/F.S	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	SKIP
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	
						DEL.
						STEP
						HOLD

FAIL STOP の設定

試験が停止すると、STOP、STARTのボタンを除く、すべての操作キーは無効になります。自動(AUTO)試験が停止されるまでのすべての試験結果は、ディスプレイに表示されます。自動(AUTO)試験の結果の詳細については、116 ページを参照してください。

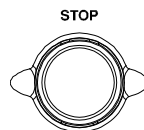
途中で停止した自動(AUTO)試験の例を次に示します。残された MANU STEP は、試験結果なしに中止されず。

自動(AUTO)試験の停止

AUTO_001		AUTO_NAME				STOP
MANU STEP	TEST MODE	READ DATA1	READ DATA2	TEST TIME	TEST RESULT	
001	DCW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
002	ACW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
026	IR	0.022kV	000.0MΩ	R000.0s	STOP	
001	DCW	0.000kV	000 uA	I000.0s		
002	ACW	0.100kV	000 uA	I000.0s		
						PAGE 1 / 1

停止になった MANU STEP

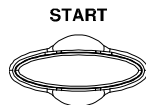
- この状態で STOP ボタンを再度押せば、READY の状態に戻ります。



READY に戻った状態

AUTO_001		AUTO_NAME				READY
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	
026	IR	0.150kV	069.8MΩ	000.6MΩ	P.C/F.S	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	SKIP
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	
						DEL.
						STEP HOLD

3. または、START ボタンを押せば、自動(AUTO)試験は再開します。



STOP の状態では、START、STOP のボタンのみが機能し、その他のボタンは機能しません。

自動(AUTO)試験の結果

概要

試験が停止せず、または保護回路が働かずに試験が完了すると、試験ごとの結果(PASSまたはFAIL)が表示されます。自動(AUTO)試験が完了すると、試験結果は表の形式で表示されます。試験を停止すると残りの試験は行わず、自動(AUTO)試験を中止します。

自動(AUTO)試験結果のインジケータ

AUTO-001	AUTO_NAME					STOP
MANU STEP	TEST MODE	READ DATA1	READ DATA2	TEST TIME	TEST RESULT	
001	DCW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
002	ACW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
001	DCW	0.000kV	000 uA	T000.0s	SKIP	
001	DCW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
002	ACW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
026	IR	0.049kV	60.00GΩ	T000.3s	FAIL	
001	DCW	0.097kV	000 uA	T000.1s	STOP	
002	ACW	0.000kV	000 uA	T000.3s		
						PAGE 1 / 1

MANU STEP の結果のインジケータ



PASS/FAIL/STOP の結果は、自動(AUTO)試験を構成するすべてのステップ(MANU STEP)の結果として、自動(AUTO)試験の右端に一覧で表示されます。

インターロック機能を有効にしているのに Signal I/O ポートにインターロック信号がない場合は、ディスプレイ右上に Interlock Open のメッセージが表示され、自動(AUTO)試験は実行できません。詳細については、146 ページを参照してください。

READY 状態のインジケータ

AUTO-001	AUTO_NAME					READY
MANU STEP	TEST MODE	V/I SETTING	HI SETTING	LOW SETTING	STEP HOLD	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↑
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C	↓
026	IR	0.050kV	49.99GΩ	001.0MΩ	P.C/F.C	←
						→

複数ページの試験結果を確認する

5つまでの自動(AUTO)試験をつなげることができ、試験結果を複数のページで表示できます。この場合、ページを切り替えて結果を確認します。自動(AUTO)試験の連続実行については、102ページを参照してください。

手順

1. 自動(AUTO)試験の連続実行が完了したならば、フロントパネルのPAGEソフトキーを押すと各ページを確認できます。

PAGE
1/2

試験結果のページ(1/2)

AUTO-001	AUTO_NAME					FAIL
MANU STEP	TEST MODE	READ DATA1	READ DATA2	TEST TIME	TEST RESULT	
001	DCW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
002	ACW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
026	IR	0.049kV	60.00GΩ	T000.3s	FAIL	
						PAGE 1/2

複数ページのインジケータ 1/2

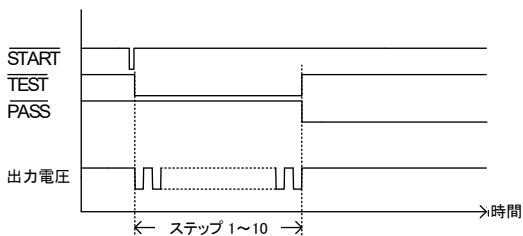
試験結果のページ(2/2)

AUTO-002	AUTO_NAME					FAIL
MANU STEP	TEST MODE	READ DATA1	READ DATA2	TEST TIME	TEST RESULT	
001	DCW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
002	ACW	0.099kV	000 uA	T000.3s	PASS	
						PAGE 2/2

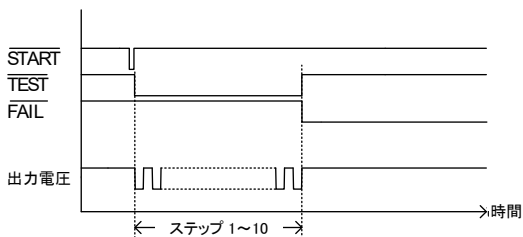
複数ページのインジケータ 2/2

2. 連続実行の自動(AUTO)試験における複数ページの試験結果は、一つの自動(AUTO)試験の場合とほとんど同じです。試験結果の確認方法の詳細については、116～118 ページを参照してください。

PASS の
タイミングチャート



FAIL の
タイミングチャート



システム設定

システム設定は、単独 (MANUAL) および自動 (AUTO) 試験の両方に適用されます。

SYSTEM メニューには、以下の項目が含まれます。

ディスプレイ設定	123
ブザー設定	125
インタフェース設定	127
コントロール設定	133
Control By	133
Double Action	133
Key Lock	133
Interlock	133
Start Click For 1 Second	133
Power GND Check	133
Barcode Function Setting	133
システム時刻の設定	147
データの初期化設定	148
情報セクション	155
統計設定	156
USB DISK 設定	159
コンタクトチェックの設定	167

4. 上/下矢印ソフトキーを押してカーソルを言語設定に移動し、スクロールホイールを使用して言語を設定します。



言語
設定

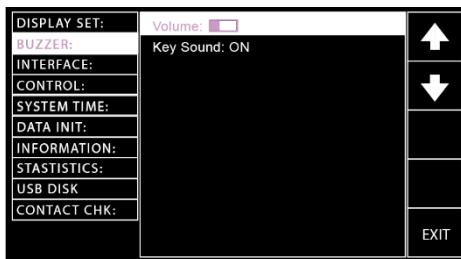
English
繁體中文 (Traditional Chinese)
简体中文 (Simplified Chinese)

5. EXIT ソフトキーを押すと、DISPLAY SET を終了します。

EXIT

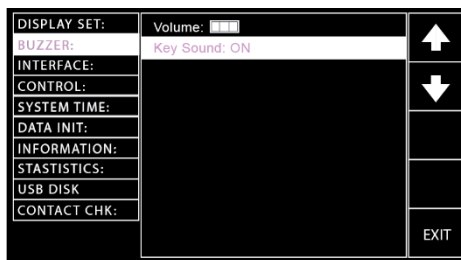


- DISPLAY SET の変更はすぐに反映されます。
- AUTO または MANUAL ボタンを押すといつでも、それぞれのページにジャンプできます。また、SYSTEM ボタンを押すだけで、自動 (AUTO) モードでも単独 (MANU) モードでも、設定のページに戻ることができます。



ブザー音量 1(小さい)~3(大きい)

4. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Key Sound(キーの音)に移動し、ロータリノブを回してキーの音を設定します。



Key Sound ON、OFF

5. EXIT ソフトキーを押すと、BUZZER 設定を終了します。



注意

自動(AUTO)試験の場合、ブザー音は自動(AUTO)試験全体の判定でのみ鳴ります。自動(AUTO)試験を構成する各試験の判定では鳴りません。





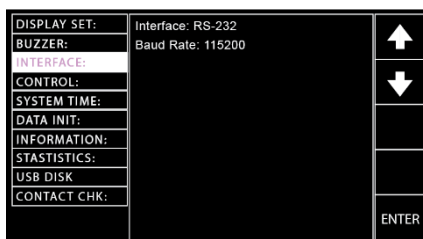
注意


Buzzer(ブザー音)の設定変更はすぐに反映されます。

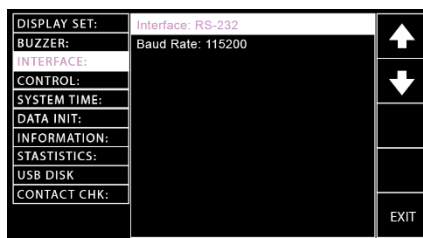
インタフェース設定

概要 インタフェース設定では、リモートインタフェースの構成を選択します。USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)が選択できます。

- 手順**
1. 本器が、単独(MANUAL)または自動(AUTO)の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。 
 2. SYSTEM ページが表示されます。上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを INTERFACE に移動します。 

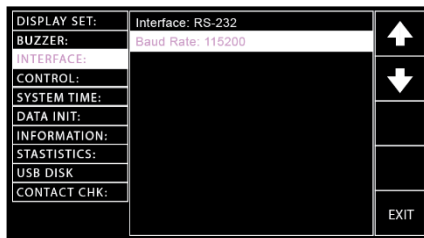


3. ENTER ソフトキーを押して Interface (インタフェース)にし、ロータリノブを回してインタフェースを選択します。 



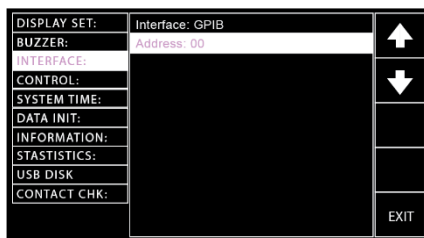
Interface の設定 RS-232、USB、GPIB、LAN

4. RS-232 を選択した場合は、上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Baud Rate (ボーレート) 設定に移動し、ロータリノブを回してボーレートを設定します。



RS-232C の 9600、19200、38400、
ボーレート設定 57600、115200

5. GPIB を選択した場合は、上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Address (アドレス) 設定に移動し、ロータリノブを回してアドレスを設定します。



GP-IB のアドレス設定 00~31

6. LAN を選択した場合は、上下矢印ソフトキーを押して DHCP 設定に移動します。DHCP ON 設定により、IP アドレス関連の設定が自動的に割り当てられます。スクロールホイールを使用して設定をオンまたはオフにします。

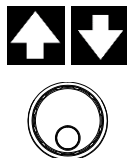


DISPLAY SET:	Interface: LAN	↑
BUZZER:	DHCP: ON	↓
INTERFACE:	Socket Port: 00023	
CONTROL:	IP Address 192 168 000 029	
SYSTEM TIME:	Subnet Mask 255 255 255 000	
DATA INIT:	Gateway 192 168 000 001	
INFORMATION:	LAN LINK MAC: 00:22:24:00:00:01	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

DHCP 設定

ON,OFF

上下矢印ソフトキーを押してカーソルを[Socket Port]設定に移動し、続いてスクロールホイールを使用してポートの値を指定します。



DISPLAY SET:	Interface: LAN	↑
BUZZER:	DHCP: ON	↓
INTERFACE:	Socket Port: 00023	
CONTROL:	IP Address 192 168 000 029	
SYSTEM TIME:	Subnet Mask 255 255 255 000	
DATA INIT:	Gateway 192 168 000 001	
INFORMATION:	LAN LINK MAC: 00:22:24:00:00:01	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

Socket Port の設定 00000-65000
定

DHCP 設定で OFF を選択した場合、上下矢印ソフトキーを押してカーソルを IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイの設定に個別に移動し、続いてスクロールホイールと左右矢印ソフトキーを使用して、各設定を手動で設定します。



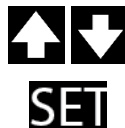
DISPLAY SET:	Interface: LAN	↑
BUZZER:	DHCP: OFF	↓
INTERFACE:	Socket Port: 00023	←
CONTROL:	IP Address 192.168.000.029	→
SYSTEM TIME:	Subnet Mask 255.255.255.000	EXIT
DATA INIT:	Gateway 192.168.000.001	
INFORMATION:	LAN Link MAC: 00:22:24:00:00:01	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		

IP Address 設定 0-255,0-255,0-255,0-255

Subnet Mask 設定 0-255,0-255,0-255,0-255

Gateway 設定 0-255,0-255,0-255,0-255

上下矢印ソフトキーを押してカーソルをインタフェース設定に戻し、SETソフトキーを押して設定を確認します。



DISPLAY SET:	Interface: LAN	↑
BUZZER:	DHCP: OFF	↓
INTERFACE:	Socket Port: 00023	SCAN
CONTROL:	IP Address 192.168.000.029	SET
SYSTEM TIME:	Subnet Mask 255.255.255.000	EXIT
DATA INIT:	Gateway 192.168.000.001	
INFORMATION:	LAN Link MAC: 00:22:24:00:00:01	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		

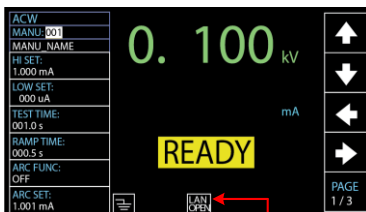
SCANソフトキーを押すと、LANカード設定をスキャンします。インタフェースがLAN設定に変更されるたびに、自動的にスキャンします。

SCAN

DISPLAY SET:	Interface: LAN	↑
BUZZER:		↓
INTERFACE:		SCAN
CONTROL:		SET
SYSTEM TIME:		EXIT
DATA INIT:		
INFORMATION:	LAN Data Check...	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		

LAN 設定が正しくスキャンされておらず、インターフェースが LAN に設定されている場合、「LAN OPEN」アイコンは次の図のように表示されます。

MANU
の場合



LAN オープンのアイコン

AUTO
の場合

LAN オープンのアイコン

AUTO:001	AUTO NAME				READY
MANU	TEST	V/I	HI	LOW	STEP
STEP	MODE	SETTING	SETTING	SETTING	HOLD
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C
026	IR	0.150kV	069.8MΩ	000.6MΩ	P.C/F.S
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C/F.C

7. EXIT ソフトキーを押すと、INTERFACE を終了します。

EXIT



ボーレートまたは GP-IB のアドレスが、ホストマシンと一致していることを確認してください。



INTERFACE (インタフェース) の設定変更はすぐに反映されます。

コントロール設定

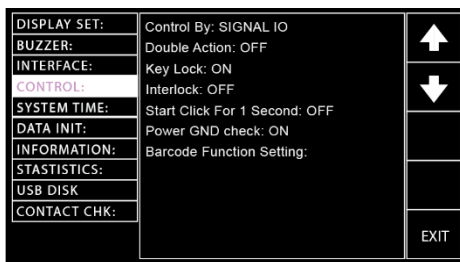
概要	コントロール設定では、Control By、Double Action、Key Lock、Interlock、Start Click For 1 Second、Power GND Check、Barcode Function Setting の 7 つの項目を設定します。
Control By	試験の開始方法を設定します。試験は、フロントパネル (START/STOP ボタン)、リモートコントローラ、または SIGNAL I/O ポートから開始できます。
Double Action	間違っ て試験を開始しないようにするための安全機能です。通常、試験を開始するには、READY 状態で START ボタンを押します。Double Action を ON にした場合、試験を開始するにはまず STOP ボタンを押し、次に 0.5 秒以内に START ボタンを押す必要があります。
Key Lock	フロントパネルで試験番号、試験モード、またはテストパラメータを変更できなくなります。START ボタン、STOP ボタンのみで試験を開始/停止する、という機能は無効になりません。
Interlock	安全機能です。Interlock 機能では、Signal I/O ポートのインターロックピンのコネクタが短絡されていない限り、試験は実行できません。付属のインターロックキーは、この目的で使用できます。詳細については、177 ページを参照してください。
Start Click For 1 Second	安全機能です。本器が単独 (MANUAL) または自動 (AUTO) モードにおいて、START ボタンを 1 秒間押すことで試験を開始できます。
Power GND Check	本器の AC ケーブルの GND 端子が、アース GND に正しく接続されているかどうかの検出をします。
Barcode Function Setting	特に組立ラインのアプリケーション向けに、MANU および AUTO テストを容易にする便利な機能です。バーコードスキャナーが接続された本器を使用すると、バーコードをスキャンし、多様なテストですぐに使用できるようにリストに登録、編集ができます。

手順

1. 本器が、単独 (MANUAL) または自動 (AUTO) の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。

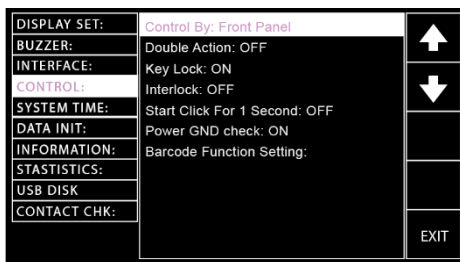
SYSTEM

2. SYSTEM ページが表示されます。上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを CONTROL に移動します。



3. ENTER ソフトキーを押して Control By にし、ロータリノブを回して以下のオプションから選択します。

ENTER



Control By の設定

- Front Panel (フロントパネル)
- Remote (フロントリモート端子)
- SIGNAL IO (背面コネクタ)

SIGNAL IO を選択した場合は、PIN SET ソフトキーを押して設定ページを表示します。

PIN SET

DISPLAY SET:	Control By: SIGNAL IO	↑	↓
BUZZER:	Double Action: OFF		
INTERFACE:	Key Lock: ON	PIN SET	
CONTROL:	Interlock: OFF		
SYSTEM TIME:	Start Click For 1 Second: OFF	EXIT	
DATA INIT:	Power GND check: ON		
INFORMATION:	Barcode Function Setting:		
STATISTICS:			
USB DISK			
CONTACT CHK:			

設定ページは2つのセクションに分かれています。上の部分は出力ピン
の設定であり、下の部分は自動
(AUTO)試験モードにおける Signal
IO のセクションです。以下の図を参
照してください。

SIGNAL IO 出力ピン(緑のセクション)

PIN1:READY	PIN2:TEST	PIN3:PASS	↑
PIN4:FAIL_H	PIN5:FAIL_L		
SIGNAL TO Selection AUTO			
TEST PIN STATUS	1 signal for all steps Step 1 ~ Step 10 test		
PASS & FAIL PIN STATUS	AUTO STEP Step 1 → Step 2 → Step 3 OUTPUT: PASS Enable		
	OUTPUT: FAIL		EXIT

自動(AUTO)試験における SIGNAL IO の選択(青のセクション)

上下矢印ソフトキーを押してカーソル
を PIN(1~5)に移動し、ロータリノブ
を回してピンごとに次の6つのオプシ
ョンから選択します。



PIN の設定 READY、TEST、PASS、FAIL、
FAIL_H、FAIL_L

さらに上下矢印ソフトキーを押してカーソルを TEST PIN STATUS に移動し、ロータリノブを回して自動(AUTO)試験における TEST PIN を次の 2 つのオプションから選択します。



1 signal for all steps TEST PIN の信号出力は、自動(AUTO)試験が完了するまですべてのステップで適用されます。



1 signal for each step TEST PIN の信号出力は、各ステップ間の各インターバル内で連続カウンタとともに適用されます。これは、特定のアプリケーションで特に有効です。

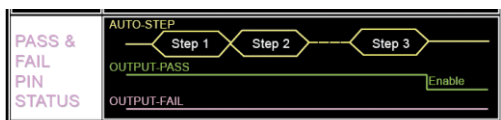


さらに上下矢印ソフトキーを押してカーソルを PASS & FAIL PIN STATUS に移動し、ロータリノブを回して自動(AUTO)試験における PASS & FAIL PIN を以下の 2 つのオプションから選択します。



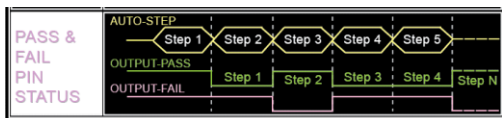
最終ステップ後に PASS/FAIL 判定

自動 (AUTO) 試験の各ステップの PASS/FAIL 判定に関係なく、すべての試験が終わった後に PASS/FAIL が判定されます。しかし、F.S (Fail Stop) が有効になっている場合は、自動 (AUTO) 試験は途中で停止します。詳細については、108 ページを参照してください。



各ステップで PASS/FAIL 判定

自動 (AUTO) 試験の各ステップで PASS/FAIL が判定されます。これにより、各ステップの判定が個別に、具体的に認識できます。



4. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Double Action に移動し、ロータリノブを回して ON、OFF を設定します。



DISPLAY SET:	Control By: Front Panel	↑
BUZZER:	Double Action: OFF	
INTERFACE:	Key Lock: ON	↓
CONTROL:	Interlock: OFF	
SYSTEM TIME:	Start Click For 1 Second: OFF	
DATA INIT:	Power GND check: ON	
INFORMATION:	Barcode Function Setting:	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

Double Action の設定 ON、OFF

5. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Key Lock に移動し、ロータリノブを回して ON、OFF を設定します。



DISPLAY SET:	Control By: Front Panel	↑
BUZZER:	Double Action: OFF	
INTERFACE:	Key Lock: ON	↓
CONTROL:	Interlock: OFF	
SYSTEM TIME:	Start Click For 1 Second: OFF	
DATA INIT:	Power GND check: ON	
INFORMATION:	Barcode Function Setting:	
STASTISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

Key Lock の設定 ON、OFF

6. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Interlock に移動し、ロータリノブを回して ON、OFF を設定します。



DISPLAY SET:	Control By: Front Panel	↑
BUZZER:	Double Action: OFF	
INTERFACE:	Key Lock: ON	↓
CONTROL:	Interlock: OFF	
SYSTEM TIME:	Start Click For 1 Second: OFF	
DATA INIT:	Power GND check: ON	
INFORMATION:	Barcode Function Setting:	
STASTISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

Interlock の設定 ON、OFF

7. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Start Click For 1 Second に移動し、ロータリノブを回して ON、OFF を設定します。



DISPLAY SET:	Control By: Front Panel	↑
BUZZER:	Double Action: OFF	
INTERFACE:	Key Lock: ON	↓
CONTROL:	Interlock: OFF	
SYSTEM TIME:	Start Click For 1 Second: OFF	
DATA INIT:	Power GND check: ON	
INFORMATION:	Barcode Function Setting:	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

Start Click For 1 Second の設定 ON、OFF

8. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Power GND Check に移動し、ロータリノブを回して設定します。



DISPLAY SET:	Control By: Front Panel	↑
BUZZER:	Double Action: OFF	
INTERFACE:	Key Lock: ON	↓
CONTROL:	Interlock: OFF	
SYSTEM TIME:	Start Click For 1 Second: OFF	
DATA INIT:	Power GND check: ON	
INFORMATION:	Barcode Function Setting:	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

Power GND Check の設定 ON、OFF

Power GND Check が ON で本器がアース GND に接続されていない場合、単独(MANU)試験、自動(AUTO)試験の両方で、下図のようなメッセージが表示されます。

単独(MANU)
試験時



POWER GND 不良メッセージ

自動(AUTO)
試験時

POWER GND 不良メッセージ

AUTO-001	AUTO_NAME	GND FAIL	READY
MANU	TEST	V/I	HI
STEP	MODE	SETTING	LOW
001	DCW	0.100kV	1.000mA
002	ACW	0.100kV	1.000mA
026	IR	0.150kV	069.8MΩ
001	DCW	0.100kV	1.000mA
002	ACW	0.100kV	1.000mA

9. 上/下矢印ソフトキーを押してカーソルをバーコード機能設定に移動し、続いてSETソフトキーを押して設定ページに入ります。



DISPLAY SET:	Control By: Front Panel	↑
BUZZER:	Double Action: OFF	↓
INTERFACE:	Key Lock: ON	SET
CONTROL:	Interlock: OFF	
SYSTEM TIME:	Start Click For 1 Second: OFF	
DATA INIT:	Power GND check: ON	
INFORMATION:	Barcode Function Setting:	
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

バーコード設定ページは、いくつかの列と行を持つテーブルで構成されています。最初にスクロールホイールを使用して、ページ番号を選択します。



PAGE # 001~010

バーコードページ番号カーソル バーコード設定インジケータ

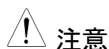
PAGE-001		BAR			
BARCODE	TEST MODE	TEST NUM	AUTO TEST	MANU/AUTO NAME	
					↓
					EXIT

下矢印キーを押して、カーソルを PAGE テーブルに移動します。接続されたバーコードスキャナーを使用してターゲットバーコードをスキャンすると、スキャンされたバーコード情報が PAGE テーブルの 1 行目に書き込まれます。



スキャンされたバーコード情報

PAGE-001		BAR			
BARCODE	TEST MODE	TEST NUM	AUTO TEST	MANU/AUTO NAME	
4710123134556			OFF		↑
					↓
					←
					→
					EXIT



- USB 仮想 COM 対応のバーコードスキャナーが使用できます。本器のフロントパネルの USB ホストポートに差し込みます。
- スキャンするバーコードの長さ制限は 15 文字以内です。

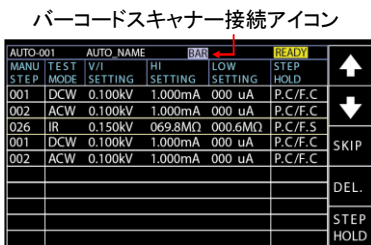
互換性のあるバーコードスキャナーを本器に接続すると、対応するアイコンが単独試験(MANU)または自動試験(AUTO)のディスプレイに表示されます。

単独試験
(MANU)
の場合



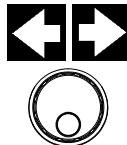
バーコードスキャナー接続アイコン

自動試験
(AUTO)
の場合



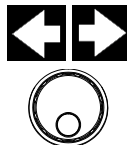
バーコードスキャナー接続アイコン

左/右矢印ソフトキーを使用してカーソルをテストモードに移動し、スクロールホイールを使用して目的のモードを選択します。



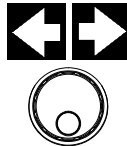
TEST MODE AUTO, MANU

左/右矢印ソフトキーを使用してカーソルをテスト番号に移動し、スクロールホイールを使用して選択したテストモードの番号を決定します。テスト番号の作成については、37 および 99 ページを参照してください。



TEST NUM 001 - 100

さらに、左/右矢印ソフトキーを使用してカーソルを自動テストに移動し、続いてスクロールホイールを使用して自動テスト機能をオンまたはオフにします。これにより、一致するバーコードが後でスキャンされたときにテストが自動的に開始されます。



AUTO TEST ON, OFF

MANU / AUTO NAME 列は、いずれかのモードで選択したテスト番号からの既存のファイル名に対応するファイル名を自動的に反映します。テスト名の作成については、38 および 100 ページを参照してください。

スキャンされたバーコードの設定が完了した例

スキャンされたバーコードを
AUTO-001, 自動試験 ON に設定

PAGE-001				BAR		
BARCODE	TEST MODE	TEST NUM	AUTO TEST	MANU/AUTO NAME		
4710123134556	AUTO	001	ON	AUTO_NAME		↑
						↓
						←
						→
						EXIT

上記の手順を繰り返して、さらにバーコードをスキャンし、必要に応じて設定を編集します。

スキャンされた複数のバーコードの設定が完了した例

3つのスキャンされたバーコードが
設定された例

PAGE-001				BAR		
BARCODE	TEST MODE	TEST NUM	AUTO TEST	MANU/AUTO NAME		
4710123134556	AUTO	001	ON	AUTO_NAME		↑
GPT-9801	MANU	022	OFF	MANU_NAME		↓
ABC-abc-1234	AUTO	006	ON	AUTO_NAME		←
						→
						EXIT

スキャンしたバーコードをリストから削除する

スキャンしたバーコードを削除する場合は、上/下矢印ソフトキーを使用してカーソルをバーコードの行に移動し、左矢印ソフトキーを使用してカーソルを削除したいバーコードがある BARCODE 列に移動します。強調表示されます。DEL ソフトキーを押して、テーブルから削除します。



選択されたバーコード

PAGE-001	BAR				
BARCODE	TEST MODE	TEST NUM	AUTO TEST	MANU/AUTO NAME	
4710123134556	AUTO	001	ON	AUTO NAME	↑
GPT-9801	MANU	022	OFF	MANU NAME	↓
ABC-abc-1234	AUTO	006	ON	AUTO NAME	DEL
					→
					EXIT

DEL. ソフトキー

バーコードの重複

既存のバーコードが再度スキャンされると、警告メッセージ「Barcode repeat」が右上にブザー音とともに表示されます。

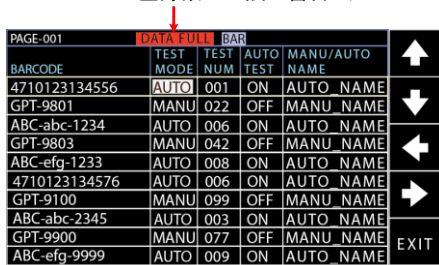
バーコード重複の警告メッセージ

PAGE-001	BAR Barcode Repeat				
BARCODE	TEST MODE	TEST NUM	AUTO TEST	MANU/AUTO NAME	
4710123134556	AUTO	001	ON	AUTO NAME	↑
GPT-9801	MANU	022	OFF	MANU NAME	↓
ABC-abc-1234	AUTO	006	ON	AUTO NAME	←
					→
					EXIT

バーコード登録の 上限

登録されたバーコードの数が上限の 100 に達すると、警告メッセージ「DATA FULL」がトップバーに表示されます。この状態でバーコードを読み込むと、短いビープ音に続いて長いビープ音が鳴り、新しいバーコードを登録するための空き容量がないことを示します。

バーコードの登録数が上限の警告メッセージ



PAGE 001					DATA FULL	BAR
BARCODE	TEST MODE	TEST NUM	AUTO TEST	MANU/AUTO NAME		
4710123134556	AUTO	001	ON	AUTO NAME		↑
GPT-9801	MANU	022	OFF	MANU NAME		↓
ABC-abc-1234	AUTO	006	ON	AUTO NAME		←
GPT-9803	MANU	042	OFF	MANU NAME		→
ABC-efg-1233	AUTO	008	ON	AUTO NAME		
4710123134576	AUTO	006	ON	AUTO NAME		
GPT-9100	MANU	099	OFF	MANU NAME		
ABC-abc-2345	AUTO	003	ON	AUTO NAME		
GPT-9900	MANU	077	OFF	MANU NAME		
ABC-efg-9999	AUTO	009	ON	AUTO NAME		EXIT

バーコードテスト の実行

バーコードページを構成したら、最初に MANU または AUTO モードの READY ステータスに切り替えます。

フロントパネルの USB ホストポートに USB 仮想 COM ポート互換バーコードスキャナーを接続します。

一致するバーコードをスキャンすると、画面は対応するテストページにジャンプするか、AUTO TEST 設定に応じて、対応するテストが自動的に起動します。

10.EXIT ソフトキーを押すと、
CONTROL を終了します。

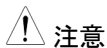
EXIT



CONTROL の設定変更はすぐに反映されます。



本器を USB、RS-232C、GP-IB のインタフェースでリモート制御する場合、Double Action の設定は無視されます。



注意

未登録のバーコードをスキャンすると、ビープ音が2回鳴ります。バーコードテスト操作の前に、ターゲットバーコードが登録されていることを確認します。



注意

INTERLOCKをONにして試験を開始した場合、付属のインターロックキーを挿すなどインターロック信号のI/Oピンが短絡されていないと、単独または自動の試験でも Interlock Open のメッセージが表示され、試験が開始できないようになっています。

単独
試験

ACW	<div style="font-size: 2em; color: green;">0.045_{kV}</div> <div style="font-size: 2em; color: cyan;">20_{uA}</div> <div style="font-size: 1.5em; color: red; margin-top: 10px;">FAIL ILOCK OPEN</div>	↑
MANU: 000		↓
MANU_NAME		←
HI SET: 355 uA		→
LOW SET: 000 uA		PAGE 1/3
TEST TIME: 002.0 s		
RAMP TIME: 004.0 s		
ARC FUNC: OFF		
ARC SET: 2.556 mA		
USB DISK		

Interlock Open のメッセージ

自動
試験

Interlock Open のメッセージ

AUTO-054	AUTO_NAME	USB	FAIL		
MANU	TEST	READ	READ	Interlock Open	
STEP	MODE	DATA1	DATA2	TIME	RESULT
001	ACW	0.000kV	000 uA	I000.0s	ILOCK
002	ACW	0.000kV	000 uA	I000.0s	ILOCK
003	DCW	0.000kV	000.0uA	I000.0s	STOP
					PAGE 1/1

システム時刻の設定

概要 本器のシステム時刻と校正予定日を設定します。

手順 1. 本器が、単独(MANUAL)または自動(AUTO)の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。

SYSTEM

2. SYSTEM ページが表示されます。上下の矢印ソフトキーを使用してカーソルを SYSTEM TIME に移動します。



DISPLAY SET:	SYSTEM TIME SETTING:	↑
BUZZER:	2021/05/14 16:51:43	
INTERFACE:		↓
CONTROL:	Calibration Alert	
TIME SETTING:	Cal Alert: ON	SET
DATA INIT:	Cal Date: 2020/05/03	
INFORMATION:	Cal Due: 2021/05/03	
STATISTICS:	Alert Date: 2021/04/01	
USB DISK:	Cal Protection: OFF	
CONTACT CHK:		EXIT

3. ENTER ソフトキーを押して Year にし、ロータリノブを回して「年」を設定します。

ENTER



DISPLAY SET:	SYSTEM TIME SETTING:	↑
BUZZER:	2021/05/14 16:53:00	
INTERFACE:		↓
CONTROL:	Calibration Alert	
TIME SETTING:	Cal Alert: ON	→
DATA INIT:	Cal Date: 2020/05/03	
INFORMATION:	Cal Due: 2021/05/03	
STATISTICS:	Alert Date: 2021/04/01	
USB DISK:	Cal Protection: OFF	
CONTACT CHK:		EXIT

Year の設定 2000~2099

4. ENTER ソフトキーを押して Year を確定し、続けて月を設定します。同様に秒までの設定を行います。



Month の設定	01~12
Date の設定	01 ~ 31
Hours の設定	00~23
Minutes の設定	00~59
Seconds の設定	00~59

5. EXIT ソフトキーを押すと、SYSTEM TIME を終了します。



注意

SYSTEM TIME (システム時刻) の設定変更はすぐに反映されます。

1. システム時刻の設定において上下の矢印ソフトキーを使用してカーソルを Cal Alert に移動します。Enter



DISPLAY SET:	SYSTEM TIME SETTING:	↑
BUZZER:	2021/05/14 16:52:47	
INTERFACE:		↓
CONTROL:	Calibration Alert	
TIME SETTING:	Cal Alert:ON	
DATA INIT:	Cal Date: 2020/05/03	
INFORMATION:	Cal Due: 2021/05/03	
STATISTICS:	Alert Date: 2021/04/01	
USB DISK:	Cal Protection: OFF	
CONTACT CHK:		EXIT

Cal Alert

ON, OFF

2. ENTER ソフトキーを押して Cal Alert の設定にし、ロータリノブを回して ON/OFF を設定します。

ENTER



ON の設定を行うと期限以後に測定画面へ赤字で校正アラートが表示されます。

The EST is due for Calibration on
2021/05/03
Please arrang for calibration

3. 上/下矢印ソフトキーを押してカーソルを Cal Date 設定に移動し、スクロール ホイールを使用して校正の日付を示す Cal Date 設定を設定します。



DISPLAY SET:	SYSTEM TIME SETTING:	↑
BUZZER:	2021/05/14 16:52:59	
INTERFACE:		↓
CONTROL:	Calibration Alert	
TIME SETTING:	Cal Alert: ON	→
DATA INIT:	Cal Date: 2020/05/03	
INFORMATION:	Cal Due: 2021/05/03	
STATISTICS:	Alert Date: 2021/04/01	
USB DISK:	Cal Protection: OFF	EXIT
CONTACT CHK:		

Cal Date 2000 ~ 2099
 01 ~ 12
 01 ~ 31

4. 上/下矢印ソフトキーを押してカーソルを Cal Due 設定に移動し、次にスクロール ホイールを使用して Cal Due 設定を設定します。これは次の校正期限を示します。



DISPLAY SET:	SYSTEM TIME SETTING:	↑
BUZZER:	2021/05/14 16:53:05	
INTERFACE:		↓
CONTROL:	Calibration Alert	
TIME SETTING:	Cal Alert: ON	
DATA INIT:	Cal Date: 2020/05/03	
INFORMATION:	Cal Due: 2021/05/03	
STATISTICS:	Alert Date: 2021/04/01	→
USB DISK:	Cal Protection: OFF	
CONTACT CHK:		EXIT

Cal Due 2000 ~ 2099
 01 ~ 12
 01 ~ 31

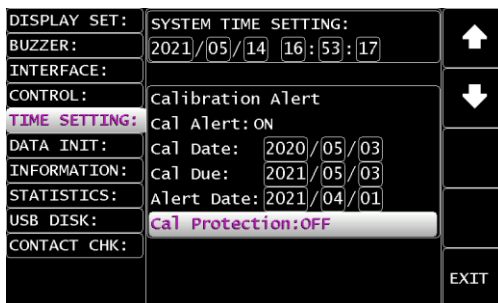
5. 上/下矢印ソフトキーを押してカーソルをアラート日付設定に移動し、スクロール ホイールを使用してアラート日付設定を設定します。これは、校正期限の事前アラート機能を示します。



DISPLAY SET:	SYSTEM TIME SETTING:	↑
BUZZER:	2021/05/14 16:53:11	
INTERFACE:		↓
CONTROL:	Calibration Alert	
TIME SETTING:	Cal Alert: ON	
DATA INIT:	Cal Date: 2020/05/03	
INFORMATION:	Cal Due: 2021/05/03	
STATISTICS:	Alert Date: 2021/04/01	→
USB DISK:	Cal Protection: OFF	
CONTACT CHK:		EXIT

Alert Date 2000 ~ 2099
 01 ~ 12
 01 ~ 31

6. 上/下矢印ソフトキーを押してカーソルを Cal Protection 設定に移動し、スクロール ホイールを使用して Cal Protection 設定を設定します。これは、校正期限になったときに出力保護設定をオンまたはオフにするかどうかを示します。



Cal Protection ON, OFF

出力保護機能がオンの場合、校正期限またはアラート期限になると画面に CAL PROTECTION が表示され出力できなくなります。

単独試験
表示



データの初期化設定

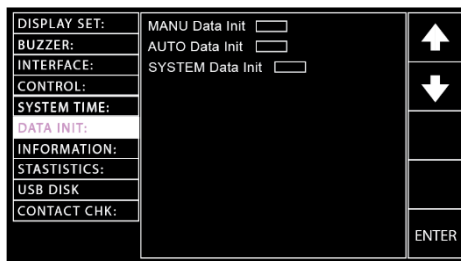
概要 自動 (AUTO)、単独 (MANUAL)、システム (SYSTEM) 試験で保存された設定は、この手順で初期化できます。

手順

1. 本器が、単独 (MANUAL) または自動 (AUTO) の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。

SYSTEM

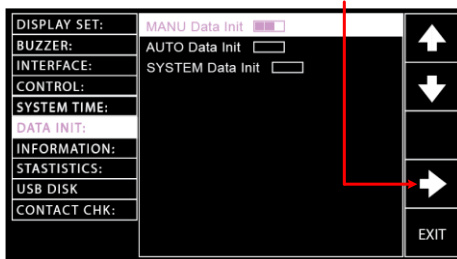
2. SYSTEM ページが表示されます。上下の矢印ソフトキーを使用してカーソルを DATA INIT に移動します。



3. ENTER ソフトキーを押すと、Manu Data Init の設定メニューになります。次に、右矢印ソフトキーを 3 回押すと、Manu Data (単独データ) 設定が初期化されます。

ENTER

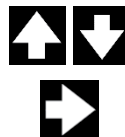
右矢印ソフトキー



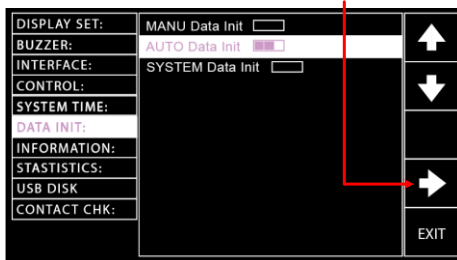
注意

Manu Data Init には 3 本のバーがあり、初期化の進行状況を示します。3 本がすべて表示されると、完全に初期化されたことを示します。初期化が完了すると、OK のメッセージが表示されます。

4. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを Auto Data Init に移動します。次に、右矢印ソフトキーを 3 回押すと、Auto Data (自動データ) 設定が初期化されます。



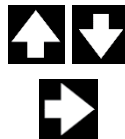
右矢印ソフトキー



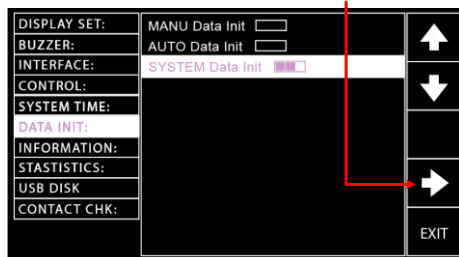
注意

Main Data Init には 3 本のバーがあり、初期化の進行状況を示します。3 本がすべて表示されると、完全に初期化されたことを示します。初期化が完了すると、OK のメッセージが表示されます。

5. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを System Data Init に移動します。次に、右矢印ソフトキーを 3 回押すと、System Data(システム・データ)設定が初期化されます。



右矢印ソフトキー



6. EXIT ソフトキーを押すと、DATA INIT を終了します。



System Data Init には 3 本のバーがあり、初期化の進行状況を示します。3 本がすべて表示されると、完全に初期化されたことを示します。初期化が完了すると、OK のメッセージが表示されます。

情報セクション

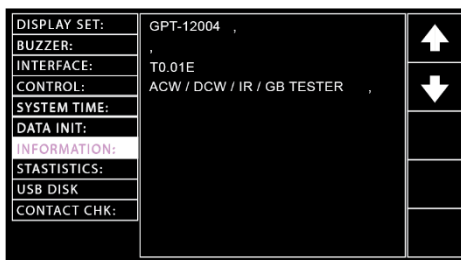
概要 Information(情報)セクションには、モデル名、ファームウェアのバージョン、利用可能なテスト機能が表示されます。

手順

1. 本器が、単独(MANUAL)または自動(AUTO)の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。

SYSTEM

2. SYSTEM ページが表示されます。上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを INFORMATION に移動します。



3. 本器の基本情報がディスプレイに表示されます。

統計設定

概要

統計設定では、試験総数、合格数、不合格数、解析結果を表示できます。また、統計データの初期化も行います。

手順

1. 本器が、単独 (MANUAL) または自動 (AUTO) の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。

SYSTEM

2. SYSTEM ページが表示されます。上下矢印ソフトキーを押してカーソルを STATISTICS に移動すると、現在までの PASS と FAIL の回数、合計 (TOTAL) の回数が表示されます (緑のエリア)。また、試験項目ごとの PASS、FAIL の回数も表示されます (青のエリア)。



PASS、FAIL の回数と合計の回数

DISPLAY SET:	TOTAL AMOUNT = 00032		↑	
BUZZER:	PASS AMOUNT = 00023			
INTERFACE:	FAIL AMOUNT = 00009			
CONTROL:	FUNCTION	PASS	FAIL	↓
SYSTEM TIME:	ACW	00003	00002	
DATA INIT:	DCW	00003	00002	ENTER
INFORMATION:	IR	00002	00003	
STATISTICS:	GB	00003	00002	ENTER
USB DISK:	CONT	00012	00000	
CONTACT CHK:				

試験項目ごとの PASS、FAIL の回数

3. ENTER ソフトキーを押すと、統計の表が表示されます。DATA INIT ソフトキーを押すと、蓄積された統計値が初期化できます。

ENTER

DATA
INIT

DISPLAY SET:	TOTAL AMOUNT = 00032			↑
BUZZER:	PASS AMOUNT = 00023			
INTERFACE:	FAIL AMOUNT = 00009			
CONTROL:	FUNCTION	PASS	FAIL	↓
SYSTEM TIME:	ACW	00003	00002	
DATA INIT:	DCW	00003	00002	DATA INIT
INFORMATION:	IR	00002	00003	
STATISTICS:	GB	00003	00002	EXIT
USB DISK	CONT	00012	00000	
CONTACT CHK:				

DATA INIT ソフトキー



注意

DATA INIT ソフトキーを押すと、このページに表示されているすべての統計値は0に初期化され、以降の試験は0から再度蓄積されます。

4. 上下の矢印ソフトキーを押してカーソルを表内に移動します。カーソルを特定の試験項目に移動して ANALY ソフトキーを押すと、その項目の解析ページが表示されます。



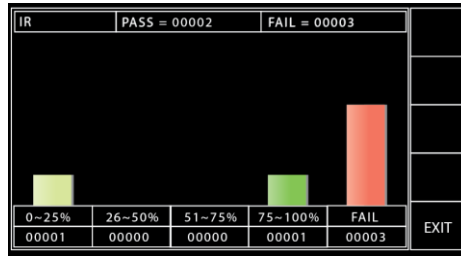
ANALY

ANALY ソフトキー

DISPLAY SET:	TOTAL AMOUNT = 00032			↑
BUZZER:	PASS AMOUNT = 00023			
INTERFACE:	FAIL AMOUNT = 00009			
CONTROL:	FUNCTION	PASS	FAIL	↓
SYSTEM TIME:	ACW	00003	00002	
DATA INIT:	DCW	00003	00002	ANALY
INFORMATION:	IR	00002	00003	
STATISTICS:	GB	00003	00002	EXIT
USB DISK	CONT	00012	00000	
CONTACT CHK:				

選択された試験項目

5. PASS と FAIL の分布がヒストグラム形式で表示され、上には試験項目の PASS と FAIL の回数が表示されます。中央と下には、右側に赤のバーとその下に FAIL の回数が、PASS は緑のバーで、その下には、設定された HI & LOW レンジに対する測定値のパーセント分布が表示されています。



6. EXIT ソフトキーを押すと、STATISTICS を終了します。

EXIT

USB DISK 設定

概要

試験データは、接続された USB メモリに保存できます。ここでは、自動またはマニュアルによる USB メモリへの保存方法が選択できます。フロントパネルの USB メモリについては、10 ページを参照してください。

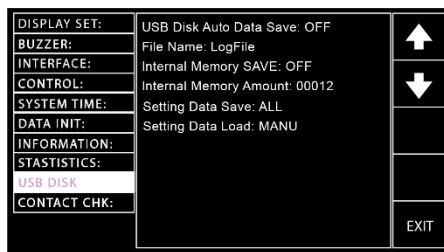
使用可能 USB メモリ:
FAT16/FAT32 フォーマット、32GB まで
日本語のフォルダは利用禁止

手順

1. 本器が、単独 (MANUAL) または自動 (AUTO) の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。

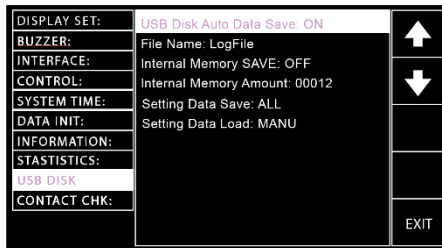


2. SYSTEM ページが表示されます。上下の矢印ソフトキーを使用してカーソルを USB DISK に移動します。



3. ENTER ソフトキーを押して Auto Data Save (自動データ保存) にし、ロータリノブを回して Auto Data Save を設定します。





Auto Data Save の設定 ON、OFF

4. 上下矢印ソフトキーを押してカーソルを File Name に移動すると、下に文字テーブルが表示されます。ここでは Auto Data Save に対して名前を設定することができます。



ロータリノブを使って、入力する文字を選択します。



左/右矢印ソフトキーを押して、カーソルを次の文字に移動し、名前の設定をします。



5. 上/下矢印ソフトキーを押してカーソルを内部メモリの保存設定に移動し、スクロールホイールを使用して設定をオンまたはオフにします。有効にすると、テストデータが本器の内部メモリに自動的に保存されます。



DISPLAY SET:	USB Disk Auto Data Save: ON	↑
BUZZER:	File Name: LogFile	
INTERFACE:	Internal Memory SAVE: ON	↓
CONTROL:	Internal Memory Amount: 00012	
SYSTEM TIME:	Setting Data Save: ALL	
DATA INIT:	Setting Data Load: MANU	
INFORMATION:		
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		EXIT

Internal Memory SAVE の設定

ON, OFF

6. 上/下矢印ソフトキーを押して、カーソルを内部メモリ量の設定に移動します。これにより、テストデータの合計量が表示されます。



DISPLAY SET:	USB Disk Auto Data Save: ON	↑
BUZZER:	File Name: LogFile	
INTERFACE:	Internal Memory SAVE: ON	↓
CONTROL:	Internal Memory Amount: 00012	
SYSTEM TIME:	Setting Data Save: ALL	SAVE USB
DATA INIT:	Setting Data Load: MANU	CLEAR DATA
INFORMATION:		EXIT
STATISTICS:		
USB DISK		
CONTACT CHK:		



注意

「Internal Memory SAVE」が有効になっている場合のみ、テストデータを内部メモリに保存できます。

挿入した USB メモリにテストデータを保存するには、SAVE USB ソフトキーを押します。

**SAVE
USB**

NO USB DISK 警告

USB メモリが本器に正しく挿入されていない場合、「NO USB DISK」という警告メッセージが表示されます。

DISPLAY SET:	USB Disk Auto Data Save: ON	↑
BUZZER:	File Name: LogFile	
INTERFACE:	Internal Memory SAVE: ON	↓
CONTROL:	Internal Memory Amount: 00012	
SYSTEM TIME:	Setting Data Save: ALL	SAVE USB
DATA INIT:	Setting Data Load: MANU	
INFORMATION:	NO USB DISK	CLEAR DATA
STASTISTICS:		
USB DISK		EXIT
CONTACT CHK:		

NO TEST DATA 警告

利用可能なテストデータがない場合 (Amount: 00000)、「NO TEST DATA」という警告メッセージが表示されます。

DISPLAY SET:	USB Disk Auto Data Save: ON	↑
BUZZER:	File Name: LogFile	
INTERFACE:	Internal Memory SAVE: ON	↓
CONTROL:	Internal Memory Amount: 00000	
SYSTEM TIME:	Setting Data Save: ALL	SAVE USB
DATA INIT:	Setting Data Load: MANU	
INFORMATION:	NO TEST DATA	CLEAR DATA
STASTISTICS:		
USB DISK		EXIT
CONTACT CHK:		

内部メモリをクリアするには、CLEAR DATA ソフトキーを押します。

CLEAR
DATA

NO TEST DATA 警告

利用可能なテストデータがない場合 (Amount: 00000)、「NO TEST DATA」という警告メッセージが表示されます。

DISPLAY SET:	USB Disk Auto Data Save: ON	↑
BUZZER:	File Name: LogFile	
INTERFACE:	Internal Memory SAVE: ON	↓
CONTROL:	Internal Memory Amount: 00000	
SYSTEM TIME:	Setting Data Save: ALL	SAVE USB
DATA INIT:	Setting Data Load: MANU	
INFORMATION:	NO TEST DATA	CLEAR DATA
STATISTICS:		
USB DISK		EXIT
CONTACT CHK:		



注意

内部メモリの容量には 30,000 カウントの容量制限があるため、最大制限に達すると、単独 (MANU) モードまたは自動 (AUTO) モードで警告メッセージが表示されます。

単独
(MANU)

ACW	0. 100 kV mA DATA FULL READY	↑
MANU: 001		
MANU_NAME		
HI SET: 1.000 mA		
LOW SET: 000 uA		
TEST TIME: 001.0 s		
RAMP TIME: 000.5 s		
ARC FUNC: OFF		
ARC SET: 1.001 mA		
USB DISK		
	→	
	PAGE 1 / 3	

メモリ上限の警告メッセージ

自動
(AUTO)

メモリ上限の警告メッセージ

AUTO-001	AUTO_NAME	USB	DATA FULL	READY	↑	
MANU	TEST	V/I	HI	LOW		STEP
STEP	MODE	SETTING	SETTING	SETTING		HOLD
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA		P.C/F.C
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA		P.C/F.C
026	IR	0.150kV	069.8MΩ	000.6MΩ		P.C/F.S
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA		P.C/F.C
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA		P.C/F.C
						SKIP
						DEL.
					STEP HOLD	

7. 上/下矢印ソフトキーを押して、カーソルを設定データの保存設定に移動します。MANUDATA、AUTODATA、SYSDATA またはすべてのデータを USB ディスクに保存できます。



Setting Data Save

All, MANU,
AUTO, SYSTEM

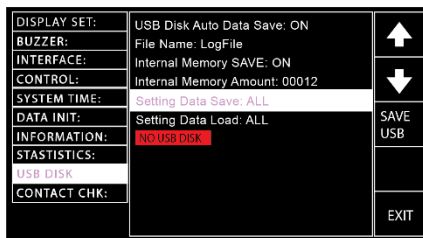


SAVE USB ソフトキーを押して、選択したデータを USB ディスクに保存します。

SAVE
USB

NO USB DISK 警告

USB メモリが本器に正しく挿入されていない場合、「NO USB DISK」という警告メッセージが表示されます。



8. 上/下矢印ソフトキーを押して、カーソルを設定データのロード設定に移動します。MANUDATA、AUTODATA、SYSDATA またはすべてのデータを USB ディスクからロードできます。



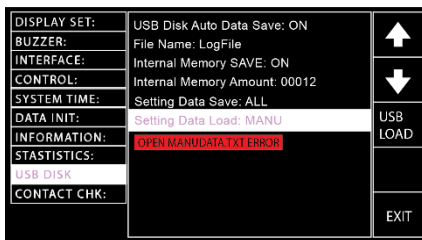
Setting Data Load

All, MANU,
AUTO, SYSTEM

USB LOAD ソフトキーを押して、選択したデータを USB ディスクからロードします。

OPEN DATA ERROR 警告

利用可能なデータがない場合、「OPEN XXXXDATA.TXT ERROR」という警告メッセージが表示されます。



9. EXIT ソフトキーを押すと USB DISK のページから抜けます。



注意

USB DISK ページの設定は、すぐに反映されま
す。

測定データを USB メモリに保存する際に、USB メ
モリが確実に本器に接続されていることを確認して
ください。

USB メモリが認識されると、単独(MANU)試験モー
ド、自動(AUTO)試験モードのどちらの場合でも、
USB のアイコンが表示されます。

MANU(単独)
試験の USB
アイコン



USB メモリの接続時に表示

AUTO(自動)
試験の USB
アイコン

USB メモリの接続時に表示

AUTO-001	AUTO_NAME	USB	READY		
MANU	TEST	V/I	HI	STEP	
STEP	MODE	SETTING	SETTING	SETTING	
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C./F.C
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C./F.C
026	IR	0.150kV	069.83MΩ	000.65MΩ	P.C./F.C
001	DCW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C./F.C
002	ACW	0.100kV	1.000mA	000 uA	P.C./F.C
					DEL.
					STEP
					HOLD

コンタクトチェックの設定

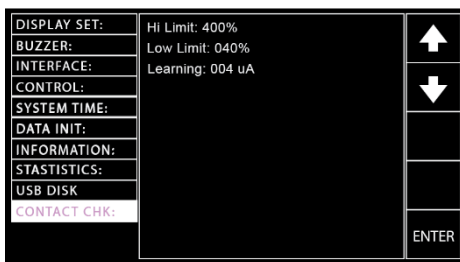
概要 CONTACT CHK 機能は、50V/400Hz の出力で、ACW、DCW、および IR テストの前に、テストリードと DUT の間にオープンまたはショートが発生しているかどうかを判断する機能です。Learning を実行することで正常時の基準値を取得し、上限、下限を指定してショート、オープンの判定を行います。

手順

1. 本器が、単独 (MANUAL) または自動 (AUTO) の試験で READY 状態において、フロントパネルの SYSTEM ボタンを押します。

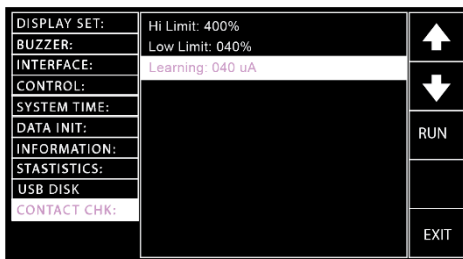
SYSTEM

2. SYSTEM ページが表示されます。上/下矢印ソフトキーを押して、カーソルを CONTACT CHK 設定に移動します。



3. ENTER ソフトキーを押して、Hi Limit 設定に入り、スクロールホイールを使用して、ショートステータス警告を検出する上限リミットの割合を設定します。

ENTER



⚠ 注意

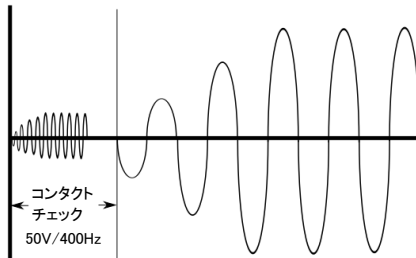
⚠ 注意

- Learning プロセスを実行する前に、本器と DUT の間の接続を適切に行ってください。
- たとえば、基準値が 100uA として定義され、上限と下限がそれぞれ 400%と 40%に設定されている場合、測定値が 40uA 未満になると、オープンと判定されます。測定値が 400uA を超えるとショートと判定されます。
- 基準値が 30uA 未満になると、MANU モードで CONTACT CHK が ON になっていても、警告メッセージが表示され、CONTACT CHK 機能が無効になります。CONTACT CHK の設定については、75 ページをご覧ください。



6. EXIT ソフトキーを押して、CONTACT CHK ページを終了します。

EXIT



ACW、DCW、IR テスト



注意

CONTACT CHK 設定の変更はすぐに反映されま
す。

外部接点制御

この章では、リモート(REMOTE)端子と
SIGNAL I/O ポートについて説明します。

リモート端子の概要	172
リモート端子の操作	173
SIGNAL I/O の概要	174
SIGNAL I/O による試験の開始／停止	176
インターロックキーの使用	177

外部接点制御の概要

ここでは、フロントパネルの REMOTE 端子接続とリアパネルの SIGNAL I/O ポートについて説明します。

リモート端子の概要

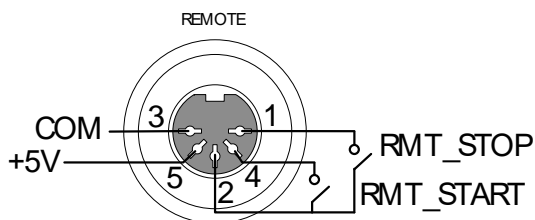
概要 REMOTE 端子のコネクタは、リモートコントローラに適した標準の 5ピン DIN 端子です。



警告

REMOTE 端子に接続したケーブルは、HIGH VOLTAGE 端子、RETURN 端子からは離してください。

ピン配列と接続



ピン	ピン名	概要
1	RMT_STOP	STOP 信号
2	COM	コモン端子
3	COM	コモン端子
4	RMT_START	START 信号
5	+5V	+5V 出力
信号特性		
High の入力電圧		3.3V~5.0V
Low の入力電圧		0~0.8V
入力パルス幅		1ms 以上

リモート端子の操作

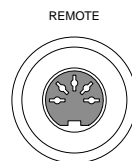
概要

本器は、START ボタンと STOP ボタンの機能を、外部リモート制御で実行できます。REMOTE 端子を使用するには、まず本器がリモート制御を受けけるようにする必要があります。

リモート制御では、フロントパネルの START ボタン、STOP ボタンと同じ操作が行えます。

手順

1. リモート(REMOTE)端子に、外部制御ユニットを接続します。



2. SYSTEM モードの CONTROL を 133 ページ REMOTE に設定します。
 3. これにより、リモート制御でのみ試験が開始できます。
-



本器をリモート制御に設定した場合でも、フロントパネルの STOP ボタンは有効で、試験を停止することができます。

4. フロントパネルの操作に戻す場合は、133 ページ CONTROL を Front Panel に設定します。

SIGNAL I/O の概要

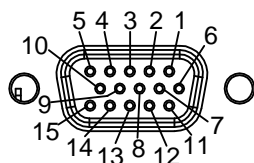
概要

SIGNAL I/O ポートは、リモートでの試験の開始／停止、試験結果のモニタで使用できます。

SIGNAL I/O ポートは、インターロック機能でも使用できます。詳細については、177 ページを参照してください。

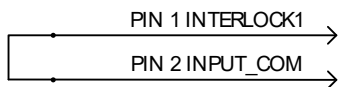
SIGNAL I/O ポートは、基本的に DB 15 ピン (Fe) コネクタを使用します。

ピン配列

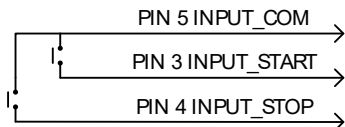


ピン名	ピン	概要
INTERLOCK1	1	INTERLOCK 設定を ON 設定とすると、
INTERLOCK2	2	1、2 の INTERLOCK ピンが短絡されている場合にのみ試験が開始可能。
INPUT_START	3	実行 (START) 信号入力端子
INPUT_STOP	4	停止 (STOP) 信号入力端子
INPUT_COM	5	入力 (INPUT) コモン端子
NC	6	NC
OUTPUT_1	7	OUTPUT1 信号
OUTPUT_2	8	OUTPUT2 信号
OUTPUT_3	9	OUTPUT3 信号
OUTPUT_4	10	OUTPUT4 信号
OUTPUT_5	11	OUTPUT5 信号
NC	12	NC
NC	13	NC
NC	14	NC
OUTPUT_COM	15	出力 (OUTPUT) コモン端子

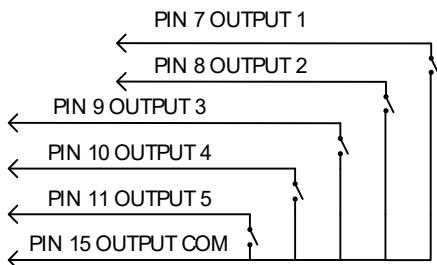
インターロック
接続



入力接続



出力接続



信号仕様

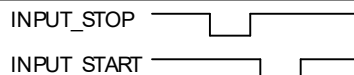
入力信号

High レベル入力電圧	5V～32V
Low レベル入力電圧	0V～1V
Low レベル入力電流	最大-5mA
最小入力時間	1ms

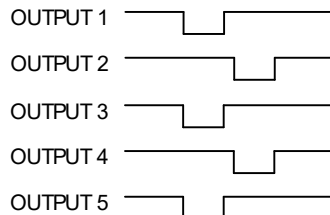
出力信号

出力タイプ	a 接点リレー
出力耐電圧	30VDC
最大出力電流	0.5A

入力停止／入力
開始タイミング



出力タイミング



注意

出力はプログラムで作成できます。

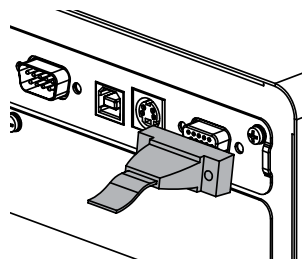
インターロックキーの使用

概要

インターロック (INTERLOCK) 機能が ON の場合、SIGNAL I/O ポートのインターロックピンが短絡されている場合にのみ試験を実行できます。インターロックキーを使用すると、SIGNAL I/O ポートの INTERLOCK1 と INTERLOCK2 のピンが短絡されます。SIGNAL I/O ポートのピン配列については、174 ページを参照してください。

パネル操作

1. インターロックキーを、リアパネルの SIGNAL I/O ポートに接続します。



2. SYSTEM モードで Interlock のオプションを ON に設定します。 133 ページ



注意

INTERLOCK の機能を ON に設定すると、インターロックキーがしっかりと接続されている場合に限り試験を開始できます。試験が始まったならば、インターロックキーは外さないでください。試験開始後、または実行中は、インターロックキーは接続しておく必要があります。

この機能を無効にする場合は、INTERLOCK の設定を OFF にします。

デジタル制御

この章では、IEEE488.2 をベースとした外部制御の基本構成を説明します。外部インターフェースは、USB、RS-232C、GP-IB、LAN に対応しています。

インターフェースについて	179
コマンド構成	184
コマンドリスト	186
エラーメッセージ	245

インタフェースについて

USB リモートインタフェース

USB 構成	PC 側のコネクタ	Type A、ホスト
	GPT 側のコネクタ	リアパネル、Type B
	USB クラス	CDC (communications device class、仮想 COM ポート)

パネル操作

1. リアパネルの USB Type B ポートに、USB ケーブルを接続します。



2. SYSTEM モードで Interface を USB に設定し、USB ケーブルを PC につなぎます。 127 ページ
3. PC が COM ポートを認識すれば完了です。Win10 よりも前の OS の場合はデバイスマネージャで USB デバイスドライバのインストールが必要です。



注意

外部制御で USB を使用する場合、PC に仮想ポートを形成します。ボーレート、その他の RS-232C 設定については、Windows のデバイスマネージャを確認してください。

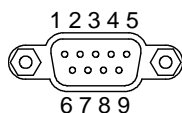
ポートの詳細については、以下の RS-232C 構成を参照してください。

USB インタフェースを使用する場合、ボーレートは 115200baud に固定されます。

RS-232C リモートインタフェース

RS-232C の構成	接続	クロスケーブル
	ボーレート	9600、19200、38400、57600、115200
	パリティ	なし
	データ・ビット	8
	ストップ・ビット	1
	フロー制御	なし

ピン配列

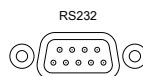


- 1: 接続なし
- 2: RxD(データ受信)
- 3: TxD(データ送信)
- 4: 接続なし
- 5: GND
- 6~9: 接続なし

接続	PC		本器	
	DB9 ピン	信号	信号	DB9 ピン
	2	RxD	TxD	3
	3	TxD	RxD	2
	5	GND	GND	5

パネル操作

- リアパネルの RS232C ポートに、クロスケーブルを接続します。



- SYSTEM モードで Interface を RS-232C に設定します。

127 ページ

LAN リモートインタフェース

LAN 構成	接続	RJ-45 ケーブル
	DHCP	ON, OFF
	Socket Port	00000 – 65000 (初期値: 23)
	IP Address	0-255, 0-255, 0-255, 0-255
	Subnet Mask	0-255, 0-255, 0-255, 0-255
	Gateway	0-255, 0-255, 0-255, 0-255
	MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX: (LAN カードにより異なります)

- パネル操作
1. RJ-45 ケーブルを背面パネルの LAN ポートに接続します。



2. SYSTEM モードで Interface を LAN 127 ページに設定します。

GP-IB リモートインタフェース

GP-IB 構成	アドレス	0~31
----------	------	------

- パネル操作
1. リアパネルの GP-IB ポートに GP-IB ケーブルを接続します。



2. SYSTEM モードで Interface を GPIB 127 ページに設定し、GP-IB アドレスを設定します。

USB/RS-232C/GP-IB/LAN リモート制御の動作確認

動作確認

RealTerm などのシリアル通信アプリケーションを用意します。

COM ポート番号、その他の設定の確認は、PC のデバイスマネージャで行います。

USB、RS-232、GP-IB、LAN リモート制御の構成が済んだならば、以下の問合せコマンドを送信します。

*idn?

通信が正常に行われると、以下のようにモデル名、シリアル番号、ファームウェアバージョンが返ってきます。

GPT-12004 ,GPT12000 ,V1.00

Model number : GPT-12004

Serial number : 8 桁のシリアル番号

Firmware version : V1.00

- 通信アプリケーションからコマンド／クエリを送る場合、文字列の最後が CR、LF となります。詳細は 185 ページを参照してください。



注意

コマンドを連続送信する場合、コマンドごとに 100ms 以上のウエイト時間が必要です。

RMT の表示

USB、RS-232C、GP-IB、LAN でデジタル制御になると、ディスプレイに RMT が表示されます。



RMT のインジケータ

Err の表示

間違ったコマンドが送られると、ディスプレイに Err が表示されます。



Err のインジケータ

デジタル制御の解除

概要

本器がデジタル制御されている場合、STOP ボタン以外のすべてのキーは無効となります。LCD に RMT が表示されている際に、前面パネル操作、通信コマンドあるいは SIGNAL IO によりストップ信号が入力されるか、通信により RMTOFF コマンド (244 ページ) が入力されると、本器は READY 状態に戻ります。



注意

RMT (デジタル制御) に戻すには、再度デジタル制御コマンドを送ります。

コマンド構成

準拠規格	IEEE488.2	準拠
	SCPI, 1999	準拠

コマンド構造 SCPI コマンドは、ノードによる階層的なツリー構造に基づいています。コマンドツリーの各レベルがノードです。SCPI コマンドの各キーワードは、コマンドツリーの各ノードを意味します。SCPI コマンドの各キーワード(ノード)は、コロン(:)で区切られています。

SCPI のサブ構成とコマンド例を以下に示します。



コマンドタイプ さまざまな機器コマンドとクエリがあります。コマンドは指示やデータを機器に送り、クエリによってデータまたはステータス情報を受け取ります。

コマンドタイプ

設定 パラメータの有り無しによる、単独または組み合わされたコマンド

例 MANU:STEP 1

クエリ (問合せ) 単独または組み合わされたコマンドの後に疑問符(?)を付けます。パラメータ(データ)が返ります。

例 MANU:ACW:VOLTage?

コマンド形式

コマンドとクエリは、完全表記(Long Form)と省略表記(Short Form)の2種類の形式があります。コマンドの構文は、大文字で書かれた省略表記と、小文字を含んだ完全表記で書きます。

コマンドは、大文字または小文字で書けますが、完全である必要があります。不完全なコマンドは受けつけられません。

正しく書かれたコマンド例を以下に示します。

完全表記	SYSTem:BUZZer:KEYSound SYSTEM:BUZZER:KEYSOUND system:buzzer:keysound
省略表記	SYST:BUZZ:KEYS syst:buzz:keys

コマンド形式

MANU:STEP 100

1. コマンドヘッダ
2. スペース
3. パラメータ

パラメータ

タイプ	概要	例
<Boolean>	ブールロジック	0、1
<NR1>	整数	0、1、2、3
<NR2>	実数	0.1、3.14、8.5
<NR3>	浮動小数点	4.5e-1、8.25e+1
<NRf>	任意の NR1, 2, 3	1、1.5、4.5e-1
<string>	ASCII 文字	TEST_NAME

メッセージ

ターミネータ

CR、LF、
CR + LF 復帰(CR)、改行(LF)コード、
※LAN 使用時は CR+LF のみ



注意

各コマンド通信の間には、少なくとも 100ms のウェイト時間が必要です。

コマンドリスト

コマンド一覧

システムコマンド

SYSTem:LCD:BRIGhtness	191
SYSTem:BUZZer:VOLUME	191
SYSTem:BUZZer:KEYSound.....	191
SYSTem:TIME	192
SYSTem:STATistics.....	192
SYSTem:ANALysis	193
SYSTem:USBDisK:AUTOSAVE.....	193
SYSTem:USBDisK:AMOUNT	193
SYSTem:USBDisK:FILENAME	194
SYSTem:INTERNAL:SAVE	194
SYSTem:CONtact:HILIMIT	194
SYSTem:CONtact:LOWLIMIT	195
SYSTem:CONtact:LEARNING	195
SYSTem:ERRor	196
SYSTem:CONtrol:INTERlock.....	197
SYSTem:CAL:ALERT	197
SYSTem:CAL:DATE.....	198
SYSTem:CAL:DUE	198
SYSTem:ALERT:DATE	198
SYSTem:CAL:PROtEction	199
SYSTem:INTernal:MEMory.....	199

ファンクションコマンド

FUNCTion:TEST	200
MEASure<x>	200
MAIN:FUNCTion	202
TESTok:RETURN	202

単独 (MANUAL) 試験コマンド

MANU:STEP	205
MANU:INITial	205
MANU:NAME	205
MANU:RTIME.....	206
MANU:EDIT:MODE.....	206

MANU:ACW:VOLTage.....	207
MANU:ACW:CHISet	208
MANU:ACW:CLOSet	208
MANU:ACW:TTIME.....	209
MANU:ACW:ARCFUNCTION.....	210
MANU:ACW:ARCCURRENT	211
MANU:ACW:ARCSPEED	211
MANU:ACW:FREQUENCY	212
MANU:ACW:WAITtime	212
MANU:ACW:RAMPdown	212
MANU:ACW:GROUNDMODE	213
MANU:ACW:MAXHold	213
MANU:ACW:PASShold.....	214
MANU:ACW:REF	214
MANU:ACW:INITvoltage.....	215
MANU:ACW:CONTACT	215
MANU:DCW:VOLTage	216
MANU:DCW:CHISet	216
MANU:DCW:CLOSet	217
MANU:DCW:TTIME	217
MANU:DCW:ARCFUNCTION	218
MANU:DCW:ARCCURRENT	219
MANU:DCW:ARCSPEED.....	219
MANU:DCW:WAITtime	219
MANU:DCW:RAMPdown.....	220
MANU:DCW:GROUNDMODE	220
MANU:DCW:MAXHold.....	221
MANU:DCW:PASShold	221
MANU:DCW:REF	221
MANU:DCW:INITvoltage	222
MANU:DCW:CONTACT	223
MANU:IR:VOLTage	223
MANU:IR:RHISet	223
MANU:IR:RLOSet	224
MANU:IR:TTIME	225
MANU:IR:WAITtime	225
MANU:IR:RAMPdown.....	225
MANU:IR:GROUNDMODE	226
MANU:IR:MAXHold.....	226
MANU:IR:PASShold	226
MANU:IR:REF	227
MANU:IR:MODE	227

MANU:IR:CONTACT	228
MANU:GB:CURRent	228
MANU:GB:RHISet	230
MANU:GB:RLOSet	230
MANU:GB:TTime	231
MANU:GB:FREQuency	231
MANU:GB:CONtact	231
MANU:GB:GROUNDMODE	232
MANU:GB:MAXHold	232
MANU:GB:PASShold	232
MANU:GB:REF	233
MANU:GB:ZEROCHECK	233
MANU:CONTInuity:RHISet	234
MANU:CONTInuity:RLOSet	234
MANU:CONTInuity:TTime	235
MANU:CONTInuity:PASShold	235
MANU:CONTInuity:REF	236
MANU:CONTInuity:ZEROCHECK	236

自動(AUTO)試験コマンド

AUTO:STEP	237
AUTO:NAME	237
AUTO:EDIT:ADD	238
AUTO<x>:EDIT:HOLD	238
AUTO<x>:EDIT:SKIP	238
AUTO:EDIT:DEL	239
AUTO:TEST:RETURN	239
AUTO:EDIT:SHOW	240

スイープコマンド

SWEEP:DATA:STATus	241
SWEEP:DATA:SHOW	241
SWEEP:GRAPh:SHOW	242

共通コマンド

*CLS	243
*IDN	243
*SRE	243

制御コマンド

*RMTOFF244

システムコマンド

SYSTem:LCD:BRIGHtness	191
SYSTem:BUZZer:VOLUME	191
SYSTem:BUZZer:KEYSound.....	191
SYSTem:TIME	192
SYSTem:STATistics.....	192
SYSTem:ANALysis	193
SYSTem:USBDisK:AUTOSAVE	193
SYSTem:USBDisK:AMOUNT	193
SYSTem:USBDisK:FILENAME	194
SYSTem:INTERNAL:SAVE	194
SYSTem:CONtact:HILIMIT	194
SYSTem:CONtact:LOWLIMIT	195
SYSTem:CONtact:LEARNING	195
SYSTem:ERRor	196
SYSTem:CONtrol:INTERlock.....	197
SYSTem:CAL:ALERT	197
SYSTem:CAL:DATE.....	198
SYSTem:CAL:DUE	198
SYSTem:ALERT:DATE	198
SYSTem:CAL:PROtEction	199
SYSTem:INTernal:MEMory.....	199

(Set) →
→ (Query)

SYSTEM:LCD:BRIGhtness

概要	LCDの明るさを、1(暗)~10(明)で設定します。
構文	SYSTEM:LCD:BRIGhtness <NR1>
クエリ構文	SYSTEM:LCD:BRIGhtness?
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR1> 1(暗)~10(明)
例	SYST:LCD:BRIG 10 ディスプレイの明るさを、最も明るい10に設定します。

(Set) →
→ (Query)

SYSTEM:BUZZer:VOLume

概要	ブザーの音量を、1(小)~3(大)で設定します。
構文	SYSTEM:BUZZer:VOLume <NR1>
クエリ構文	SYSTEM:BUZZer:VOLume?
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR1> 1(小)~3(大)
例	SYST:BUZZ:VOLUME 3 ブザーの音量を最も大きな3に設定します。

(Set) →
→ (Query)

SYSTEM:BUZZer:KEYSound

概要	キーが押されたときの音をオン/オフします。
構文	SYSTEM:BUZZer:KEYSound {ON OFF}
クエリ構文	SYSTEM:BUZZer:KEYSound?
パラメータ/ リターンパラメータ	ON キーサウンド:オン OFF キーサウンド:オフ
例	SYST:BUZZ:KEYS ON キーが押されたときにブザーを鳴らします。

SYSTem:TiMe

Set →

→ Query

概要	システム時刻を設定または照会します。
構文	SYSTem:TiMe {TYY_MM_DD_hh:mm:ss}
クエリ構文	SYSTem:TiMe?
パラメータ/ リターンパラメータ	TYY_MM_D 年 (YY)_月 (MM)_日 (DD)_時 (hh)_分 D_hh:mm:ss (mm)_秒 (ss)
	<string> システムの日付と時刻を文字列として返します
例	SYST:TIME T19_12_05_17_10_20 2019-12-05 17:10:20 に設定します。

SYSTem:STATistics

→ Query

概要	PASS、FAIL の最新の統計値を問い合わせます。
クエリ構文	SYSTem:STATistics?
リターンパラメータ	<string> すべての機能試験の最新の統計値を、PASSとFAILの判定回数で返します。
例	SYST:STAT? >TOTAL AMOUNT=00071 >PASS AMOUNT=00059 >FAIL AMOUNT=00012 >FUNC,PASS ,FAIL , >ACW ,00026,00009, >DCW ,00000,00000, >IR ,00017,00003, >GB ,00000,00000, >CONT,00016,00000,

SYSTEM:ANALysis

→ Query

概要	試験機能の最新の解析結果を問い合わせます。
クエリ構文	SYSTEM:ANALysis {ACW DCW IR GB CONT}
リターンパラメータ	<string> 選択された試験項目の最新の解析を、PASS、FAIL の判定と分布で返します。
例	<pre> SYST:ANAL IR >IR,PASS=00017,FAIL=00003 >000~025%=00003 >026~050%=00000 >051~075%=00000 >076~100%=00014 >FAIL=00003 </pre>

Set →

SYSTEM:USBDisk:AUTosave

→ Query

概要	USB メモリへの自動データ保存を ON、OFF します。
構文	SYSTEM:USBDisk:AUTosave {ON OFF}
クエリ構文	SYSTEM:USBDisk:AUTosave?
パラメータ	ON USB メモリへの自動保存:オン
リターンパラメータ	OFF USB メモリへの自動保存:オフ
例	<pre> SYST:USB:AUTOSAVE ON </pre> USB メモリへの自動保存をオンにします。

Set →

SYSTEM:USBDisk:AMOut

→ Query

概要	テストデータを保存、クリア、または返します。
構文	SYSTEM:USBDisk:AMOut {SAVE CLEAR}
クエリ構文	SYSTEM:USBDisk:AMOut?
パラメータ	SAVE 内部メモリのテストデータを USB メモリに保存します。
	CLEAR 内部メモリのテストデータを消去します。

リターンパラメータ <value> 内部メモリのテストデータ数を返します。

例 SYST:USBD:AMOUNT SAVE
内部メモリのテストデータを USB メモリに保存します。

Set →

SYSTEM:USBDisk:FILENAME

→ Query

概要 挿入された USB ディスクに保存されるデータファイル名を設定または返します。ファイル名の設定には、英数字 (A~Z, a~z, 0~9) と「_」アンダースコアを使用できます。

構文 SYSTem:USBDisk:FILENAME <"string">

クエリ構文 SYSTem:USBDisk:FILENAME?

パラメータ <"String"> 8 文字までの文字列。

リターンパラメータ

例 SYST:USBD:FILENAME "File1"
データファイル名を「File1」に設定します。

Set →

SYSTEM:INTERNAL:SAVE

→ Query

概要 内部データの保存をオンまたはオフに設定または返します。

構文 SYSTem:INTERNAL:SAVE {ON |OFF}

クエリ構文 SYSTem:INTERNAL:SAVE?

パラメータ ON 内部データの保存:オン

リターンパラメータ OFF 内部データの保存:オフ

例 SYST:INTERNAL:SAVE ON
内部データの保存をオンにします。

Set →

SYSTEM:CONTACT:HILimit

→ Query

概要 コンタクトチェック機能の上限リミット値を設定または返します。

構文	SYSTem:CONtAct:HILimit {value OFF}	
クエリ構文	SYSTem:CONtAct:HILimit?	
パラメータ	<value>	110% ~ 500% (10%ステップ)
	OFF	Hi Limit 値を無効にします。
リターンパラメータ	<value>	110% ~ 500% (10%ステップ)
	OFF	Hi Limit 値は無効です。
例	SYST:CONt:HILIMIT 200% 上限値を基準値の 200%に設定します。	

Set →

SYSTem:CONtAct:LOWLimit

→ Query

概要 コンタクトチェック機能の下限リミット値を設定または返します。

構文	SYSTem:CONtAct:LOWLimit {value}	
クエリ構文	SYSTem:CONtAct:LOWLimit?	
パラメータ	<value>	10% ~ 90% (10%ステップ)
リターンパラメータ	<value>	10% ~ 90% (10%ステップ)

例 SYST:CONt:LOWLIMIT 80%
下限値を基準値の 80%に設定します。

Set →

SYSTem:CONtAct:LEARning

→ Query

概要 コンタクトチェック機能の現在の基準値を設定または返します。

構文	SYSTem:CONtAct:LEARning RUN	
クエリ構文	SYSTem:CONtAct:LEARning?	
パラメータ	RUN	現在の基準値を設定します。
リターンパラメータ	<value>	現在の基準値を返します。

例 SYST:CONt:LEARNING RUN
コンタクトチェックの現在の基準値を設定します。

SYSTem:ERRor

→(Query)

概要 前回のエラーのエラーコードを返します。エラーコードの詳細は、以下の表を参照してください。

クエリ構文 SYSTem:ERRor ?

リターンパラメータ <string> エラーコードとエラーの概要を含んだメッセージを返します。

エラーコード表

エラーコード	エラー概要
0,No Error	エラーなし
20,Command Error	コマンドエラー
21,Value Error	値エラー
22,String Error	文字エラー
23,Query Error	クエリエラー
24,Mode Error	モードエラー
25,TIME OVER 240s Error	RAMP+TEST が 240 秒を超えた
26,DC Over 50W[GPT-12xxx]	DCW 設定が 50W を超えた
26,DC Over 100W[GPT-15xxx]	DCW 設定が 100W を超えた
27,GBV > 7.2V	GB 設定が 7.2V を超えた
28,ARC <= HI Set	ARC が HI Set 以下
29,HI Set => ARC	HI Set が ARC 以上
30,Voltage Setting Error	電圧設定エラー
31,Current Setting Error	電流設定エラー
32,Current HI SET Error	電流 HI SET エラー
33,Current LO SET Error	電流 LOW SET エラー
34,Resistance HI Set Error	抵抗 HI SET エラー
35,Resistance LO Set Error	抵抗 LOW SET エラー
36,REF Setting Error	REF 設定エラー
37,Frequency Setting Error	周波数設定エラー
38,ARC Setting Error	ARC 設定エラー
39,RAMP Time Setting Error	RAMP Time 設定エラー
40,TEST Time Setting Error	TEST Time 設定エラー
41,WAIT Time Setting Error	WAIT Time 設定エラー
42,RAMP Down Setting Error	RAMP Down 設定エラー
43,PASS Hold Setting Error	PASS Hold 設定エラー
44,GB Contact Setting Error	GB Contact 設定エラー
45,Setting Over 200W	設定が 200W を超えた (GB)
46,CONT Setting Over 8V	CONT 設定が 8V を超えた

47,Auto Step Add Full	自動ステップ追加上限
48,This Is The Last Step	最後のステップ
49,Learning less than 30uA	Learning の値が 30 μ A 未満
50,USB DISK BUSY	USB メモリアクセス中
51,Filter Setting Error	フィルタ設定エラー
70,Read Buffer Error	バッファエラー

例 SYST:ERR ?
>0,No Error
エラーメッセージとして「0,No Error」を返します。

SYSTEM:CONTROL:INTERlock

→ Query

概要 インターロック設定のステータスを返します。

クエリ構文 SYSTem:CONTROL:INTERlock ?

リターン On インターロック設定は ON です。

パラメータ Off インターロック設定は OFF です。

例 SYSTem:CONTROL:INTERlock ?
> On
インターロック設定は ON です。

Set →

SYSTEM:CAL:ALERT

→ Query

概要 校正アラート表示をオンオフします

構文 SYSTem:CAL:ALERT {ON |OFF}

クエリ構文 SYSTem:CAL:ALERT?

パラメータ ON 校正アラート表示をオンします

OFF 校正アラート表示をオフします

リターン ON 校正アラート表示はオンです

パラメータ OFF 校正アラート表示はオフです

例 SYST:CAL:ALERT ON
校正アラート表示をオンします。

SYSTem:CAL:DATE

Set →

→ Query

概要	校正日を指定します。
構文	SYSTem:CAL:DATE {TYY_MM_DD}
クエリ構文	SYSTem:CAL:DATE?
パラメータ	TYY_MM_DD 年(YY)_月(MM)_日(DD) <string> 年月日で応答します。
例	SYST:CAL:DATE T21_06_01 校正日を 2021-06-01 に指定します

Set →

→ Query

SYSTem:CAL:DUE

概要	次回校正日を指定します。
構文	SYSTem:CAL:DUE {TYY_MM_DD}
クエリ構文	SYSTem:CAL:DUE?
パラメータ	TYY_MM_DD Year (YY)_Month (MM)_Day (DD) <string> 年月日で応答します。
例	SYST:CAL:DUE T21_06_01 次回校正日を 2021-06-01 に指定します。

Set →

→ Query

SYSTem:ALERT:DATE

概要	校正前警告日を指定します。
構文	SYSTem:ALERT:DATE {TYY_MM_DD}
クエリ構文	SYSTem:ALERT:DATE?
パラメータ	TYY_MM_DD Year (YY)_Month (MM)_Day (DD) <string> 年月日で応答します。
例	SYST:ALERT:DATE T21_06_01 校正前警告日を 2021-06-01 にします。

SYSTEM:CAL:PROTection Set →
→ Query

概要	校正 警告保護機能を設定します。	
構文	SYSTEM:CAL:PROTection {ON OFF}	
クエリ構文	SYSTEM:CAL:PROTection?	
パラメータ	ON	校正 警告保護をオンします。
	OFF	校正 警告保護をオフします。
応答パラメータ	ON	校正 警告保護をオンです。
	OFF	校正 警告保護をオフです。
例	SYST:CAL:PROT ON 校正 警告保護機能をオンにします。	

SYSTEM:INTernal:MEMory → Query

概要	内部メモリに残るテスト結果を要求します。	
クエリ構文	SYSTEM:INTernal:MEMory?	
パラメータ	<string>	内部メモリに残るテスト結果を応答します。
例	SYST:INTERNAL:MEMORY? > Date/Time ,Stp,MOD,Judge, V/A , Reading , Timer ,MA_S,Barcode , >2021-02-24 13:52:08,001,IR ,PASS ,0.049kV, 10Gohm,T=000.3s,A002, ,	

ファンクションコマンド

FUNCTION:TEST	200
MEASure<x>	200
MAIN:FUNCTION	202
TESTok:RETurn	202

FUNCTION:TEST

Set →

→ Query

概要 現在選択されている試験を開始・停止します。

自動(AUTO)試験中に HOLD が表示されているときに FUNCTION:TEST コマンドを使用すると次のステップに進みます。

試験の最後に FUNCTION:TEST コマンドを OFF に設定すると、PASS/FAIL 判定のブザー音も一時的にオフになります。

構文	FUNCTION:TEST {ON OFF}	
クエリ構文	FUNCTION:TEST?	
パラメータ	ON	試験をオンにします。
	OFF	試験をオフにします。
リターンパラメータ	TEST ON	試験はオンです。
	TEST OFF	試験はオフです。

例 FUNC:TEST ON
テストを開始・再開します。

MEASure<x>

→ Query

概要 単独(MANU)モード: 単独(MANU)試験のパラメータと結果を返します。
自動(AUTO)モード: 自動(AUTO)試験時の選択されたステップ(1~50)のパラメータと結果を返します。
パラメータ戻り値: 機能、判定/状態、試験電圧、試験電流/抵抗、試験時間(完了した試験時間)またはランプ時間等(完了しなかったテストの経過時間)

クエリ構文	MEASure<x>?	
パラメータ (MANU モード)	(無し)	単独モードでは、パラメータは、不要
パラメータ (AUTO モード)	<NR1>	1~50: MANU ステップ番号
リターンパラメータ	<string>	次の形式でテストの状態を返します。 試験項目、判定と状態、試験電圧、試験電流または抵抗、試験時間またはランプ時間等
試験項目	ACW、DCW、IR、GB、CON	
判定／状態	TEST	試験中
	PASS	合格
	FAIL	不合格
	ERROR	エラー発生
	HFAIL	HI 設定側で不合格
	LFAIL	LOW 設定側で不合格
	HOLDP	PASS ホールド中
	HOLDF	FAIL ホールド中
	HPLDT	TIME ホールド中
	SKIP	スキップ
	VOVER	電圧超過 110%越え
	V LOW	電圧過少 90%未満
	SHORT	10V 未満
	OPEN	コンタクトチェック Low
	IOVER	電流超過 110%越え
	I LOW	電流過少 90%未満
	GFAIL	GFCI エラー
	ARC	アーク検出
	STOP	停止中
試験電圧	電圧と単位	
試験電流／ 試験抵抗	電流と単位 抵抗と単位、R OVER(GB,CONT)	
試験時間	時間と単位 I: イニシャル時間 R: ランプ時間 T: 試験時間 D: ランプ下降時間	

例 (MANU モード)	MEAS? > CON,FAIL ,100.0mA,99.99 ohm,T=000.1s 現在の MANU 試験の結果を返します。
例 (AUTO モード)	MEAS21? > DCW,FAIL ,0.004kV, 000 uA ,T=000.3s 現在の AUTO 試験の 21 ステップ目の結果を返します。

Set →

→ Query

MAIN:FUNCTION

概要	自動(AUTO)と単独(MANUAL)のモードを切り替えます。
構文	MAIN:FUNCTION {MANU AUTO}
クエリ構文	MAIN:FUNCTION ?
パラメータ/ リターンパラメータ	MANU MANUAL(単独)モード AUTO AUTO(自動)モード
例	MAIN:FUNC MANU MANU(単独)モードにします。

Set →

→ Query

TESTok:RETurn

概要	テストの終了時に表示されるテスト結果の「OK」メッセージをオンまたはオフにします。
構文	TESTok:RETurn {ON OFF}
クエリ構文	TESTok:RETurn ?
パラメータ/ リターンパラメータ	ON テスト結果の「OK」メッセージをオンにします。 OFF テスト結果の「OK」メッセージをオフにします。
例	TEST:RETURN ON テスト結果の「OK」メッセージをオンにします。

単独 (MANUAL) 試験コマンド

MANU:STEP	205
MANU:INITial	205
MANU:NAME	205
MANU:RTIME.....	206
MANU:EDIT:MODE	206
MANU:ACW:VOLTage.....	207
MANU:ACW:CHISet	208
MANU:ACW:CLOSet	208
MANU:ACW:FILTer	209
MANU:ACW:TTIME.....	209
MANU:ACW:ARCFunction.....	210
MANU:ACW:ARCCurrent	211
MANU:ACW:ARCSpeed	211
MANU:ACW:FREQuency	212
MANU:ACW:WAITtime	212
MANU:ACW:RAMPdown	212
MANU:ACW:GROUNDMODE	213
MANU:ACW:MAXHold.....	213
MANU:ACW:PASShold.....	214
MANU:ACW:REF	214
MANU:ACW:INITvoltage.....	215
MANU:ACW:CONTACT.....	215
MANU:DCW:VOLTage	216
MANU:DCW:CHISet	216
MANU:DCW:CLOSet	217
MANU:DCW:FILTer	217
MANU:DCW:TTIME	218
MANU:DCW:ARCFunction	218
MANU:DCW:ARCCurrent	219
MANU:DCW:ARCSpeed.....	219
MANU:DCW:WAITtime	219
MANU:DCW:RAMPdown.....	220
MANU:DCW:GROUNDMODE	220
MANU:DCW:MAXHold.....	221
MANU:DCW:PASShold	221
MANU:DCW:REF.....	221
MANU:DCW:INITvoltage	222
MANU:DCW:CONTACT	223
MANU:IR:VOLTage	223

MANU:IR:RHISet	223
MANU:IR:RLOSet	224
MANU:IR:TTIME.....	225
MANU:IR:WAITtime	225
MANU:IR:RAMPdown	225
MANU:IR:GROUNDMODE	226
MANU:IR:MAXHold	226
MANU:IR:PASShold.....	226
MANU:IR:REF	227
MANU:IR:MODE	227
MANU:IR:CONtact	228
MANU:IR:FILTer	228
MANU:IR:GNDoffset	229
MANU:GB:CURRent	229
MANU:GB:RHISet.....	230
MANU:GB:RLOSet.....	230
MANU:GB:TTIME	231
MANU:GB:FREQuency.....	231
MANU:GB:CONtact	231
MANU:GB:GROUNDMODE.....	232
MANU:GB:MAXHold	232
MANU:GB:PASShold	232
MANU:GB:REF	233
MANU:GB:ZEROCHECK.....	233
MANU:CONtinuity:RHISet	234
MANU:CONtinuity:RLOSet	234
MANU:CONtinuity:TTIME.....	235
MANU:CONtinuity:PASShold.....	235
MANU:CONtinuity:REF	236
MANU:CONtinuity:ZEROCHECK	236

MANU:STEP

Set →

→ Query

概要	単独 (MANU) 試験の番号を設定します。
構文	MANU:STEP <NR1>
クエリ構文	MANU:STEP?
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR1> 0~100
例	MANU:STEP 100 単独 (MANU) 試験の番号を 100 に設定します。

MANU:INITial

Set →

概要	選択された単独 (MANU) 試験の初期設定を読み込みます。試験項目 (ACW、DCW、IR、GB または CONT) に応じて初期設定は読み込まれます。MANU000 では Err のメッセージが表示され、適用されません。					
構文	MANU:INITial					
初期設定		試験項目				
	パラメータ	ACW	DCW	IR	GB	CONT
	REF#	000uA	000uA	000.0MΩ	000.0mΩ	00.00Ω
	周波数	60Hz	X	X	60Hz	X
	HI SET	1.000mA	1.000mA	OFF	100.0mΩ	01.00Ω
	LOW SET	000uA	000uA	001.0MΩ	000.0mΩ	00.00Ω
	電流または 電圧	0.100kV	0.100kV	0.050kV	03.00A	100mA
	試験時間	000.3s	000.3s	000.3s	000.3s	000.3s
ランプ時間	000.1s	000.1s	000.1s	X	X	

例	MANU:INITial 選択された単独 (MANU) 試験の初期設定を読み込みます。
---	--

Set →

→ Query

MANU:NAME

概要 選択された単独 (MANU) 試験の名前を設定、返します。コマンドを使用する前、単独モードにする必要があります。

単独 (MANU) 試験の名前には、英数字 (A~Z、a~z、0~9) とアンダースコア “_” が使用できます。

構文 MANU:NAME <"string">

クエリ構文 MANU:NAME?

**パラメータ/
リターンパラメータ** <string> 10 個の文字例

例 MANU:NAME "test1"
単独 (MANU) 試験名を test1 に設定します。

Set →

→ Query

MANU:RTIME

概要 試験のランプ時間を秒で設定または返します。

注意: HI SET 上限電流が 30mA (GPT-12xxx)、80mA (GPT-15xxx) を超え、ランプ時間 + 試験時間が 240 秒を超えると、パネルには “Err” が表示され、コマンドは無効です。これは、ACW 機能のみで適用されます。リモート時、クエリコマンド「SYSTEM:ERROR?»を使用すると、「TIME OVER 240s」メッセージが返されません。

注意: GB または CONT のモードでは RAMP TIME の設定がないため、このリモートコマンドを発行すると “Err” のメッセージが表示されます。

構文 MANU:RTIME <NR2>

クエリ構文 MANU:RTIME?

**パラメータ/
リターンパラメータ** <NR2> 0.1~999.9 (秒)

例 MANU:RTIM 0.5
ランプ時間を 0.5 秒に設定します。

Set →

→ Query

MANU:EDIT:MODE

概要	選択された単独 (MANU) 試験のモード (ACW、DCW、IR、GB、CONT) を設定または返します。	
構文	MANU:EDIT:MODE {ACW DCW IR GB CONT}	
クエリ構文	MANU:EDIT:MODE?	
パラメータ/ リターンパラメータ	ACW	AC 耐電圧モード
	DCW	DC 耐電圧モード
	IR	絶縁抵抗モード
	GB	アース導通モード
	CONT	導通モード
例	MANU:EDIT:MODE ACW ACW (AC 耐電圧) モードに設定します。	

Set →

MANU:ACW:VOLTage

→ Query

概要	ACW の電圧を kV で設定または返します。このコマンドを使用する前に ACW モードにしておく必要があります。	
構文	MANU:ACW:VOLTage <NR2>	
クエリ構文	MANU:ACW:VOLTage?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0.050~5.100 (kV)
例	MANU:ACW:VOLT 1 ACW の電圧を 1kV に設定します。	

MANU:ACW:CHISet

概要

ACW の HI SET 電流を、mA の値で設定または返します。コマンド発行前に ACW のモードにしておく必要があります。

注意: HI SET+REF 電流が 30mA (GPT-12xxx)、80mA (GPT-15xxx) を超え、ランプ時間+試験時間が 240 秒を超えると、パネルには“Err”が表示され、コマンドは無効です。これは、ACW 機能のみで適用されません。リモート時、クエリコマンド「SYSTEM:ERRor?」を使用すると、「TIME OVER 240s」メッセージが返されます。

以下の条件の場合、パネルには“Err”が表示され、コマンドは無効となります。

LOW SET>HI SET

ARC SET \leq HI SET

HI SET+REF VALUE>42mA (GPT-12xxx)

110mA (GPT-15xxx)

構文

MANU:ACW:CHISet <NR2>

クエリ構文

MANU:ACW:CHISet?

パラメータ/

<NR2> 0.001~42.00 (mA) [GPT-12xxx]

リターンパラメータ

0.001~110.0 (mA) [GPT-15xxx]

例

MANU:ACW:CHIS 30.0

ACW HI SET の電流を 30mA に設定します。

MANU:ACW:CLOSet

概要

ACW の LOW SET 電流を、mA の値で設定または返します。LOW SET の値は、HI SET の値よりも小さくなければなりません。コマンド発行前に ACW のモードにしておく必要があります。

LOW SET の値は HI SET の値より小さいことが必要です。LOW SET が HI SET の範囲を外れた場合は、パネルには、“Err”のメッセージが表示されコマンドは無効です。

例:

HI SET の値: 30.00
 LOW SET の値: 30.01 → エラー

構文	MANU:ACW:CLOSet <NR2>	
クエリ構文	MANU:ACW:CLOSet?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0.000~41.99 (mA) [GPT-12xxx] 0.000~109.9 (mA) [GPT-15xxx]
例	MANU:ACW:CLOS 20.0 ACW LO SET の電流を 20mA に設定します。	

Set →

MANU:ACW:FILTer

→ Query

概要	ACW テストのフィルタ機能をオン/オフします。 オン状態では ACW テストの判定を 100ms ごとに行います。	
構文	MANU:ACW:FILTer {OFF ON}	
クエリ構文	MANU:ACW:FILTer ?	
パラメータ/ リターンパラメータ	ON	ACW テストのフィルタ機能をオンします。
	OFF	ACW テストのフィルタ機能をオフします。
構文	MANU:ACW:FILT ON	
クエリ構文	ACW テストのフィルタ機能をオンします。	

Set →

MANU:ACW:TTIME

→ Query

概要	ACW 試験の試験時間を秒で設定または返します。コマンド発行前に ACW のモードにしておく必要があります。
----	--

注意: HI SET 上限電流が 30mA (GPT-12xxx)、80mA (GPT-15xxx) を超え、ランプ時間 + 試験時間が 240 秒を超えると、パネルには“Err”が表示され、コマンドは無効です。これは、ACW 機能のみで適用されます。リモート時、クエリコマンド「SYSTem:ERRor?」を使用すると、「TIME OVER 240s」メッセージが返されます。

構文	MANU:ACW:TTIME {<NR2> OFF}	
クエリ構文	MANU:ACW:TTIME?	
パラメータ	<NR2>	0.3~999.9 (秒)
	OFF	タイマー: OFF
リターンパラメータ	<NR2>	0.3~999.9 (秒)
	TIME OFF	タイマー: OFF

例 MANU:ACW:TTIM 1
ACW の試験時間を 1 秒に設定します。

Set →

MANU:ACW:ARCFUNCTION

→ Query

概要 ACW ARC (アーク検出) モードを設定または返します。コマンド発行前に ACW のモードにしておく必要があります。なお、このコマンドは、ARC SET > HI SET の場合のみ動作しますので先に ARC 電流を設定してください。

構文	MANU:ACW:ARCFUNCTION {OFF ON_CONT ON_STOP}
クエリ構文	MANU:ACW:ARCFUNCTION?

パラメータ/	OFF	ARC 機能をオフにします。
リターンパラメータ	ON_CONT	ARC 機能をオン、継続します。
	ON_STOP	ARC 機能をオン、停止にします。

例 MANU:ACW:ARCF OFF
ACW ARC 機能をオフにします。

Set →

MANU:ACW:ARCCurrent

→ Query

概要 ACW 試験の ARC 電流値を mA で設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:ARCCurrent <NR2>

クエリ構文 MANU:ACW:ARCCurrent?

パラメータ/	<NR2>	1.000~80.00 (mA) [GPT-12xxx]
リターンパラメータ		1.000~200.0 (mA) [GPT-15xxx]

例 MANU:ACW:ARCC 1.233
ACW の ARC の値を 1.233mA に設定します。

Set →

MANU:ACW:ARCSpeed

→ Query

概要 ACW 試験における ARC 速度を設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:ARCSpeed {FAST|NORMAL|SLOW}

クエリ構文 MANU:ACW:ARCSpeed?

パラメータ/	FAST	ARC の速度: 高速
リターンパラメータ	NORMAL	ARC の速度: 中速
	SLOW	ARC の速度: 低速

例 MANU:ACW:ARCS SLOW
ACW の ARC 速度を低速に設定します。

MANU:ACW:FREQuency

Set →

→ Query

概要 ACW 試験の周波数を Hz で設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:FREQuency {50|60}

クエリ構文 MANU:ACW:FREQuency?

パラメータ 50 50Hz

リターンパラメータ 60 60Hz

例 MANU:ACW:FREQ 50
ACW 試験の周波数を 50Hz に設定します。

Set →

→ Query

MANU:ACW:WAITtime

概要 ACW の保留時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:WAITtime <NR2>

クエリ構文 MANU:ACW:WAITtime?

パラメータ/ <NR2> 0~999.9 (秒)

リターンパラメータ

例 MANU:ACW:WAIT 10.1
ACW の保留時間を 10.1 秒に設定します。

Set →

→ Query

MANU:ACW:RAMPdown

概要 ACW の下降時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:RAMPdown <NR2>

クエリ構文 MANU:ACW:RAMPdown?

パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0~999.9 (秒)
---------------------	-------	-------------

例 MANU:ACW:RAMP 999.9
下降時間を 999.9 秒に設定します。

MANU:ACW:GROundmode

Set →

→ Query

概要 ACW のグラウンドモードを設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:GROundmode {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:ACW:GROundmode?

パラメータ/ リターンパラメータ	ON	ACW グラウンドモード: ON
	OFF	ACW グラウンドモード: OFF

例 MANU:ACW:GROUNDMODE OFF
ACW のグラウンドモードをオフにします。

MANU:ACW:MAXHold

Set →

→ Query

概要 ACW の MAX HOLD 機能を設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:MAXHold {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:ACW:MAXHold?

パラメータ/ リターンパラメータ	ON	ACW の MAX HOLD 機能: ON
	OFF	ACW の MAX HOLD 機能: OFF

例 MANU:ACW:MAXH OFF
ACW の MAX HOLD 機能をオフに設定します。

Set →

MANU:ACW:PASShold

→ Query

概要 ACW の PASS HOLD の時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:ACW:PASShold {<NR2>|ON}

クエリ構文 MANU:ACW:PASShold?

パラメータ/ <NR2> 0~999.9 (秒)

リターンパラメータ ON 無制限

例 MANU:ACW:PASS 999.9

ACW の PASS HOLD 時間を 999.9 秒に設定します。

Set →

MANU:ACW:REF

→ Query

概要 ACW 試験のオフセット(REF VALUE)を μ A または mA で設定または返します。このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。

ACW のオフセット(REF VALUE)を含めた上限値は、HI SET 値と同じ 42mA(GPT-12xxx)、110mA(GPT15000)です。GPT-12xxx では、HI SET 値を 10mA に設定した場合、オフセット(REF VALUE)は 32mA まで設定できます。

構文 MANU:ACW:REF <NR2>

クエリ構文 MANU:ACW:REF?

パラメータ/ <NR2> 0.000~41.99 (mA)[GPT-12xxx]

リターンパラメータ 0.000~109.9 (mA)[GPT-15xxx]

例 MANU:ACW:REF 40

ACW の基準値を 40mA に設定します。

MANU:ACW:INITvoltage (Set) → → (Query)

概要	初期電圧の ACW パーセントを設定または返します。 このコマンドの前には、ACW モードにしておく必要があります。	
構文	MANU:ACW:INITvoltage <NR1>	
クエリ構文	MANU:ACW:INITvoltage?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR1>	0~99 (%)
例	MANU:ACW:INIT 87 ACW の初期電圧を 87% に設定します。	

MANU:ACW:CONtact (Set) → → (Query)

概要	CONTACT CHK 機能をオンまたはオフに設定または返します。 注: 基準値が 30uA 未満の場合、「Err」メッセージがディスプレイに表示されます。 コマンド「SYSTem:ERRor?」を使用すると、「LEARNING <30uA」メッセージが返されます。	
構文	MANU:ACW:CONtact {ON OFF}	
クエリ構文	MANU:ACW:CONtact?	
パラメータ/ リターン パラメータ	ON	ACW テスト時、コンタクトチェック機能がオン
	OFF	ACW テスト時、コンタクトチェック機能がオフ
例	MANU:ACW:CONtact OFF ACW テスト時、コンタクトチェック機能をオフにします。	

MANU:DCW:VOLTage

Set →

→ Query

概要 DCW の電圧を kV で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

注意: DCW 電圧 × HISET の値が 50W を超える場合、パネルには“Err”が表示されコマンドは無効です。リモート時、クエリコマンド「SYSTem:ERRor?」を使用すると、「DC Over 50W」メッセージが返されます。

構文 MANU:DCW:VOLTage <NR2>

クエリ構文 MANU:DCW:VOLTage?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 0.050~6.100 (kV)

例 MANU:DCW:VOLT 6
DCW の電圧を 6kV に設定します。

Set →

→ Query

MANU:DCW:CHISet

概要 DCW の HI SET の電流を mA で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

注意: 以下の条件の場合、パネルには“Err”が表示され、コマンドは無効となります。

DCW 電圧 × (HISET+REF VALUE) の値が 50W (GPT-12xxx)、100W(GPT-15xxx)を超える

クエリコマンド「SYSTem:ERRor?」を使用すると、「DC Over 50W または 100W」メッセージが返されません。

LOW SET > HI SET

ARC SET ≤ HI SET

HI SET+REF VALUE > 11mA (GPT-12xxx)

21mA (GPT-15xxx)

構文	MANU:DCW:CHISet <NR2>	
クエリ構文	MANU:DCW:CHISet?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0.001~11.00 (mA)[GPT-12xxx] 0.001~21.00 (mA)[GPT-15xxx]

例 MANU:DCW:CHIS 5
DCW の HI SET 電流を 5mA に設定します。

Set →

MANU:DCW:CLOSet

→ Query

概要 DCW の LOW SET の電流を mA で設定または返します。LOW SET の値は、HI SET の値よりも小さくする必要があります。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

LOW SET の値は HI SET の値より小さいことが必要です。LOW SET が HI SET の範囲を外れた場合、パネルには、“Err”のメッセージが表示され、コマンドは無効です。

例:

HI SET の値: 10.99

LOW SET の値: 11.00 → エラー

構文	MANU:DCW:CLOSet <NR2>	
クエリ構文	MANU:DCW:CLOSet?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0.000~10.99 (mA)[GPT-12xxx] 0.000~20.99 (mA)[GPT-15xxx]

例 MANU:DCW:CLOS 2.00
DCW の LO SET 電流を 2mA に設定します。

Set →

MANU:DCW:FILTer

→ Query

概要 DCW テストのフィルタ機能をオン/オフします。オン状態では DCW テストの判定を 100ms ごとに行います。

構文	MANU:DCW:FILTer {OFF ON}	
クエリ構文	MANU:DCW:FILTer ?	

パラメータ/	ON	DCW テストのフィルタ機能をオンします。
リターンパラメータ	OFF	DCW テストのフィルタ機能をオフします。
構文	MANU:DCW:FILT ON	
クエリ構文	DCW テストのフィルタ機能をオンします。	

(Set) →

MANU:DCW:TTIME

→ (Query)

概要 DCW の試験時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:TTIME {<NR2>|OFF}

クエリ構文 MANU:DCW:TTIME?

パラメータ <NR2> 0.3~999.9(秒)
OFF タイマー:オフ

リターンパラメータ <NR2> 0.3~999.9(秒)
TIME OFF タイマーはオフです。

例 MANU:DCW:TTIM 1
DCW の試験時間を 1 秒に設定します。

(Set) →

MANU:DCW:ARCFUNCTION

→ (Query)

概要 DCW ARC(アーク検出)機能を設定または返します。コマンド発行前に DCW のモードにしておく必要があります。なお、このコマンドは、ARC SET > HI SET の場合のみ動作しますので ARC 電流を先に設定してください

構文 MANU:DCW:ARCFUNCTION

クエリ構文 {OFF|ON_CONT|ON_STOP}
MANU:DCW:ARCFUNCTION?

パラメータ/ OFF ARC 機能をオフにします。
リターンパラメータ ON_CONT ARC 機能をオン、継続します。
ON_STOP ARC 機能をオン、停止にします。

例 MANU:DCW:ARCF OFF
DCW の ARC 機能をオフにします。

MANU:DCW:ARCCurrent

Set →

→ Query

概要 DCW 試験の ARC 電流値を mA で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:ARCCurrent <NR2>

クエリ構文 MANU:DCW:ARCCurrent?

パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	1.000~20.00 (mA) [GPT-12xxx]
		1.000~40.00 (mA) [GPT-15xxx]

例 MANU:DCW:ARCC 10

DCW の ARC の値を 10mA に設定します。

Set →

→ Query

MANU:DCW:ARCSpeed

概要 DCW 試験における ARC 速度を設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:ARCSpeed {FAST|NORMAL|SLOW}

クエリ構文 MANU:DCW:ARCSpeed?

パラメータ/ リターンパラメータ	FAST	ARC 速度: 高速
	NORMAL	ARC 速度: 中速
	SLOW	ARC 速度: 低速

例 MANU:DCW:ARCS SLOW

DCW の ARC 速度を低速に設定します。

Set →

→ Query

MANU:DCW:WAITtime

概要 DCW の保留時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:WAITtime <NR2>

クエリ構文 MANU:DCW:WAITtime?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 0~999.9 (秒)

例 MANU:DCW:WAIT 10.1
DCW の保留時間を 10.1 秒に設定します。

Set →

MANU:DCW:RAMPdown

→ Query

概要 DCW の下降時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:RAMPdown <NR2>

クエリ構文 MANU:DCW:RAMPdown?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 0~999.9 (秒)

例 MANU:DCW:RAMP 999.9
DCW の下降時間を 999.9 秒に設定します。

Set →

MANU:DCW:GROundmode

→ Query

概要 DCW のグラウンドモードを設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:GROundmode {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:DCW:GROundmode?

パラメータ/リターンパラメータ ON DCW グラウンドモード: ON
OFF DCW グラウンドモード: OFF

例 MANU:DCW:GROUNDMODE OFF
DCW のグラウンドモードをオフにします。

Set →

MANU:DCW:MAXHold

→ Query

概要 DCW の MAX HOLD 機能を設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:MAXHold {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:DCW:MAXHold?

パラメータ/	ON	DCW の MAX HOLD 機能: ON
リターンパラメータ	OFF	DCW の MAX HOLD 機能: OFF

例 MANU:DCW:MAXH OFF
DCW の MAX HOLD 機能をオフにします。

Set →

MANU:DCW:PASShold

→ Query

概要 DCW の PASS HOLD の時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。

構文 MANU:DCW:PASShold {<NR2>|ON}

クエリ構文 MANU:DCW:PASShold?

パラメータ/	<NR2>	0~999.9 (秒)
リターンパラメータ	ON	無制限

例 MANU:DCW:PASS 999.9
DCW の PASS HOLD 時間を 999.9 秒に設定します。

Set →

MANU:DCW:REF

→ Query

概要	DCW 試験のオフセット(REF VALUE)を μA または mA で設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。	
	DCW のオフセット(REF VALUE)を含めた上限値は、HI SET 値と同じ 11mA(GPT-12xxx)、21mA(GPT-15xxx)です。GPT-12xxx では、HI SET 値を 5mA に設定した場合、オフセット(REF VALUE)は 6mA まで設定できます。	
構文	MANU:DCW:REF <NR2>	
クエリ構文	MANU:DCW:REF?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0.000~10.99 (mA)[GPT-12xxx] 0.000~20.99 (mA)[GPT-15xxx]
例	MANU:DCW:REF 10 DCW の基準値を 10mA に設定します。	

Set →

MANU:DCW:INITvoltage

→ Query

概要	初期電圧の DCW パーセントを設定または返します。このコマンドの前には、DCW モードにしておく必要があります。	
構文	MANU:DCW:INITvoltage <NR1>	
クエリ構文	MANU:DCW:INITvoltage?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR1>	0~99 (%)
例	MANU:DCW:INIT 87 DCW の初期電圧を 87% に設定します。	

MANU:DCW:CONtact

Set →

→ Query

概要 コンタクトチェック機能をオンまたはオフに設定または返します。

注: 基準値が 30uA 未満の場合、「Err」メッセージがディスプレイに表示されます。

コマンド「SYSTem:ERRor?」を使用すると、「LEARNING <30uA>」メッセージが返されます。

構文 MANU:DCW:CONtact {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:DCW:CONtact?

パラメータ/リターン パラメータ	ON	DCW テスト時、コンタクトチェック機能がオン
	OFF	DCW テスト時、コンタクトチェック機能がオフ

例 MANU:DCW:CONtact OFF
DCW テスト時、コンタクトチェック機能をオフにします。

Set →

→ Query

MANU:IR:VOLTage

概要 絶縁抵抗 (IR) 試験の印加電圧を kV で設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:VOLTage <NR2>

クエリ構文 MANU:IR:VOLTage?

パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0.05 ~ 1.2 (kV、ステップ: 0.05kV)
---------------------	-------	------------------------------

例 MANU:IR:VOLT 1
IR の印加電圧を 1kV に設定します。

Set →

→ Query

MANU:IR:RHISet

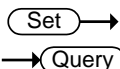
概要 絶縁抵抗 (IR) 試験の HI SET 抵抗値を MΩ または GΩ で設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:RHISet {<NR2>|NULL}

クエリ構文 MANU:IR:RHISet?

パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	000.2M~999.9M (Ω) 1.000G~9.999G (Ω) 10.00G~50.00G (Ω)
	NULL	HI SET 値を OFF(∞) に設定します。

例 MANU:IR:RHIS 10M
IR の HI SET 抵抗を 10MΩ に設定します。



MANU:IR:RLOSet

概要 絶縁抵抗 (IR) 試験の LO SET 抵抗値を MΩ または GΩ で設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:RLOSet <NR2>

クエリ構文 MANU:IR:RLOSet?

パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	000.1M~999.9M (Ω) 1.000G~9.999G (Ω) 10.00G~50.00G (Ω)
---------------------	-------	---

例 MANU:IR:RLOS 10M
IR の LO SET 抵抗を 10MΩ に設定します。

Set →

→ Query

MANU:IR:TTIME

概要 IR の試験時間を秒で設定します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:TTIME <NR2>

クエリ構文 MANU:IR:TTIME?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 0.3~999.9 (秒)

例 MANU:IR:TTIM 1
IR の試験時間を 1 秒に設定します。

Set →

→ Query

MANU:IR:WAITtime

概要 IR の保留時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:WAITtime <NR2>

クエリ構文 MANU:IR:WAITtime?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 0~999.9 (秒)

例 MANU:IR:WAIT 10.1
IR の保留時間を 10.1 秒に設定します。

Set →

→ Query

MANU:IR:RAMPdown

概要 IR の下降時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:RAMPdown <NR2>

クエリ構文 MANU:IR:RAMPdown?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 0~999.9 (秒)

例 MANU:IR:RAMP 999.9
IR の下降時間を 999.9 秒に設定します。

Set →

MANU:IR:GROundmode

→ Query

概要 IR のグラウンドモードを設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:GROUNDMODE {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:IR:GROUNDMODE?

パラメータ/ リターンパラメータ	ON	IR グラウンドモード: ON
	OFF	IR グラウンドモード: OFF

例 MANU:IR:GROUNDMODE OFF
IR のグラウンドモードをオフにします。

Set →

MANU:IR:MAXHold

→ Query

概要 IR の MAX HOLD 機能を設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:MAXHold {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:IR:MAXHold?

パラメータ/ リターンパラメータ	ON	IR の MAX HOLD: ON
	OFF	IR の MAX HOLD: OFF

例 MANU:IR:MAXH OFF
IR の MAX HOLD 機能をオフにします。

Set →

MANU:IR:PASShold

→ Query

概要 IR の PASS HOLD の時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:PASShold {<NR2>|ON}

クエリ構文 MANU:IR:PASShold?

パラメータ/	<NR2>	0~999.9 (秒)
リターンパラメータ	ON	無制限

例 MANU:IR:PASS 999.9
IR の PASS HOLD 時間を 999.9 秒に設定します。

Set →

MANU:IR:REF

→ Query

概要 IR 試験のオフセット(REF VALUE)を MΩ または GΩ で設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:REF <NR2>

クエリ構文 MANU:IR:REF?

パラメータ/	<NR2>	000.0M~999.9M (Ω)
リターンパラメータ		1.000G~9.999G (Ω)
		10.00G~50.00G (Ω)

例 MANU:IR:REF 900M
IR の基準値を 900MΩ に設定します。

Set →

MANU:IR:MODE

→ Query

概要 絶縁(IR)試験の IR モードを設定または返します。このコマンドの前には、IR モードにしておく必要があります。

構文 MANU:IR:MODE
{STOP_ON_FAIL|STOP_ON_PASS|TIMER}

クエリ構文 MANU:IR:MODE?

パラメータ/	STOP_ON_FAIL	IR モード: FAIL で停止
リターンパラメータ	STOP_ON_PASS	IR モード: PASS で停止
	TIMER	IR モード: タイマー

例 MANU:IR:MODE TIMER
IR モードを、タイマーに設定します。

MANU:IR:CONtact

Set →

→ Query

概要 コンタクトチェック機能をオンまたはオフに設定または返します。

注: 基準値が 30uA 未満の場合、「Err」メッセージがディスプレイに表示されます。

コマンド「SYSTem: ERRor?」を使用すると、「LEARNING <30uA」メッセージが返されます。

構文 MANU:IR:CONtact {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:IR:CONtact?

パラメータ/ リターンパラメータ	ON	IR テスト時、コンタクトチェック機能がオン
	OFF	IR テスト時、コンタクトチェック機能がオフ

例 MANU:IR:CONTACT OFF

IR テスト時、コンタクトチェック機能をオフにします。

Set →

→ Query

MANU:IR:FILTEr

概要 IR テストのフィルタを設定します。

LEVEL1:1 秒平均、LEVEL10:10 秒平均

構文 MANU:IR:FILT {OFF | LEVEL1 | LEVEL2 | LEVEL3
| LEVEL4 | LEVEL5 | LEVEL6 | LEVEL7 | LEVEL8
| LEVEL9 | LEVEL10}

クエリ構文 MANU:IR:FILT?

パラメータ/ リターンパラメータ	OFF	FILTER in IR test Off
	LEVEL1	FILTER in IR test Level 1
	LEVEL2	FILTER in IR test Level 2
	LEVEL3	FILTER in IR test Level 3
	LEVEL4	FILTER in IR test Level 4
	LEVEL5	FILTER in IR test Level 5
	LEVEL6	FILTER in IR test Level 6
	LEVEL7	FILTER in IR test Level 7
	LEVEL8	FILTER in IR test Level 8
	LEVEL9	FILTER in IR test Level 9
	LEVEL10	FILTER in IR test Level 10

例 MANU:IR:FILT OFF
フィルタをオフにします。

Set →

MANU:IR:GNDoffset

→ Query

概要 IR テストの GND オフセット機能を設定します。

構文 MANU:IR:GNDoffset {ON | OFF}

クエリ構文 MANU:IR:GNDoffset?

パラメータ/リターンパラメータ	ON	IR テストの GND オフセット機能をオンします。
	OFF	IR テストの GND オフセット機能をオフします。

例 MANU:IR:GND OFF
IR テストの GND オフセット機能をオフします。

Set →

MANU:GB:CURRent

→ Query

概要 アース導通(GB)試験の電流を A で設定または返します。このコマンドの前には、GB モードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:CURRent <NR2>

クエリ構文 MANU:GB:CURRent?

パラメータ/リターンパラメータ	<NR2>	3.00~33.00 (A)
-----------------	-------	----------------

例 MANU:GB:CURR 3.00
GB の電流を 3.00A に設定します。

Set →

MANU:GB:RHISet

→ Query

概要 アース導通(GB)試験の HI SET 抵抗を mΩ で設定または返します。このコマンドの前には、GB モードにしておく必要があります。

注意:GB の電流値と(HI SET 抵抗+REF)の値により 7.2V または 200W より大きいと、パネルには“Err”が表示され、設定は無効です。リモート時、クエリコマンド「SYSTem:ERRor?」を使用すると、「GBV> 7.2V」または「Setting Over 200W」メッセージが返されます。

構文 MANU:GB:RHISet <NR2>

クエリ構文 MANU:GB:RHISet?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 000.1~650.0 (mΩ)

例 MANU:GB:RHIS 100.0

GB の HI SET 値を 100mΩ で設定します。

Set →

MANU:GB:RLOSet

→ Query

概要 アース導通(GB)試験の LOW SET 抵抗値を mΩ で設定または返します。このコマンドの前には、GB モードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:RLOSet<NR2>

クエリ構文 MANU:GB:RLOSet?

パラメータ/リターンパラメータ <NR2> 0.000~649.9 (mΩ)

例 MANU:GB:RLOS 50

GB の LO SET 抵抗を 50mΩ に設定します。

Set →

MANU:GB:TTIME

→ Query

概要 アース導通(GB)の試験時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、GBモードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:TTIME <NR2>

クエリ構文 MANU:GB:TTIME?

パラメータ/ <NR2> 0.3~999.9 (秒)

リターンパラメータ

例 MANU:GB:TTIM 1

GBの試験時間を1秒に設定します。

Set →

MANU:GB:FREQUENCY

→ Query

概要 アース導通(GB)試験の周波数をHzで設定または返します。このコマンドの前には、GBモードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:FREQUENCY {50|60}

クエリ構文 MANU:GB:FREQUENCY?

パラメータ/ 50 50Hz

リターンパラメータ 60 60Hz

例 MANU:GB:FREQ 50

GBの試験周波数を50Hzに設定します。

Set →

MANU:GB:CONTACT

→ Query

概要 アース導通(GB)試験の接触時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、GBモードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:CONTACT <NR2>

クエリ構文 MANU:GB:CONTACT?

パラメータ/ <NR2> 0~999.9 (秒)

リターンパラメータ

例 MANU:GB:CONtAct 999.9
GB の接触時間を 999.9 秒に設定します。

Set →

MANU:GB:GROUNDMODE

→ Query

概要 アース導通(GB)試験のグラウンドモードを設定または返します。このコマンドの前には、GB モードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:GROUNDMODE {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:GB:GROUNDMODE?

パラメータ/ ON GB グランドモード: ON

リターンパラメータ OFF GB グランドモード: OFF

例 MANU:GB:GROUNDMODE OFF
GB のグラウンドモードをオフにします。

Set →

MANU:GB:MAXHold

→ Query

概要 アース導通(GB)試験の MAX HOLD 機能を設定または返します。このコマンドの前には、GB モードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:MAXHold {ON|OFF}

クエリ構文 MANU:GB:MAXHold?

パラメータ/ ON GB の MAX HOLD: ON

リターンパラメータ OFF GB の MAX HOLD: OFF

例 MANU:GB:MAXH OFF
GB の MAX HOLD 機能をオフにします。

Set →

MANU:GB:PASShold

→ Query

概要 アース導通(GB)試験の PASS HOLD 時間を設定または返します。このコマンドの前には、GB モードにしておく必要があります。

構文 MANU:GB:PASShold {<NR2>|ON}

クエリ構文 MANU:GB:PASShold?

パラメータ/	<NR2>	0~999.9 (秒)
リターンパラメータ	ON	無制限

例 MANU:GB:PASS 999.9
GB の PASS HOLD 時間を 999.9 秒に設定します。

Set →

MANU:GB:REF

→ Query

概要 アース導通(GB)試験のオフセット(REF VALUE)を mΩ で設定または返します。このコマンドの前には、GB モードにしておく必要があります。

注意: GB の電流値と(HI SET 抵抗+REF)の値により 7.2V または 200W より大きいと、パネルには「Err」が表示され、設定は無効です。リモート時、クエリコマンド「SYSTem: ERRor?」を使用すると、「GBV> 7.2V」または「Setting Over 200W」メッセージが返されます

構文	MANU:GB:REF <NR2>	
クエリ構文	MANU:GB:REF?	
パラメータ/	<NR2>	0.000~650.0 (mΩ)
リターンパラメータ		

例 MANU:GB:REF 100
GB の基準値を 100mΩ に設定します。

Set →

MANU:GB:ZERocheck

→ Query

概要 ゼロチェック機能を実行します。このコマンドの前には GB モードにし、READY 状態になっていることを確認します。
ZERO 機能の詳細については、66 ページを参照してください。

構文	MANU:GB:ZERocheck {ON OFF}	
クエリ構文	MANU:GB:ZERocheck?	

パラメータ/ リターンパラメータ	ON	ZERO 機能を有効にします。
	OFF	ZERO 機能を無効にします。

例 MANU:GB:ZEROCHECK OFF
GB ZERO 機能を有効にします。

Set →

MANU:CONTInuity:RHISet

→ Query

概要 導通 (CONT) 試験の HI SET 抵抗値を Ω で設定または返します。このコマンドの前には、CONT モードにしておく必要があります。

注意: LOW SET \geq HI SET の場合、パネルには“Err”が表示され、コマンドは無効です。

構文 MANU:CONTInuity:RHISet <NR2>

クエリ構文 MANU:CONTInuity:RHISet?

パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	00.01~80.00 (Ω)
---------------------	-------	--------------------------

例 MANU:CONT:RHIS 30.0
CONT の HI SET 抵抗を 30 Ω に設定します。

Set →

MANU:CONTInuity:RLOSet

→ Query

概要 導通 (CONT) 試験の LOW SET 抵抗値を Ω で設定または返します。LOW SET の値は、HI SET の値よりも小さい必要があります。このコマンドの前には、CONT モードにしておく必要があります。

LOW SET の値は HI SET の値より小さいことが必要です。LOW SET が HI SET の範囲を超えている場合、パネルには、“Err”のエラーメッセージが表示され、コマンドは無効です。

例:

HI SET の値: 10.00

LOW SET の値: 10.01 → エラー

構文	MANU:CONTInuity:RLOSet <NR2>	
クエリ構文	MANU:CONTInuity:RLOSet?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	00.00 ~ 79.99 (Ω)

例 MANU:CONT:RLOS 20.0
CONT の LO SET 抵抗を 20Ω に設定します。

Set →

MANU:CONTInuity:TTIME

→ Query

概要 導通 (CONT) の試験時間を秒で設定または返します。このコマンドの前には、CONT モードにしておく必要があります。

構文	MANU:CONTInuity:TTIME <NR2>	
クエリ構文	MANU:CONTInuity:TTIME?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0.3~999.9 秒

例 MANU:CONT:TTIM 1
CONT の試験時間を 1 秒に設定します

Set →

MANU:CONTInuity:PASShold

→ Query

概要 導通 (CONT) 試験の PASS HOLD 時間を設定または返します。このコマンドの前には、CONT モードにしておく必要があります。

構文	MANU:CONTInuity:PASShold {<NR2> ON}	
クエリ構文	MANU:CONTInuity:PASShold?	
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR2>	0~999.9 (秒)
	ON	無制限

例 MANU:CONT:PASS 999.9
CONT の PASS HOLD 時間を 999.9 秒に設定します。

MANU:CONTinuity:REF

Set →

→ Query

概要

導通 (CONT) 試験の基準値を Ω で設定または返します。このコマンドの前には、CONT モードにしておく必要があります。

注意: HI SET+REF の値が 80Ω より大きいと、パネルには“Err”が表示され、コマンドは無効です。リモート時、クエリコマンド「SYSTem:ERRor?」を使用すると、「CONT Setting Over 8V」メッセージが返されません。

構文

MANU:CONTinuity:REF <NR2>

クエリ構文

MANU:CONTinuity:REF?

パラメータ/

リターンパラメータ

<NR2> 00.00~79.99 (Ω)

例

MANU:CONT:REF 0.01

CONT の基準値を 00.01Ω に設定します。

Set →

→ Query

MANU:CONTinuity:ZERocheck

概要

ゼロチェック機能を実行します。このコマンドの前には CONT モードにし、READY 状態になっていることを確認します。

ZERO 機能の詳細については、66 ページを参照してください。

構文

MANU:CONTinuity:ZERocheck {ON|OFF}

クエリ構文

MANU:CONTinuity:ZERocheck?

パラメータ/

リターンパラメータ

ON ゼロチェック機能: 有効

OFF ゼロチェック機能: 無効

例

MANU:CONT:ZEROCHECK OFF

CONT の ZERO 機能をオフにします。

自動(AUTO)試験コマンド

AUTO:STEP	237
AUTO:NAME	237
AUTO:EDIT:ADD	238
AUTO<x>:EDIT:HOLD	238
AUTO<x>:EDIT:SKIP	238
AUTO:EDIT:DEL	239
AUTO:TEST:RETURN	239
AUTO:EDIT:SHOW	240

AUTO:STEP

Set →

→ Query

概要	自動(AUTO)試験番号を設定または返します。
構文	AUTO:STEP <NR1>
クエリ構文	AUTO:STEP?
パラメータ/ リターンパラメータ	<NR1> 1~100
例	AUTO:STEP 100 現在の自動(AUTO)試験番号を 100 に設定します。

Set →

→ Query

AUTO:NAME

概要	選択された自動(AUTO)試験の名前を設定または返します。このコマンドの前には、AUTO モードにしておく必要があります。 自動(AUTO)試験名に使用できるキャラクタは、アルファベットと数字(A~Z、a~z、0~9)と“_”(アンダースコア)のみです。
構文	AUTO:NAME <"string">
クエリ構文	AUTO:NAME?
パラメータ/ リターンパラメータ	<string> 10 文字までの文字列

例 AUTO:NAME "program1"
自動(AUTO)試験名を program1 に設定します。

AUTO:EDIT:ADD

Set →

概要 現在の自動(AUTO)試験番号に、選択した単独(MANU)試験を追加します。

構文 AUTO:EDIT:ADD {<NR1>|CON}

パラメータ

<NR1>	1~100
CON	継続ステップ

例 AUTO:EDIT:ADD 7
現在の自動(AUTO)試験番号に単独(MANU)試験の 007 を追加します。

Set →

AUTO<x>:EDIT:HOLD

→ Query

概要 現在の自動(AUTO)試験の単独(MANU)試験ごとの STEP HOLD のアクションを設定または返します。

構文 AUTO<x>:EDIT:HOLD {PH_FH|PH_FS|PH_FC
|PC_FH|PC_FS|PC_FC}

クエリ構文 AUTO<x>:EDIT:HOLD?

パラメータ/
リターンパラメータ

<x>	MANU ステップ順位:1~10
PH_FH	Pass Hold & Fail Hold に設定
PH_FS	Pass Hold & Fail Stop に設定
PH_FC	Pass Hold & Fail Continue に設定
PC_FH	Pass Continue & Fail Hold に設定
PC_FS	Pass Continue & Fail Stop に設定
PC_FC	Pass Continue & Fail Continue に設定

例 AUTO1:EDIT:HOLD PH_FH
現在の自動(AUTO)試験の MANU ステップ順位 1 で Pass Hold & Fail Hold を設定します。

Set →

AUTO<x>:EDIT:SKIP

→ Query

概要 自動(AUTO)試験の単独(MANU)試験ごとのスキップアクションを設定または返します。

構文 AUTO<x>:EDIT:SKIP {ON|OFF}

クエリ構文 AUTO<x>:EDIT:SKIP?

パラメータ/リターンパラメータ	<x>	MANU ステップ順位: 1~10
	ON	選択したステップをスキップします。
	OFF	選択したステップをスキップしません。

例 AUTO1:EDIT:SKIP ON
自動(AUTO)試験のSTEP 順位 1 をスキップします。

AUTO:EDIT:DEL

Set →

概要 現在の自動(AUTO)試験で選択された単独(MANU)試験を削除します。

構文 AUTO:EDIT:DEL {<NR1>|ALL}

パラメータ	<NR1>	MANU ステップ順位: 1~10
	ALL	すべて削除します。

例 AUTO:EDIT:DEL 3
現在の自動(AUTO)試験からMANU ステップ順位 3 を削除します。

AUTO:TEST:RETurn

→ Query

概要 現在試験されている自動(AUTO)試験と単独(MANU)試験の番号を返します。

クエリ構文 AUTO:TEST:RETurn?

リターンパラメータ	String	返される文字列は、自動(AUTO)試験番号、単独(MANU)試験番号の順序になります。 AUTO-XXX、STEP-XX
-----------	--------	---

スイープコマンド

SWEEP:DATA:STATus	241
SWEEP:DATA:SHOW	241
SWEEP:GRAPh:SHOW	242

SWEEP:DATA:STATus

→ Query

概要	スイープ機能で取得した基本情報を返します。
クエリ構文	SWEEP:DATA:STAT?
リターンパラメータ	<String> 下のフォーマットに従った文字列が返されます。 STEP, TEST MODE, V SET, HI SET, TOTAL DATA
例	SWEEP:DATA:STAT? > STEP, MODE, V SET , HI SET , TOTAL DATA 000 , DCW , 0.450kV, 1.700mA, 00076

SWEEP:DATA:SHOW

→ Query

概要	スイープ機能によって取得したすべてのデータを返します。
クエリ構文	SWEEP:DATA:SHOW<NR1>
リターンパラメータ	<NR1> 0~10000 0: 取得した全データを返します。 1~10000: 指定した番号のデータのみを返します。
例	SWEEP:DATA:SHOW 0 > TIMER , READ V, READ I 0000.1s , 0.003kV, 007uA 0000.2s , 0.008kV, 026uA 0000.3s , 0.019kV, 064uA 0000.4s , 0.028kV, 095uA 0000.5s , 0.037kV, 126uA 0000.6s , 0.045kV, 153uA

注意 全データを要求した場合の応答は CR+LF で区切られて複数行応答します。
 あらかじめ SWEEP:DATA:STAT コマンドでデータ数を取得してから、ヘッダ行分を+1した行数を取り込んでください。

SWEEP:GRAPh:SHOW

Set →

→ Query

概要	スイープ機能により取得したデータを LCD にグラフ表示させたり、そのグラフ表示を消したりします。また、LCD にスイープ機能によるグラフ表示がされているかどうかを問い合わせます。このコマンドは MANU モードのみ有効です。	
コマンド構文	SWEEP:GRAPh:SHOW {ON OFF}	
クエリ構文	SWEEP:GRAPh:SHOW?	
パラメータ/ リターンパラメータ	ON	LCD に、スイープ機能のグラフを表示
	OFF	LCD に、スイープ機能のグラフを非表示
例	SWEEP:GRAP:SHOW? > OFF スイープ機能によるグラフは、LCD に表示されていません。	

共通コマンド

*CLS.....	243
*IDN.....	243
*SRE	243

*CLS



概要 *CLS コマンドは、内部レジスタをクリアし、エラーメッセージがあればこれをクリアします。

構文 *CLS

*IDN



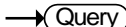
概要 モデル番号、シリアル番号、ファームウェアバージョンを問い合わせます。

クエリ構文 *IDN?

リターンパラメータ <string> 機器の情報を以下の形式で返します。

```
>GPT-12004 ,GPT12000 ,T0.01|
モデル名: GPT-12004
シリアル番号: 8 文字のシリアル番号
ファームウェアバージョン: T0.01|
```

*SRE



概要 自動 (AUTO) モードのみ。自動 (AUTO) 試験における現時点での測定ステップ番号を問い合わせます。

クエリ構文 *SRE?

リターンパラメータ <NR1> 00~50

例 *SRE?

>5

現在の試験番号は 5 です。

エラーメッセージ

概要 SYST:ERR?のクエリで返されるエラーメッセージを以下に示します。

エラー	エラー内容	エラーコード
No Error	エラーなし	0
Command Error	コマンドエラー	20
Value Setting Error	値の設定エラー	21
String Setting Error	文字列設定エラー	22
Query Error	クエリエラー	23
MODE Setting Error	モード設定エラー	24
TIME Error	時間エラー	25
DC Over 50W[GPT-12xxx]	DC 電力 50W 以上	26
DC Over 100W[GPT-15xxx]	DC 電力 100W 以上	26
GBV > 7.2V	GB 電流 × (HI SET+REF) > 7.2V	27
ARC ≤ HI Set	ARC ≤ HI Set	28
HI Set ≥ ARC	HI Set ≥ ARC	29
Voltage Setting Error	電圧設定エラー	30
Current Setting Error	電流設定エラー	31
Current HI Set Error	電流 HI Set エラー	32
Current LO Set Error	電流 LO Set エラー	33
Resistance HI Set Error	抵抗 HI Set エラー	34
Resistance LO Set Error	抵抗 LO Set エラー	35
REF Setting Error	REF 設定エラー	36
Frequency Setting Error	周波数設定エラー	37
ARC Setting Error	ARC 設定エラー	38
RAMP Time Setting Error	RAMP 時間設定エラー	39
TEST Time Setting Error	試験時間設定エラー	40
WAIT Time Setting Error	保留時間設定エラー	41
RAMP Down Setting Error	下降時間設定エラー	42
PASS Hold Setting Error	PASS Hold 設定エラー	43
GB Contact Setting Error	GB 接触設定エラー	44
Setting Over 200W	GB 電力 200W 以上	45
CONT Setting Over 8V	CONT(HI SET+REF) × 100mA ≥ 8V	46
Auto Step Add Full	自動ステップ追加フル	47
This Is The Last Step	最後のステップ	48
Learning less than 30uA	Learning の値が 30 μ A 未満	49
USB DISK BUSY	USB メモリアクセス中	50

よくある質問

- 電源が入らない。
- 操作パネルのキーが反応しない。
- IR または GB 試験の測定値が仕様と合わない。
- START ボタンを押しても試験が開始されない。

電源が入らない。

電源ケーブルが接続されていることを確認してください。ヒューズが切れていないこと、正しく取り付けられていることを確認してください。248 ページを参照してください。

操作パネルのキーが反応しない。

本器が SIGNAL I/O または デジタル制御モードになっていないことを確認してください(133 ページ)。デジタル制御モードになっている場合は、183 ページを参照してフロントパネルからの操作モードに戻してください。また、Key Lock(キーロック)が有効になっている場合は、START ボタン、STOP ボタン以外は機能しません。詳細については、133 ページを参照してください。

IR 試験の測定値が仕様と合わない。

+15～+35℃の周囲温度において、本器の電源を入れてから最低でも30分間はウォームアップしていることを確認してください。本器が安定し、仕様を満たすのに必要な時間です。ウォームアップ後、グラウンドチェック手順を実行してください。

GB 試験の測定値が仕様と合わない。

+15～+35°Cの周囲温度において、本器の電源を入れてから最低でも30分間はウォームアップしていることを確認してください。本器が安定し、仕様を満たすのに必要な時間です。ウォームアップ後、ゼロチェック手順を実行してください。詳細については、66 ページを参照してください。

START ボタンを押しても試験が開始されない。

試験を開始するためには、まず READY(準備完了)の状態になっていることが必要です。START ボタンを押す前に、ディスプレイに READY が表示されていることを確認してください(単独(MANU)試験は 83 ページ、自動(AUTO)試験は 111 ページを参照)。

Double Action が有効になっている場合は、STOP ボタンを押してから 0.5 秒以内に START ボタンを押さないと試験は開始しません。

インターロックが有効になっている場合、リアパネルの SIGNAL I/O ポートにインターロックキーを挿してください。

さらに、Start Click For 1 Second が有効になっている場合は、START ボタンを 1 秒以上押してください。1 秒以下では試験が開始しません。

詳細については、133 ページを参照してください。

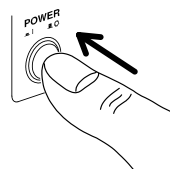
詳細については、販売代理店または当社 (info@texio.co.jp) までお問い合わせください。

付録

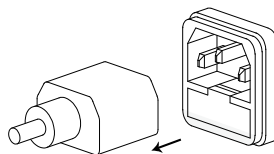
ヒューズ交換

手順

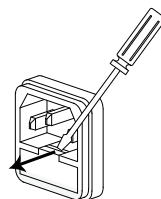
1. 電源を切ります。



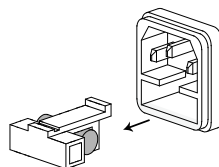
2. 電源ケーブルを外します。



3. マイナスドライバーを使ってヒューズ・ケットを外します。



4. ヒューズホルダ内のヒューズを交換します。



ヒューズの定格 T 4A、250V[GPT-12xxx]

T10A、250V[GPT-15xxx]

試験エラー

試験中にエラーが発生した場合、試験完了後に GPT-10000 シリーズのディスプレイに以下のようなメッセージが赤で表示されます。

エラーメッセージ	概要
HI FAIL	試験結果が HI SET の値を超えた
LOW FAIL	試験結果が LOW SET の値より小さかった
V OVER	測定電圧が設定値の 1.1 倍以上だった
V LOW	測定電圧が設定値の 0.9 倍未満だった
SHORT	電圧短絡が検出された
GBI OVER	測定電流が設定値の 1.1 倍以上だった
GBI LOW	測定電流が設定値の 0.9 倍未満だった
GBV OVER	測定された GB 電圧が 7.2V 以上だった
CONT V ERR	測定された CONT 電圧が 8.0V 以上だった
ARC ERR	ARC で異常が検出された
GFCI ERR	接地電流の異常を検出
SHORT (CONTACT CHK)	コンタクトチェックにおいて、ショートを検出した (HI Limit を超えた)
OPEN (CONTACT CHK)	コンタクトチェックにおいて、オープンを検出した (LOW Limit を下回った)

単独 (MANU) 試験の設定で異常が発生すると、GPT-10000 シリーズのディスプレイに以下のようなエラーメッセージが赤で表示されます。

エラーメッセージ	概要
TEST MODE ERROR	ACW/DCW の設定エラー
VOLTAGE SET ERROR	電圧設定エラー
CURRENT SET ERROR	電流設定エラー
MANU STEP ERROR	単独 (MANU) 試験の値設定エラー
MANU NAME ERROR	単独 (MANU) 試験の名前エラー
HI SET ERROR	HI SET 値の設定エラー

HISET <= LOWSET	HI SET 値 \leq LOW SET 値の設定エラー
HISET >= ARC	HI SET 値 \geq ARC SET 値の設定エラー
LOW SET ERROR	LOW SET の設定エラー
TEST TIME ERROR	TEST TIME の設定エラー
RAMP TIME ERROR	RAMP TIME の設定エラー
ARC FUNC ERROR	ARC FUNC の設定エラー
ARC SET ERROR	ARC SET の設定エラー
ARC SPEED ERROR	ARC SPEED の設定エラー
FREQ SET ERROR	ACW/GB の周波数設定エラー
WAIT > TEST+RAMP	WAIT TIME の設定エラー
GB CONTACT ERROR	GB CONTACT の設定エラー
RAMP DOWN ERROR	RAMP DOWN の設定エラー
GROUND ERROR	GROUND MODE の設定エラー
MAX HOLD ERROR	MAX HOLD の設定エラー
PASS HOLD ERROR	PASS HOLD の設定エラー
REF SET ERROR	REF VALUE の設定エラー
GBV OVER	GB モードにおける $ISET \times (HI SET + REF) > 7.2V$ の設定エラー
INIT VSET ERROR	INIT VOLTAGE の設定エラー
IR MODE ERROR	IR MODE の設定エラー
DCW OVER 50W [GPT-12xxx]	DCW における $V \times I > 50W$ の設定エラー
DCW OVER 100W [GPT-15xxx]	DCW における $V \times I > 100W$ の設定エラー
GB OVER 200W	GB モードにおける $V \times I > 200W$ の設定エラー
ZERO SET ERROR	ZERO CHECK の設定エラー
CONT. TEST V OVER	CONT モードにおける、 $ISET(100mA) \times (HI SET + REF) > 8V$ の設定エラー
TIME OVER 240s [GPT-12xxx]	ACW 試験モードで表示され、HI SET の値が 30mA 以上、かつ、RAMP TIME + TEST TIME の設定が 240 秒以上の設定エラー

TIME OVER 240s [GPT-15xxx]	ACW 試験モードで表示され、HI SET の値が 80mA 以上、かつ、RAMP TIME+TEST TIME の設定が 240 秒以上の設定エラー
TEST TIME<0.5s	TEST TIME <0.5s は、グラウンドモードがオンの IR テストモードで、テスト時間が 0.5 秒未満の場合に表示
CONTACT ERROR	ACW、DCW、または IR の CONTACT の設定エラー
LEARNING < 30uA	CONTACT CHK の基準値は 30uA 未満のため、CONTACTCHK 機能は無効になります。

バーコードリーダーについて

バーコードリーダーを前面 USB ポートに接続する場合にバーコードリーダー側の設定が必要になります。

バーコードリーダー仕様

インタフェース	USB
プロトコル	USB 仮想 COM モード
確認済み	ARGOX 社 AS-8050
バーコードリーダー	DUKEPOS 社 DK-7666
	Cino 社 L680

バーコードリーダーを本器と接続する前にバーコードリーダーの設定シートなどでインタフェースを USB、動作モードを USB Virtual COM (仮想 COM モード) に設定してください。

バーコードで数字以外を取り扱う場合は code39 などの英数字が利用できる形式を設定してください。

バーコードの作成・印刷についてはバーコードリーダーに付属のアプリケーションなどでおこなってください。

工場出荷時設定

DISPLAY SET

Brightness	5
Language	ENGLISH

BUZZER

Volume	3
Key Sound	ON

INTERFACE

Interface	RS-232
Baud Rate	9600

CONTROL

Control By	Front Panel	
	SIGNAL IO -->	OUT1:READY
		OUT2:TEST
		OUT3:PASS
		OUT4:FAIL
		OUT5:FAIL_H
Double Action	OFF	
Key Lock	OFF	
Interlock	OFF	
Start Click For 1 Second	OFF	
Power GND Check	OFF	
Barcode Function Setting	Delete set data of 100 groups	

STATISTICS

TOTAL AMOUNT =	0
PASS AMOUNT =	0
FAIL AMOUNT =	0
ACW PASS DATA	0
ACW FAIL DATA	0
DCW PASS DATA	0
DCW FAIL DATA	0
IR PASS DATA	0
IR FAIL DATA	0
GB PASS DATA	0
GB FAIL DATA	0
CONT PASS DATA	0
CONT FAIL DATA	0

USB DISK

USB Disk Auto Data Save	OFF
File Name	Logfile_
Internal Memory Save	OFF

CONTACT CHK

Hi Limit	200%
Low Limit	50%
Learning	000 uA

GPT-10000 シリーズの仕様

以下の仕様は、GPT-10000 シリーズを、周囲温度 15～35℃で 30 分以上電源をオンにした状態において適用されます。

仕様

一般項目

ディスプレイ	7 型カラーLCD	
メモリ	自動(AUTO)／単独(MANUAL)モードを合計 100 個保存可能	
電源	AC 100V～240V±10%、50Hz/60Hz	
消費電力	GPT-15xxx	1000VA MAX.
	GPT-12xxx	400VA MAX.
アクセサリ	電源ケーブル×1、 ユーザマニュアル×1(CD) GHT-115×1(GPT-1X001/1X002/1X003) GHT-115×1、GTL-215×1(GPT-1X004)	
寸法／質量	GPT-15001	約 380mm(W) x 148mm(H) x 492mm(D)
	GPT-15002	※突起物を含む寸法
	GPT-15003	約 17kg
	GPT-15004	約 380mm(W) x 148mm(H) x 546mm(D) ※突起物を含む寸法 約 21kg
	GPT-12001	約 380mm(W) x 148mm(H) x 436mm(D)
	GPT-12002	※突起物を含む寸法
	GPT-12003	約 11kg
	GPT-12004	約 380mm(W) x 148mm(H) x 454mm(D) ※突起物を含む寸法 約 15kg

環境項目

適用範囲	温度	湿度
保証	15℃～35℃	70%以下(結露のないこと)
動作時	0℃～40℃	70%以下(結露のないこと)
保存時	-10℃～+70℃	85%以下(結露のないこと)
設置場所	標高 2000m 以下の室内	
EMC	EN61326-1(ClassA)、2014/30/EU 準拠	
LVD	EN61010-1(Class1、汚染度 2)、2014/35/EU 準拠	

AC 耐電圧

出力電圧範囲	0.050kV~5.000kV ¹	
出力電圧分解能	1V	
出力電圧確度	±(設定の1%+5V)、無負荷時	
最大定格負荷(表1)	GPT-15xxx	500VA(5kV/100mA)
	GPT-12xxx	200VA(5kV/40mA)
最大定格電流	GPT-15xxx	100mA 0.001mA~10mA(0.05kV≦V≦0.5kV) 0.001mA~100mA(0.5kV<V≦5kV)
	GPT-12xxx	40mA 0.001mA~10mA(0.05kV≦V≦0.5kV) 0.001mA~40mA(0.5kV<V≦5kV)
出力電圧波形	正弦波	
周波数	50Hz / 60Hz	
電圧レギュレーション	±(1%+5V)[最大定格負荷 → 無負荷]	
電圧計確度	±(読み値の1%+5V)	
電流測定レンジ	GPT-15xxx	0.001mA~100.0mA
	GPT-12xxx	0.001mA~40.00mA
電流最高分解能	GPT-15xxx	1μA 1μA (1μA~9.999mA) 10μA (10.00mA~99.99mA) 100μA (100.0mA)
	GPT-12xxx	1μA 1μA (1μA~9.999mA) 10μA (10.00mA~40.00mA)
電流測定確度	±(読み値の1.5%+30μA)	
電流オフセット	60μAmax	
判定確度	±(設定の3%+30μA)	
部分放電(ARC)検出	○	
上昇時間制御機能	○	
RAMP TIME(上昇時間)	0.1~999.9s	
下降時間制御機能	○	
RAMP DOWN(下降時間)	0.0~999.9s	
タイマー(試験時間)	OFF ² 3、0.3s~999.9s	
タイマー確度	±(100ppm+20ms)	
GND(グラウンドモード)	ON/OFF	
WAIT TIME(判定保留時間)	0.0~999.9s	

¹ 50V/10mA の設定電圧に達するには、少なくとも 0.3 秒が必要になります。

² タイマー設定を OFF できるのは、上限電流が 80mA 未満 (GPT-15xxx) / 30mA 未満(GPT-12xxx)の場合に限ります。

DC 耐電圧

出力電圧範囲	0.050kV~6.000kV ¹	
出力電圧分解能	1V	
出力電圧確度	±(設定の 1%+5V)、無負荷時	
最大定格負荷(表 1)	GPT-15xxx	100W(5kV/20mA)
	GPT-12xxx	50W(5kV/10mA)
最大定格電流	GPT-15xxx	20mA 0.001mA~2mA(0.05kV≦V≦0.5kV) 0.001mA~20mA(0.5kV<V≦6kV) ²
	GPT-12xxx	10mA 0.001mA~2mA(0.05kV≦V≦0.5kV) 0.001mA~10mA(0.5kV<V≦6kV) ²
電圧計確度	±(読み値の 1%+5V)	
電圧レギュレーション	±(1%+5V) [最大定格負荷 → 無負荷]	
電流測定レンジ	GPT-15xxx	0.001mA~20.00mA
	GPT-12xxx	0.001mA~10.00mA
電流最高分解能	GPT-15xxx	0.1μA 0.1μA (0.1μA~999.9μA) 1μA (1μA~9.999mA) 10μA (10.00mA~20.00mA)
	GPT-12xxx	0.1μA 0.1μA (0.1μA~999.9μA) 1μA (1μA~9.999mA) 10μA (10.00mA)
電流測定確度	±(読み値の 1.5%+3μA) (I < 1mA) ±(読み値の 1.5%+30μA) (I ≥ 1mA)	
判定確度	±(設定値の 3%+30μA)	
電流オフセット	5μAmax	
ウィンドウコンパレータ方式	○	
部分放電(ARC)検出	○	
上昇時間制御機能	○	
RAMP TIME(上昇時間)	0.1~999.9s	
下降時間制御機能	○	
RAMP DOWN(下降時間)	0.0~999.9s	
タイマー(試験時間)	OFF、0.3s~999.9s	
タイマー確度	±(100ppm+20ms)	
WAIT TIME(判定保留時間)	0.0~999.9s	
容量負荷最大値	1μF (6kV 時、10 秒以下で放電可能な最大値)	

¹ 50V/2mA の設定電圧に達するには、少なくとも 0.3 秒が必要になります。

² >5kV では、最大電流は最大定格電力により制限されます。

絶縁抵抗(IR)試験

出力電圧範囲	50V~1200V	
出力電圧分解能	50V	
出力電圧確度	±(設定の1%+5V)、無負荷時	
抵抗測定レンジ	0.1MΩ~50GΩ	
抵抗分解能	抵抗範囲	分解能
	0.1MΩ~999.9MΩ	0.1MΩ
	1.000GΩ~9.999GΩ	0.001GΩ
	10.00GΩ~50.00GΩ	0.01GΩ
試験電圧	測定レンジ	確度
	50V ≤ V ≤ 450V	0.1MΩ~1MΩ 1MΩ~50MΩ 51MΩ~2GΩ
500V ≤ V ≤ 1200V	0.1MΩ~1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1MΩ~500MΩ	読み値の5%+1カウント
	501MΩ~9.999GΩ	読み値の10%+1カウント
	10G~50GΩ	読み値の20%+1カウント ¹
試験電圧	測定値表示範囲	
50V ≤ V ≤ 100V	000.1MΩ~10.00GΩ	
150V ≤ V ≤ 450V	000.1MΩ~20.00GΩ	
500V ≤ V ≤ 1200V	000.1MΩ~50.00GΩ	
電圧レギュレーション	±(1%+5V)[最大定格負荷 → 無負荷]	
抵抗判定レンジ	0.1MΩ~50GΩ	
試験電圧	判定レンジ	確度
	50V ≤ V ≤ 450V	0.1MΩ~1MΩ 1MΩ~50MΩ 51MΩ~2GΩ
500V ≤ V ≤ 1200V	0.1MΩ~1MΩ	読み値の5%+3カウント
	1MΩ~500MΩ	読み値の5%+1カウント
	501MΩ~9.999GΩ	読み値の10%+1カウント
	10G~50GΩ	読み値の20%+1カウント ¹
出力ショート時の出力電流	10mA max.	
出カインピーダンス	2kΩ	
ウィンドウコンパレータ方式	○	
上昇時間制御機能	○	
RAMP TIME(上昇時間)	0.1~999.9s	
下降時間制御機能	○	
RAMP DOWN(下降時間)	0.0~999.9s	
WAIT TIME(判定保留時間)	0.0~999.9s	
タイマー(試験時間)	0.3s~999.9s ²	
タイマー確度	±(100ppm+20ms)	

GND (グラウンドモード) ON/OFF

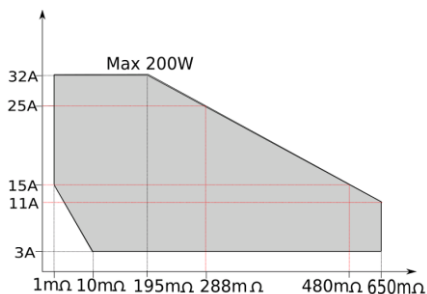
注意: IR 試験でグラウンドモードが ON の場合には、GND OFFSET を加える必要があります。

¹ IR 試験でグラウンドモードが ON の場合、最大 30GΩ の測定を保証します。

² IR 試験でグラウンドモードが ON の場合、試験時間の最小値は 0.5s です。

アース導通(GB: Ground Bond)試験

出力電流範囲	3.00A~32.00A
出力電流確度	±(設定の 1%+0.2A)、3A≤I≤8A 時 ±(設定の 1%+0.05A)、8A<I≤32A 時
出力電流分解能	0.01A
試験電圧	最大 約 8VAC (オープン回路)
周波数	50Hz/60Hz の切り替え式
抵抗測定範囲	1mΩ~650mΩ



抵抗測定分解能	0.1mΩ
抵抗測定確度	±(読み値の 1%+2mΩ)
抵抗判定確度	±(設定の 1%+2mΩ)
ウィンドウコンパレータ方式	○
タイマー(試験時間)	0.3s~999.9s
タイマー確度	±(100ppm+20ms)
GND (グラウンドモード)	ON/OFF

導通 (CONT) 試験

出力電流	100mA (DC)
抵抗測定範囲	0.10Ω~70.00Ω
抵抗測定分解能	0.01Ω
抵抗測定確度	± (読み値の 10%+2Ω)
抵抗判定確度	± (読み値の 10%+2Ω)
ウィンドウコンパレータ方式	○
タイマー (試験時間)	0.3s~999.9s
タイマー 確度	± (100ppm+20ms)

インタフェース

REMOTE (リモート端子)	○
SIGNAL IO	○
RS-232C	○
USB (デバイス)	○ (USB 2.0)
リアパネル出力	○
USB (ホスト)	○ (USB 2.0 USB メモリ、 USB-VCP バーコードリーダー)
GP-IB	○ (オプション)
LAN	○ (オプション)

表 1: 耐電圧試験の出力制限

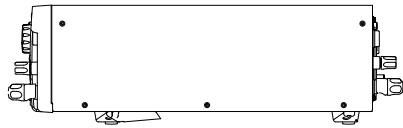
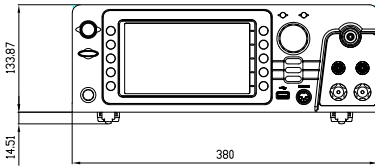
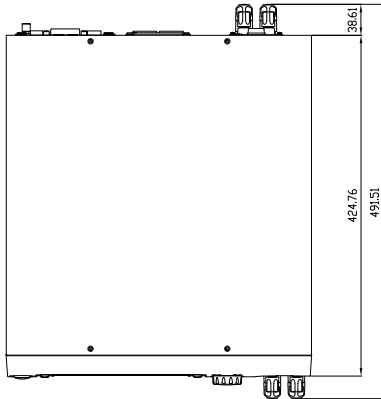
試験項目	出力電流	休止時間	出力時間
AC	GPT-15xxx	80mA ≤ I ≤ 100mA	少なくとも出力時間 最長 240 秒 以上が必要
		0.001mA ≤ I < 80mA	不要 連続出力が可能
	GPT-12xxx	30mA ≤ I ≤ 40mA	少なくとも出力時間 最長 240 秒 以上が必要
		0.001mA ≤ I < 30mA	不要 連続出力が可能
DC	GPT-15xxx	0.001mA ≤ I ≤ 20mA	不要 連続出力が可能
	GPT-12xxx	0.001mA ≤ I ≤ 10mA	不要 連続出力が可能
GB	15A < I ≤ 32A	少なくとも出力時間 999.9 秒 以上が必要	
	3A ≤ I ≤ 15A	不要	999.9 秒

注意: 出力時間 = 上昇 (RAMP) 時間 + 試験時間

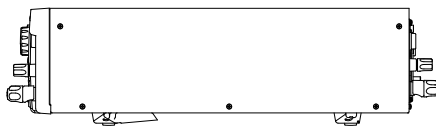
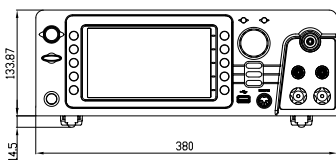
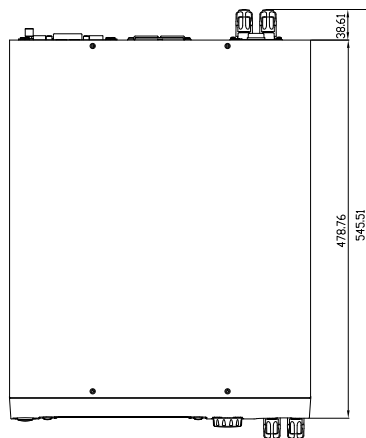
表 2: 容量性負荷

	試験条件			
	試験電圧 DCW	HI-SET 電流	ランプ時間 ↗	最大 容量性負荷
1	1.000kV	$I \geq 10.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	4.7 μF
2	2.000kV	$I \geq 7.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	1.65 μF
3	3.000kV	$I \geq 8.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	1.32 μF
4	4.000kV	$I \geq 11.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	1.32 μF
5	5.000kV	$I \geq 7.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	0.66 μF
6	6.000kV	$I \geq 8.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	0.66 μF

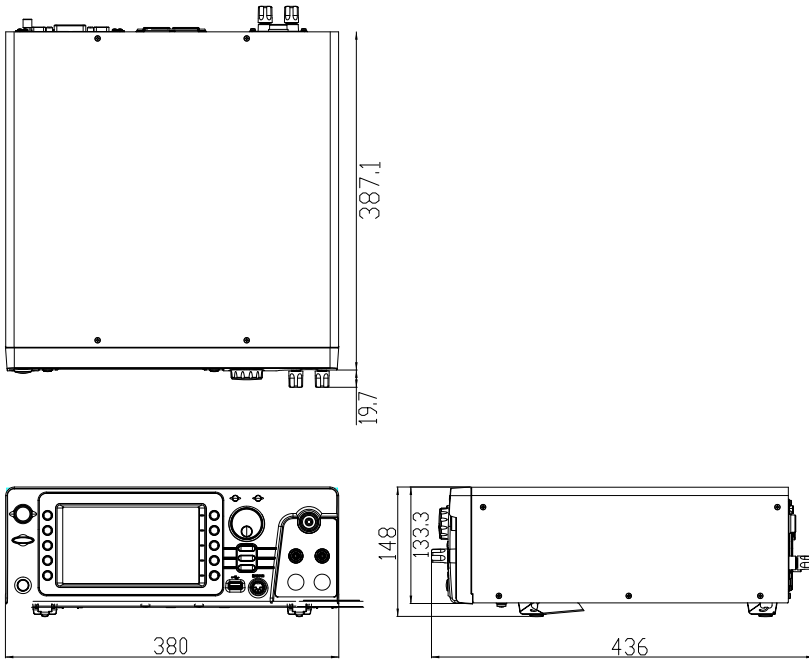
GPT-15001/15002/15003 の外形寸法図



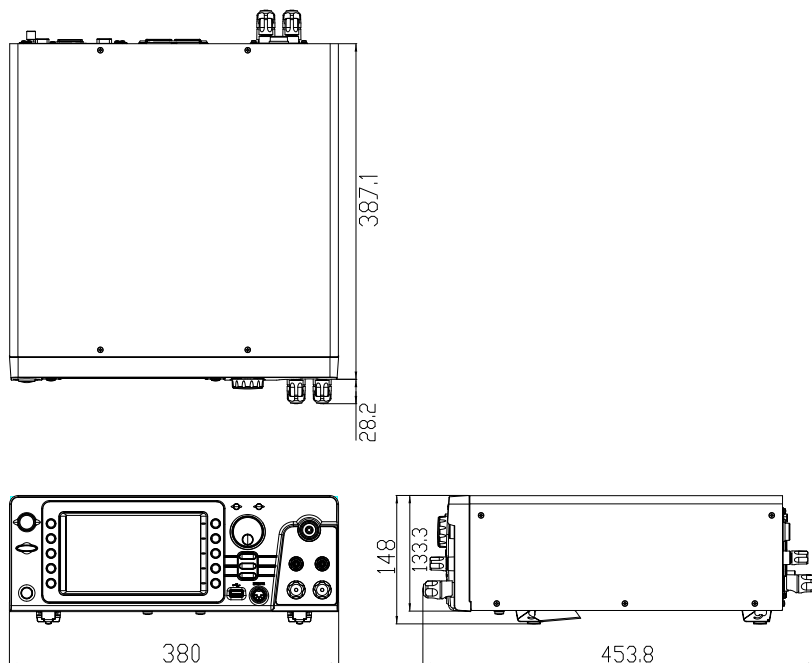
GPT-15004 の外形寸法図



GPT-12001/12002/12003 の外形寸法図



GPT-12004 の外形寸法図



Declaration of Conformity

We

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

declare that the below mentioned product

Type of Product: Electrical Safety Analyzer

Model Number: **GPT-12001 / GPT-12002 / GPT-12003 / GPT-12004**
GPT-15001 / GPT-15002 / GPT-15003 / GPT-15004

satisfies all the technical relations application to the product within the scope of council:

Directive: EMC, LVD, WEEE, RoHS

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

◎ **EMC**

EN 61326-1:	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements
Conducted & Radiated Emission EN 55011/EN55032	Electrical Fast Transients EN 61000-4-4
Current Harmonics EN 61000-3-2/EN61000-3-12	Surge Immunity EN 61000-4-5
Voltage Fluctuations EN 61000-3-3/EN61000-3-11	Conducted Susceptibility EN 61000-4-6
Electrostatic Discharge EN 61000-4-2	Power Frequency Magnetic Field EN 61000-4-8
Radiated Immunity EN 61000-4-3	Voltage Dip/ Interruption EN 61000-4-11/EN61000-4-34

◎ **Safety**

EN 61010-1:	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements
--------------------	--

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan

Tel: +886-2-2268-0389

Fax: +866-2-2268-0639

Web: www.gwinstek.com

Email: marketing@goodwill.com.tw

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.

No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011, China

Tel: +86-512-6661-7177

Fax: +86-512-6661-7277

Web: www.instek.com.cn

Email: marketing@instek.com.cn

GOOD WILL INSTRUMENT EURO B.V.

De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, The Netherlands

Tel: +31(0)40-2557790

Fax: +31(0)40-2541194

Email: sales@gw-instek.eu

索引

- Dimensions262, 263
- EN61010
 - 汚染度..... 3
 - 測定カテゴリ..... 2
- GP-IB/LAN カード(オプション)のインストール 19
- GPT-10000 シリーズの概要5
- Zeroing 77, 78, 81
- 安全上の注意
 - お問合せ 247
 - 分解 2
- インターロックキー 177
- お問合せ247
- 外形寸法図.....264, 265
- 外部接点制御 171
 - SIGNAL I/O の概要 174
 - SIGNAL I/O による試験の開始/停止 176
 - インターロック・キー 177
 - 概要 172
 - リモート端子 172
 - リモート端子の操作 173
- 環境
 - 安全動作 3
 - クリーニング2
 - 警告シンボル1
 - 梱包内容9
 - 作業場の注意事項21
 - 試験エラー249
- システム設定
 - GP-IB..... 127
 - RS232..... 127
 - USB 127
 - USB メモリ設定 159
 - インタフェース..... 127
 - コンタクトチェック設定 167
 - コントロール設定 133
 - コントロール設定
 - インターロックキー..... 133
 - 開始方法 133, 134
 - キーロック 133, 138
 - スタートクリック..... 133, 139
 - ダブルアクション 133, 137
 - バーコード 133, 140
 - パワーグラウンドチェック..... 133, 139
 - 時刻の設定 147
 - 情報セクション 155
 - ディスプレイ 123
 - データの初期化 152
 - 統計設定..... 156
 - ブザー..... 125
- 自動試験
 - SIGNAL I/O による試験の開始/停止 176
 - SIGNAL I/O の概要..... 174
 - 結果..... 116
 - 実行..... 111
 - ステップの追加 101
 - ファイル名の作成..... 100
 - ページの編集 104
 - 呼出..... 99
 - 連続実行..... 102
- 仕様..... 255
- スイープ機能 95
- 大地アース
 - シンボル..... 1
- 単独 (MANU) 試験
 - ARC(アーク検出)モード 55
 - GB Contact 64
 - GND OFFSET 62
 - IR モード 61
 - MAX HOLD(最大測定値保持機能) 58
 - PASS HOLD(PASS 表示保持) ..59
 - Ramp Up(上昇)時間 53
 - オフセット 50
 - 概要..... 34
 - 下降時間(Ramp Down) 45

基準値	39	注意シンボル	1
グラウンドモード(GROUND MODE)	69	チルトスタンド	17
結果	88	適合宣言	266
試験機能	36	デジタル制御	178
試験時間	41	インタフェースについて	179
試験周波数	49	コマンド構成	184
試験電圧	47	コマンドリスト	186
試験番号の選択/呼出	37	動作確認	182
試験ファイル名	38	特長	6
実行	83	廃棄	3
上昇時間(Ramp Up)	43	付属品とオプション	8
初期電圧	51	フロント・パネル一覧	10
ゼロ調整	66	メニュー構成	26, 27
タイミングチャート	89	よくある質問	246
特別 単独(MANU)試験	93	リアパネル一覧	14
保留時間	53		

お問い合わせ

製品についてのご質問等につきましては下記までお問い合わせください。

株式会社テクシオ・テクノロジー

本社：〒222-0033横浜市港北区新横浜2-18-13

藤和不動産新横浜ビル7F

[HOME PAGE] : <https://www.texio.co.jp/>

[E-Mail]: info@texio.co.jp

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへサービスセンター：

〒222-0033横浜市港北区新横浜2-18-13

藤和不動産新横浜ビル8F

TEL. 045-620-2786 FAX.045-534-7183